ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИНЕРАЛООБРАЗУЮЩИХ СИСТЕМ



АКАДЕМИЯ НАУК СССР СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИНЕРАЛООБРАЗУЮЩИХ СИСТЕМ

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

НОВОСИБИРСК-1982

Физико-хамические исследования минералообразуниих систем:Сб. науч.тр./АН СССР, Сиб. •тд-ние, Ин-т геологии и геофизики; Редкол.: А.А.Годовиков (отв.ред.) и др.-Новосибирск, 1982.-154 с.

В сборнике помещены оригинальные работы по физико-химическим исследованиям минералообразуищих систем.

В статьях рассматриваются сухие рудные системы, содержащие ртуть, мышьяк, медь, серебро, галлий, золото; кинетика гидротермальной кристаллизации берилла и растворения монокристаллов парателлурита; фазовые превращения силикатных систем при высоких давлениях; много внимания уделяется исследованию иризирующего опалового материала, вопросам устойчивости минералов в гидротермальных условиях, изучению расплавов при высоких температурах, а также методическим вопросам.

Сборник представляет интерес для широкого круга геохимиков и геологов, интересуищихся результатами экспериментальных исследований в области минералогии.

Редколлегия:

д-р геол.-мин. наук А.А.Годовиков (отв. ред.), канд. геол.-мин. наук Х.Н.Федорова, И.В.Синяков

Рецензенты:

канд. геол.-мин. наук В.А.Кляхин, канд. физ.- мат. наук В.А.Винокуров

С Институт геологии и геофизики СО АН СССР, 1982 г. УДК 549.07+549.2II+548.248

Ю.Н.Пальянов, А.Ф.Хохряков, А.И.Чепуров ЦИКЛИЧЕСКИЕ ДВОЙНИКИ СИНТЕТИЧЕСКОГО АЛМАЗА

Циклические двойники алмаза довольно редко встречаются в природе, хотя и описывались многократно и являются хорошо известными благодаря оригинальной внешней форме [7,4,I,IO]. Среди синтетических алмазов такие двойники, образованные христаллами октаэдрического габитуса, также были отмечены [16,8]. Летальное исследование таких образований синтетического алмаза проведено Г.Г.Леммлейном [2], которым показано, что каждый из двойниковых сростков представляет шестерник. В основном циклические двойники состоят из цяти октаздров, образуваних пятилучевую звезду, а пестой индивид присутствует в виде тонкой прослейки клинообразной формы. В последнее время появилась статья, посвященная пиклическим двойникам синтетического алмаза оригинальной морфологии, образованным кристаллами кубооктаэдрического габитуса [12].

Вопрос о происхождении циклических двойников во многих аспектах является дискуссионным. Так, например, образование звездоподобных двойников пентагонита объясняется возникновением цятерного мотива в структуре кристаллического зародыша [II,I5]. Для пятерников золота предлагается модель, где их образование связывается с примесями [I3]. Пангаров [5], проведя исследования по кристаллизации двойников серебра, полыгает, что тамие пятерники, вероятно, образуются благодаря последовательному двойникованию, однеко механизм их образования не рассматривается. Достоверным и экспериментально установленным следует считать лишь тот факт, что образование циклических двойников возможно только в условиях значительных пересыщений [5].

Опыты по синтезу алмаза проводялись в системе Ni-Mn-С на аппарате высокого давления типа "разрезной куб" [6]. Наиболее благоприятной для кристаллизации циклических двойников оказалась

Сфери	ические	коорди	наты Т	раней	
циклического	шестерн	wka ky	боокта	эдров	алмазаЖ

Номер	Индекс	Координаты				Omnora		
талла	грани	измер	енные	BHTI	сленные	A P	Δφ	
		Р	Ý	S	φ			
I	(00I) (III)	90°00' 35°10'	211°41' 211°41'	90°00' 35°16'	211°36' 211°36'	_ 0 ⁰ 06'	0°05' 0°05'	
II	(00I) (III) (IĪI)	90 ⁰ 00' 35 ⁰ 08' 90 ⁰ 00'	141 ⁰ 09' 141 ⁰ 12' 195 ⁰ 33'	90°00' 35°16' 90°00'	I4 I ⁰ 04' I4I ⁰ 04' I95 ⁰ 48'	_ 0 ⁰ 08' _	0 ⁰ 05′ 0 ⁰ 08′ 0 ⁰ 15′	
III	(00I) (IĪI)	90 ⁰ 01′ 89 ⁰ 58′	70 ⁰ 22' 125 ⁰ 10'	90 ⁰ 00'	70 ⁰ 32' 125 ⁰ 16	0 ⁰ 01' 0 ⁰ 02'	0°06'	
IÀ	(00I) (III) (ĪII)	90 ⁰ 00' 35 ⁰ 05' 90 ⁰ 02'	0 ⁰ 00 [°] 0 ⁰ 00′ 305 ⁰ 27′	90 ⁰ 00' 35 ⁰ I6' 90 ⁰ 00'	0°00' 0°00' 305°12'	- 0°II' 0°02'	- - 0 ⁰ 15'	
У	(00I) (III)	90 ⁰ 03′ 35 ⁰ 07'	289 ⁰ 26' 289 ⁰ 21'	90 ⁰ 00' 35 ⁰ 16'	289 ⁰ 28' 289 ⁰ 28'	0°03′ 0°09'	0°02′ 0°07′	
λI	(001) (IĪI) (III)	90°00' 90°00' 35°07'	219 ⁰ 06 164 ⁰ 17' 219 ⁰ 08'	90 ⁰ 00 90 ⁰ 00 35 ⁰ I6	218 ⁰ 56 <i>°</i> 164 ⁰ 12′ 218 ⁰ 56′	- 0 ⁰ 09'	0 ⁰ 10′ 0 ⁰ 05′ 0 ⁹ 12′	

* За ось Z принята ось шестерника

область Р-Т-параметров, удаленная от линии равновесия графит алмаз, где предполагаются максимальные пересыщения расплава утлеродом относительно алмаза [3]. В ячейке высокого давления [9], кроме хорошо известных циклических двойников, образованных октаздрическими кристаллами (рис. І.в), были получены циклические двойники алмаза кристаллов кубического (рис. І.а) и кубооктаздрического (рис. І.б) габитуса. Опыты проводились в услеших заданных Р-Т-параметров, искличающих возможность переогранения.



Рис. I. Морфологический ряд циклических двойников, образованных кристаллеми: а - кубического; б - кубооктаэдрического; в - октаэдрического габитуса

Гониометрические данные, полученные на гониометре ZRG-3 для циклического двойника кубооктаздров алмаза, приведены в таблице, стереографическая проекция – на рис. 2.

В работе [12] при исследовании циклических двойников синтетического алиаза отмечаются грани {511} в виде узких полосок волизи двойникового шва. Бизкая точность приведенных гонкометрических данных (~ I⁰) вызывает сомнения относительно существования этих граней. На исследованных нами циклических двойниках быля обнаружены грани, стереографическая проекция которых совпадает с проекцией, приведенной в работе [12]. Установлено, что 9TN трани являются гранями (III) соседних индивидов. По своему положению они отличаются от граней {5II} на 6'и без рассмотрения позиции двойникового шва легко могут быть приняты за грани {5II}. Также сомнительно для альназа наличие двойниковой плоскости {5II}. Эха плоскость не является двойниковой потому. что образуется при разрастании и смыкании первого и четвертого индивидов в четвернике и, как показывают наши наблюдения, не является актиенны местом роста. В противном случае, придется признать существование двойниковой плоскости между первым и шестым индивидом в шестернике (рис. 2), которая будет иметь очень высокие индексы. Де-



Рис. 2. Стереогеографическая проекция циклического двойника кубооктаэдров алмаза

тальное изучение морфологии двойников синтетического алиаза с помощью микроскопа МБС-9 и электронного сканирушего MIKEDO-CROITA JSM-35 ПОЗВОЛИло выявить ряд инте-DECHHA ACHERTOB HA HOCKOJERY генезиса. среди циклических двойников алмаза, кроме законченных mecтерников. встречаются коленчатые двойники. состоящие из трех или четырех инливидов.

можно предположить, что формирование полных шестерников про-

исходит благодаря последовательному зарождению новых индивидов в двойниковом положение на уже существующем двойнике срастания. Высказанное предположение подтверждается и тем, что часто наблюдаются пятерники, имеющие один или два индивида большего размера, а остальные – последовательно уменьшающихся размеров. Характерно, что линейные размеры последних свидетельствуют о преобладании в 2 раза скоростей роста индивидов в направлении двойникового шва относительно других направлений.

Кроме известных простых циклических двойников алмаза, нами обнаружены спиральные циклические двойники (рис. 3а,б) и сложные циклические двойники с несколькими пиклическими осями (рис. 4). Полученный экспериментальный материал позволяет высказать некоторые представления о механизме образования циклических двойников синтетического алмаза.

Как отмечал Г.Г.Леммлейн [2], для формирования циклического двойника угол поворота между осями L₄ двух индивидов при двойниковании по плоскости (III) с поворотом на I80⁰ должен составлять 70⁰32' и в результате циклического двойникования пять хорошо развитых индивидов занимают сектор 5 х 70⁰32' = 352⁰40', а на



Рис. 3. Спиральный циклический двойник синтетического алмаза, образованный кристаллами октаэдрического габитуса: а - x180; б - схема



Рис. 4. Сложный циклический двойник синтетического алмаза с тремя циклическими осями (0₁,0₂, 0₃), xI60

шестой утнетенный индивид остается сектор в 7⁰20[']. При исследовании электронно-микроскопических снимков большого количества циклических двойников установлено, что шестой индивид либо занимает сектор 7⁰20['] и тогда циклический двойник замыкается, либо нарастает на первый индивид и занимает недостающий ему сектор в 63⁰12[']. Во втором случае к шестому индивиду может присоединиться новый индивид в двойниковом положении. Естественно, что в результате последовательного присоединения следующих индивидов образуется новый цикл в той же плоскости (IIO). Таким образом продолжается процесс двойникования и соответственно смещение индивидов относительно друг друга с образованием спирального циклического двойника. Очевидно, такие спиральные цик-

лические двойники могут быть как правыми, так и левыми. Следует отметить, что измеренные нами углы между плоскостями двойникования реальных циклических двойников оказались в некоторых случаях значительно больше 7⁰, но всегда примерно кратные 7, что свидетельствует о том, что в процессе спирального развития двойника полный оборот на 352⁰40' ссуществлялся несколько раз и углы между плоскостями двойникования будут соответственно равны 7⁰20', 14⁰40', 22⁰ и так далез.

Все высказанное подтверждает, что двойникование происходит благодаря последовательному присоединению новых зародышей в двойниковом положении на грани уже имениегося кристалла или двойника. Однако, шинелевый двойник октаэдров имеет 14 граней {III} и в случае, если возможность присоединения зародыша в двойниковом положении на любую свободную грань одинакова, то ветрезвычайно роятность образования циклического пестерника будет мала. Значит, следует предположить, что различные грани двойника обладают разной способностью присоединять зародыш в двойниковом положении. Действительно, шинелевый двойник октаздров имеет три различных типа граней: две грани, параллельные двойниковой плоскости, шесть граней, образующих входящий угол, и шесть граней, образукщих выходящий угол. Общеизвестно, что двойниковая ILJOCкость является нарушением структуры кристалла и соответственно является источником дислокаций. Дислокации, в свою очередь, являются ответственными за появление двойников, как было убелительно показано [14] при кристаллизации веществ с алмазным типом структуры. Опыты по травлению двойников алмаза [17] также показаля, что максимальная концентрация ямок травления, отвечаниих дислокациям, установлена именно вблизи двойникового шва. С учетом этих положений очевидно, что наиболее благоприятными областями для присоединения двойников будут участки вблизи двойникового шва на гранях третьего типа, образущих выходящий угол. Лютность дислований на гранях, образущих выходящий угол вблаен линии соединения двойниковых плоскостей, будет увеличиваться с присоединением каждого нового инлинила и, следовательно. будет возрастать вероятность возникновения зародыта в двойниковом положении именно в этом месте. Таким образом, коленчатые двойники из трех или четирех инливидов в условиях значительных пересыщений стремятся образовать пиклический двойник. Не исключено, **TTO**

двойникование в определенных условиях может происходить по нескольким граням при выходящем угле двойника. В таких случаях образуются сложные циклические двойники с несколькими циклическими осями (см. рис.4). В итоге такое развитие двойника может привести к образованию очемь сложного замкнутого циклического двойника, имеющего I2 циклических осей. Конечную фигуру проще всего представить как пентагондодеказдр, на каждой грани которого находится циклический двойник.

Обобщая изложенный в данной работе материал, можно сделать следующие выводы:

I. Установлен морфологический непрерывный ряд пиклических двойников синтетического алмаза в соответствии с морфологическим рядом куб – октаздр.

2. Получены новые типы циклических двойников аличза: спиральные пиклические двойники и сложные пиклические двойнике с несколькими циклическими оснми.

3. Предложен механизм образования циклических двойников алмаза, закличающийся в последовательном возникновении новых зародышей в двойниковом положении на грани кристалла или двойника.

Литература

I. Бобриевич А.П., Бондаренко М.Н., Гневупев М.А. и др. Алмазные месторождения Якутии. – М.: Госгеолтехиздат, 1959. – 395 с.

2. Леммлейн Г.Г. Морфолотия и генезис кристаллов. М.; Наука, 1973, с.71-74.

3. Литвин Ю.А., Безруков Г.Н., Капранова Г.П., Чернов Д.Б. Перекристаллизация и перенос в системах металл-углерод. – В кн.: Экспериментальные исследования минералообразования в сухих окисных и силикатных системах. М.: Маука, 1972, с. 30-36.

4. Орлов Ю.Л. Морфология алмаза.- М.: Изд-во АН СССР, 1963.- 234 с.

5. Пангаров Н.А. Ориентация кристаллов при электроосаждении металлов. – В кн.: Рост кристаллов. М.: Наука, 1974, т.Х, с.71-97.

6. Ран Э.Н., Малиновский И.Ю. Кубический двухступенчатый аппарат с гидростатическим приводом. – В кн.: Экспериментальние исследования по минералогии (1974–1975). Новосибирск: Изд-ние ИГиГ СО АН СССР, 1975, с.149–154. 7. Ферсман А.Е. Кристаллография алмаза. - М.: Изд-во АН СССР, 1955. - 565 с.

8. Хателишвили Г.В., Безруков Г.Н., Лаптев В.А. Морфологические характеристики и особенности образований двойниковых кристаллов алмаза марки САМ.- Алмазы, 1972, вып.8, с.I-8.

9. Чепуров А.И., Пальянов Ю.Н., Хохряков А.Ф. и др. Морфология кристаллов алмаза, синтезированных в системе Ni-Mn-Cha anпарате типа "разрезной куб".- В кн.: Проблемы теоретической и генетической минералогии. Новосибирск: Наука, 1981, с.38-40.

IO. Casanova R.D., Simon B., Turco G. A repeated twin in natural diamond from Tortiya, Ivory Coast.- Amer. Mineral. 1972, v.57, n.11-12, p.1871-1873.

11. Evans H.T. Penetration twins in hexagonal barium titanate: A Proposed mode of nucleation.- Canad. Mineral., 1978, v.16, p.347-352.

12. Pipkin N.J., Davies J., The crystal morphology of cyclic twins in sinthetic diamond grits.- Phil. Mag. A 1979, v. 40, n.3, p.435-443.

13. Schwobel R., Anomalous Growth of Gold from the vapor Phase.- Journ. Appl. Phys., 1966, v.37, n.6, p.2515-2516.

14. Simon B., Kern., Formation des Macles des Cristaux de Stuctures de Structures Diamand et Blende-Krist. und Technik, Bd.2, H.4, 1967, p.475-480.

15. Staples L.W., Evans H.T., Lindsay J.R. Cavansite and Pentagonite, New dimorphous Calcium Vanadium Silicate Minerals from Oregon.- Amer. Mineral., 1973, v.58, p.405-411.

16. Strong H., Making Diamond in the Laboratory.- The Physics Teacher, 1975, v.13, n.1, p.7-13.

17.Varma C.K.R. Intersecting twins in diamond. Scr. Metal. 1972, v.6, p.799-800.

II

УДК 541.161.2

А.А.Годовиков, Р.Г.Куряева

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПРИВЕДЕННЫХ СИЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ СУЛЬФИДОВ Р-ЭЛЕМЕНТОВ II ГРУППЫ

В предыдущей статье [I] говорилось, что р-элементы в разных количествах входят в стеклообразный As₂S₃.Это в какой-то мере обусловлено тем, что химическая связь во вновь образующихся сульфидах и в As₂S₃ имеет неодинаковую степень "металличности, ковалентности и ионности". В качестве величины, характеризующей степень ковалентности (ионности) связи, мы приняли приведенные силовые характеристики \tilde{y} орб, которые определяются следующим образом:

 $\bar{\chi}_{opd} = \chi_{opd} s / Kq s - \chi_{opd} M / KqM$

Для сульфидов Ш и У группы ў оро рассчитывались на основании структурной единицы Р.Л.Мыллера MS 3/2 (при КЧ серы = 2, КЧМ = 3), а для сульфидов ІУ группы — на основании структурной единицы MS_{4/2}.

Co

денными силовыми характеристиками соответствующих сульфидов показало, что вхождение р-элементов в стеклообразный As₂S₃ тем больше, чем ближе $\bar{\langle}$ орб сульфида введенного элемента к $\bar{\langle}$ орб As₂S₃.

Оставался открытым вопрос относительно места Al и Pb в ряду растворимости, построенном по приведенным силовым характеристикам сульфидов р-алементов (табл.) и образования стекла на основе As₂S₃ с добавкой Sn.

Как видно из приведенных силовых характеристик SnS₂ и As₂S₃, никаких противопоказаний к растворению Sn в As₂S₃ нет. И действительно, изменив режим синтеза, удалось получить стекло состава As₂S₃Sn_x, максимальное вхождение Sn в As₂S₃ соответствует месту его расположения в указанном ряду. Согласно классификации аморфных полупроводников [2], основанной на разбиении их на группы с одинаковым структурным окружением ближнего порядка, халькогениды элементов Ш группы относятся к тетраэдрическому тицу. Причем, было отмечено, что в аморфном состоянии сохраняется координацт нное число соответствущего кристаллического тела, где КЧМ = 4. Чтобн сохранилась стехиометрия в Al₂S₃, Ga₂S₃ и In₂S₃, следует допустить, что среднее КЧS = 2,66 и структурной единицей будет MS₄/2,66. Тогда приведенные силовые характеристики для этих сульфидов рассчитать по формуле $\chi_{\rm орб} = \chi_{\rm орб} S / 2,66 - \chi_{\rm орб} M / 4.$ Если выписать сульфиди р-элементов в порядке уменьшения

Если выписать сульфийн р-элементов в порядке уменьшения величин $\tilde{\gamma}_{\rm ODO}$, то видно, что все они, кроме Al, находятся на месте, соответствущем их растворимости в As₂S₃^{π} (табл.), что свидетельствует о правильности вибора системы расчета приведенных силовых характеристик.

Вхождение р-элементов в стеклообразный	As2S3
и приведенные силовые характеристи	KIN .
соответствующих сульбилов	

Формула сульфица	Вхожде- ние со- ответ- ствуищих р-эле- ментов в As ₂ S ₃ ; ат.%	γ opd= Yopd S/ KЧS - - YopdM/. KЧM	Формула Сульфиде	Вхождение соответ- ствущих р-элемен- тов в Аs ₂ S ₃ , ат.%	ȳopo= ȳopos/kys= -ȳopo ^{M/kym}
In ₂ S ₃	<0,5	0,44	Sb2S3	5-6	0,37
PbS	~ I	0,43	Al2S3	4-5	0,34
SnS ₂	~2	0,42	As2S3		0,28
Ga2S3	2-2,5	0,40	GeS2	~9	0,23
Bi2S3	3-3,5	0,39	SiS2	5–6	0,20

Следует отметить, что в предыдущей работе [I], на основании энергии связи Pb-S, мы предложили поместить Pb в ряду растворимости рядом с индием, что теперь подтвердилось пересчетом приведенных силовых характеристик и экспериментально.

^{*} Небольшое отклонение в положении Al, скорее всего, связано с неустойчивостью этих стекол из-за частичного гидролитического разложения Al₂S₃.

Виводы

Предложен расчет приведенных силовых карактеристик для сульфидов р-элементов II группы на основе "структурной единицы" MS_{4/2,66}. Расположение Al, Pb и Sn в ряду растворимости, построенном на основании приведенных силовых карактеристик сульфидов р-элементов, подтвердилось экспериментально.

Литература

I. Годовиков А.А., Куряева Р.Г. Влияние добавок р-алементов на свойства стеклообразного As₂S₃. - В кн.: Исследование физических свойств и состава синтетических минералов и монокристаллов. Новосибирск: Изд-ние ИТыГ СО АН СССР, 1981, с.3-12.

2. Мотт Н., Дэвис Э. Электронные процесс: в некристаллических веществах. М.: Мир, 1974, с.202.

УДК 541.161.2

Р.Г.Куряева, А.А.Годовиков

ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА РАЗМЯТЧЕНИЯ ХАЛЬКОГЕНИЛНЫХ СТЕКОЛ НА ОСНОВЕ Аз₂S₃, ЛЕГИРОВАННЫХ Р-ЭЛЕМЕНТАМИ И СРЕДНЯЯ ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ ЭТИХ СТЕКОЛ

Для изучения влияния добавок р-элементов на температуру начала размятчения (Тg) калькогенидных стекол на основе As₂S₃ мы исп-эльзовали гомогенные образци, изготовленные по технологии, описанной ранее [5,2]. Образцы считались гомогенными, если при микроскопическом исследовании анилифов стекол (200-300^ж) не наблидалось других фаз, кроме основной, на термограмме не было пиков, кроме эффектов размятчения и плавления стекла и на дебаеграммах не было линий, указываниях на присутствие кристаллических веществ.

^{*} Термический анализ проводился методом ПТА [I].

Таблица I

Температура начала размягчения стекол[≌] состава АзS_{1,5}M_ж где М - р-алементы Ш,IУ и У групп периодической системы Д.И.Менделеева

Состав стекла	Tg(°C)	Coctab Cteria	¶g ℃)	Состав стекла	Tg °C
AsS _{1,5} AsS _{1,5} Sb _{0,05} AsS _{1,5} Sb _{0,1}	194–196 182–186 178–184	AsS _{1,5} Al _{0,05} AsS _{1,5} Al _{0,07} AsS _{1,5} Al _{0,08}	178–184 172–178 166–170	AsS _{1,5} Si0,1 AsS _{1,5} Si0,125	184–187 178
AsS1,5Sb0,125	178–184	AsS1,5Ga0,05 AsS1,5Ga0,055	177-179 167-172 180-184	Ass _{1,5} Ge _{0,05} Ass _{1,5} Ge _{0,1} Ass _{1,5} Sn _{0,05} Ass _{1,5} Sn _{0,055} Ass _{1,5} Pb _{0,025}	186–198 196–202 180–184 184 178–184

* Тврмический анализ проводился методом ПТА []

Если сравнить температуры начала размятчения (Tg) стекол (табл. I) состава AsS_{1,5}^Mx и AsS_{1,5}, то видно что практически все они имеют более низкую Tg по сравнению с AsS_{1,5}. Чтобы понять такое понижение Tg,была оценена средняя энергия связи стекла состава AsS_{1,5}M_x предполегая, что средняя энергия связи между двумя атомами будет одинаковой в различных соединениях.

Расчет проводился из предположения, что при введении в AsS_{1,5} какого-либо элемента часть связей As-S разрушается, все количество добавляемых элементарных веществ связывается атомами серы с образованием связей M-S, а высвободившийся мышьяк образует связи As-As. Для проведения такого расчета необходимо было знать энергии связей As-S, As-As, M-S, а в ряде случаев и M-M, где M - р-элементы Ш, IV и У групп.

В качестве значений энериий гомосвязей (В_{М-М}) использовались значения, приведенные Р.Б.Добрстиным [4] (табл.2). Однако для ряда алементов эти значения имеют большой разброс. Поэтому необходимо выбрать, какие значения можно использовать в дальнейшем.

Были избраны в основном значения, полученные из энергий атомизации, а энергин диссоциации газообразных молекул использовались в крайнем случае, так как кратность связи в таких молекулах может быть самой различной. Так, из двух значений энергий гомосвязи Аз-Аз (4I ккал/моль и 46 ккал/моль) вноиралось второе, полученное по энергии атомизации мышьяка в предположении наличия трех связей по формуле $B_{M-M} = (2/3) \Delta H_{f 298}$, где B_{M-M} - энергия гомосвязи, а $\Delta H_{f 298}$ - теплота образования одноатомных газов из элементов в стандартном состоянии. Дальнейшие пояснения относительно выбора величин энергий гомосвязей будут даны по ходу расчетов энергий гетеросвязей (B_{M-S}), где это необходимо.

Энергии гетеросвязей (B_{M-S}) рассчитывались по энергии атомизации кристаллических веществ по формуле $B_{M-S} = \triangle H_A / b \cdot n$ [6], где B_{M-S} - средняя энергия единичной гетеросвязи, $\triangle H_A$ - молярная теплота атомизации, n - число локализованных связей между атомами в структурной единице, b - число структурных единиц, составляющих формулу соединения. В основу расчета были положены структурные единицы предложенные Р.Л.Маллером [6]: $Ass_{3/2}$, Ges_{4/2}; :Ges_{2/2}. Энергии атомизации красталлических веществ и энергии диссоциации газообразных молекул взяты из справочников [9,10].

Расчет энергий гетеросвязей для сульфидов р-элементов У группы, типа M_2S_3 проводился по формуле $B_{M-S} = \Delta H_A/2.3$ (I), а для сульфидов р-элементов IV группы типа MS_2 и MS соответственно по формулам: $B_{M-S} = \Delta H_A/4(2)$ и $B_{M-S} = (\Delta H_A - B_{M-M})/2$ (3).

Таблица 2

Связь	Значения энер- гий гомосвязей, [4] (ккал/моль)	Используе- мне энер- гии гомо- связей (ккал/моль)	Связь	Значения энергий гомосвя- зей, [4] (ккал моль)	Используемые энергии го- мосвязей, (ккал/моль)
Si-Si	46-56	-	A1-A1	46-55	50-52
Ge-Ge	38,62	45	Ga-Ga	36-39	39-45
Sn-Sn	50	50	As-As	4I-4 6	46
Pb-Pb	24	46	Sd-Sd	34-42	-
In-In	-	37-39	Bi-Bi	~48	

Значения энергий гомосвязей

Энергии гомосвязей для элементов IV группа (B_{M-M}) рассчитывались по теплотам образования одноатомных газов из элементов в в стандартном состоянии по формуле B_{M-M} = (2/4) \triangle H_{f298} в предположении наличия четырех связей. Для Ge в справочной литературе есть два значения энергии образования одноатомных газов – 90 ккал/моль и 106 ккал/моль.Соответствующие им энергии гомосвязей будут 45 и 53 ккал/моль. Было взято первое значение, так как рассчитанные по формулам (2) и (3) величины энергии гетеросвязи для соединений GeS₂ и GeS с его использованием находятся в хорошем соответствии (64 и 63 ккал/ моль).

Для Sn приводятся также два значения энергий гомосвязи: 36 ккал/моль, полученное из теплоты образования одноатомного газа в предположении наличия четырех связей и 50 ккал/моль, полученное в результате калориметрического исследования (C₂H₅)₃Sn -Sn(C₂H₅)₃.

величиной значение 50 ккал/моль, предполагая, что в данном случае эффективная валентность, проявляемая Sn,ниже числа валентных электронов. Действительно, если предположить, что согласно Л.Полингу [7] металлическая валентность Sn равна 2,56, то энергия связи В_{М-М} = (2/2,56).72 = 56 ккал/моль. Это значение уже олиже к значению 50 ккал/моль.

Значения энергий гетеросвязей, рассчитанные по уравнениям (2) и (3) для соединений snS₂ и snS, принимая B_{M-M} = 50 ккал/ моль, так же как и в случае германия, близки между собой (55 и 56 ккал/моль).

У Ръ, в силу увеличения металлических свойств, в максимальной мере должна проявляться коллективизация р³-орбиталей и двух р-электронов и расчет энергии гомосвязи, вероятно, надо проводить по формуле $B_{M-M} = (2/2) \cdot \Delta H_{f,298}$, что будет составлять 46 ккал/моль. Если теперь посчитать энергию гетеросвязи по формуле (3), то получим значение $B_{M-S} = 45$ ккал/моль.

Однако осталось сомнение, можно ли использовать для расчетов структурную единицу, предложенную Р.Л.Мюллером, для GeS и SpS в качестве основной для соединения с большой долей "металличности" связи, такого как PbS. Поэтому была сделана попытка оценить энергию связи Pb-S другим путем.

Если сопоставить энергии связе. B_{M-S} , рассчитанные из топлот атомизации соединений MS_2 и MS, с энергиями диссоциации двухатомных газообразных молекул $MS_{(r)}$ в подгруппе Si, Ge, Sn, Pb (табл.3), то видно, что кратность связи (m) газообразных молекул, рассчитанная по формуле m = D_{298}/B_{M-S} , где D_{298} -

энергия диссоциации газообразных молекул SiS, GeS, SnS, FbS, уменьщается сверху вниз по подгруппе. Если нанести эти точки на график зависимости кратности связи от порядкового номера элемента ($m - Z_M$), то видно, что три точки (для Si, Ge и Sn) ложатся практически на прямур линию (рис.). Если экстраполировать эту прямур до Z = 82, то получим кратность связи для PbS_(T) равнур I,8, откуда легко рассчитать энергию связи Pb-S, которая будет ~ 4I ккал/моль. Это значение вполне сопоставимо со значением 45 ккал/моль, рассчитанным по энергии атомизации кристалического Pb S.



Рис. Зависимость кратности связи (m) в газообразных молекулах от атомного номе-

ра катиона (ZM)

Необходимо сделать пояснение относительно расчета энергии связи для сульфидов элементов II группы главной подгруппы. Известно, **TTO** А1, Ga и In имерт свободные р-орбитали, в то время как S имеет избыток электронов, вследствие чего возможно образование ЛОНОДНОакцепторных связей и за счет этого тетраэдрической конфигурации атомов. Поэтому для соединений типа MoSz, rge M - Al, Ga, In , 3Haчения энергий гетеросвязей рассчитывались в прелноложении HAJINYNA четырех связей, по формуле В $\triangle H_{A}/2\cdot 4.$

Для Ga расчет проводился для двух соединений Ga₂S₃ и GaS. Оба

эти соединения диамагнитен. Дламагнетизм последнего можно объяснить спариванием а-электронов, т.е. с установлением кластерной связи между атомами Ga. Причем, каждый из них окружен тетраэдром из одного атома Ga и трех атомов S[8]. Исходя из сказанного ранее, энергию связи в этом соединении рассчитывали по формуле $B_{M-S} = (\Delta H_A - B_{M-M}/2)/3.$

Для расчета энергии гетеросвязи Ga-S надо знать значение энергий гомосвязи Ga-Ga. У Р.Б.Добротина (табл.2) находим значения 39 ккал/моль, полученное из энергии атомизации элементарного вещества в предположении наличия трех связей, и значение

I8

Таблица З

Энергии связей М-S и М-М, рассчитанные из теплот атомизации твердого тела, энергии диссоциации газообразных молекул MS_(г) и M_{2(г)} и кратность связи в этих молекулах

Связь	Энергин связейм-S и М-И, рассчитанные из теплот атомизации твердого тела, ккац моль	Энерт и диссоция- ции соответствую- щих газообразных молекул D, ккал/ моль	Кратность связи в
Si-S	68	I49	2,2
Ge-S	63	131	2,I
Sn-S	56	II3	2
Pb-S	45,4I ^X	74	I,8 [₩]
Al-Al	50-52	50	I
Ga-Ga	39,45 [±]	36	0 , 8 ^ૠ
In-In	37–39	23	0,6

К Значения получены из прямых на рисунке

36 ккал/моль, представляющее энергию газообразной молекулы Ga2.

Структура металлического Ga уникальна, поскольку в ней имеются близкие к молекулярным группы Ga₂. В целом же связь в металлическом Ga имеет молекулярно-металлический характер. Поэтому расчет энергии гомосвязи по обычной схеме здесь,возможно, неприменим.

В то же время для Al и In можно допустить атомные остовы Al³⁺ и In³⁺ и коллективизированные sp³ -орбитали. Причем, в In связь должна иметь более строгую пространственную ориентацию благодаря ковалентным тенденциям [3]. Поэтому расчет энергии гомосвязи по обычной схеме из энергии атомизации простого тела вполне допустим (рассчитанные значения представлены в табл.2).

Сопоставляя полученные значения с энергиями диссоциации газообразных Al₂ и In₂, можно рассчитать кратность связи газообразных молекул. Если предположить, что кратность связи (m) так же, как и для газообразных сульфидов IV группы, будет убывать пропорционально атомному номеру элемента (Z_M) то, нанеся на график (m-Z_M) значения для Al₂ и In₂, можно получить кратность связи для молекулы Ga₂, а затем и значение энергии гомосвязи Ga-Ga. Как видно из рисунка, кратность связи (m) в молекуле Ga₂ равна 0,8, а соответствующее значение энергии гомосвязи B_{M-M} = 45 ккал/моль.

Зная энергию гомосвязи Ga-Ga, по формуле $B_{M-S} = (\Delta H_A - B_{M-M}/2)/3$ можно рассчитать энергию связи Ga-S для соединения GaS (кр.). Как видно из табл. 4, значения B_{Ga-S} для соединений GaS и Ga₂S₃ близки между собой.

Таблица 4

Значения энергии связи (B_{M-S}), рассчитанные из энергий атомизации соответствующих сульфидов

Формула сульфида	Энергия атомиза- ции «Н _А , ккал/моль	Энергия связи ккал/моль	Формула сульфида	Экергия атомиза- ции _о Н _А , ккал/моль	Энергия связи, ккал/моль
As2S3	37 I	62	SiS2	27I	68
Sb_S_	358	60	GeS	254	64
Bi S.	326-340	54-57	GeS	1 7 1	63
A1253	524	65	SnS2	220	55
GaoSz	429-433	53-54	SnS	163	56
GaS	I68-I77	48-52	PbS	I 3 6	45(4I [*])
In ₂ S ₃	395	49		-	(→)1

* Значение получено экстраполяцией прямой на рисунке

Теперь, зная энергии связей M-S, As-S и As-As, можно оценить среднюю энергию связи (B_{CD}) стекла состава AsS_{1,5}M_x, предполагая, что при небольших добавках легирующих элементов к AsS_{1,5} все добавляемое вещество свяжется атомами серы с образованием соответствующего сульфида.

. Вероятный структурно-химический состав стекла AsS_{1,5}M_{0,05}, где M = Sb, Bi будет следующий:

0,054S3/2.0,075As2S4/2.0,85AsS3/2.

Учитывая, что структурная единица MS_{3/2} и AsS_{3/2} содержит 3 связи, а As₂S_{4/2} - 5 связей (1Аз-Аз и 4Аз-S) процентное соотношение связей в стекле такого состава будет следующее:

92,7% As-S, 2,4% As-As, 4,9% M-S.

Для стекол с добавками р-элементов Е группы такого же сос-

Taomma 5

Изменение средней энергии связи (В ср.), рассчитанной из процентного соотношения связей As-S, M-S и As-As и температуры начала размятчения (Тg) стекла в зависимости от его состава

Состав стегла	Предполагаемый структурно-жимический состав стекла	Процентное соотно- тение связей. I) As-S; 2) M-S; 3) As-As	В ср. Т _д , ккал/ о _С
AsS, c	ABSZ/2	4	62 194-196
A 8S1,5A10,05	0,85ÅsS _{3/2} •0,05ÅlS _{4/2,66} •0,075Ås ₂ S _{4/2}	1) 91,2; 2) 6,4; 3) 2,4	61,8 178-184
AsS1,5 ^{Ge} 0,05	0,8AsS _{3/2} °0,05GeS _{4/2} °0,1As ₂ S _{4/2}	1) 90,3; 2) 6,5; 3) 3,2	61,6 196-198
^{AsS} 1,5 ^{Sb} 0,05	0,854sS3/2°0,05SbS3/2°0,075As2S4/2	1) 92,7; 2) 4,9; 3) 2,4	61,5 182-184
AsS1,5 ^{Bi} 0,05	0,8545S _{3/2} •0,05BiS _{3/2} •0,075As ₂ S _{4/2}	1) 92,7; 2) 4,9; 3) 2,4	61,3 178
^{AsS} 1,5 ^{Ga} 0,05	0,85AsS _{3/2} °0,05GaS _{4/2,66} °0,075As ₂ S _{4/2}	1) 91,2; 2) 6,4;	61,1 177-179
AsS1,5 ^{S1} 0,1	0,6ABS _{3/2} .0,1SiS _{4/2} .0,2AB ₂ S _{4/2}	1) 81,25; 2) 12,5; 3) 6,25	61,8 184-187
AsS1,5 ^{Ge} 0,1	0,6AsS _{3/2} °0,1GeS _{4/2} °0,2As ₂ S _{4/2}	1) 81,25; 2) 12,5; 3) 6,25	61,3 196-203
^{AsS} 1,5 ^{Sb} 0,1	0,7AsS3/2.0,1SbS3/2.0,15A82S4/2	1) 85,7; 2) 9,5; 3) 4,8	61,0 178-184

тава AsS1,540,05 процентное соотношение связей будет иное (91,2% As-S 2,4% As-As, 6,4% M-S), так как надо учитывать наличие четырех связей в "структурной единице" MS4/2.66.

Таким же образом можно представить соотношение связей в стеклах других составов. Исходя из указанных соотношений, легко можно рассчитать средних прочность связи (В_{СР}) стекла.

Как видно из табл.5, понижение температуры начала размятчения стекол состава AsS₁, Mx по сравнению со стеклообразным AsS_{1,5} хорошо согласуется с величинами средней энергии связи стекла (B_{CP}.), несмотря на казалось бы большие энергии вновь образущихся связей, например As-S (B_{Al-S} = 65 ккал/моль) и Si-S (B_{Si-S} = 68 ккал/моль), и является, по-видимому, закономерным. Общей закономерности не подчиняются образцы с Ge, что вероятно, связано с неучтенным более сложным структурно-кимическым составом стекол. Понижение температуры начала размятчения стекла, вероятно, в основном определяется образованием низкоэнергетических связей As-As (46 ккал/моль), а аномальное поведение Тg для стекол с добавками Ge свидетельствуют о том, что связей As-As в них, по-видимому, не образуется.

Выводы

На основании данных термического анализа отмечено, что температура начала размягчения (тg) стекол состава Ass_{1,5}M_x, где М – р-элементы Ш, IV и У группы, в основном ниже тg Ass_{1,5}.

Для ряда элементов рассчитаны энергии гетеросвязей с s. Исходя из предполагаемого структурно-химического состава оценена средняя энергия связи стекол AsS_{1,5}M_x и показано, что с ней хоропо согласуется понижение Tg.

Общей закономерности не подчиняются образцы с Ge , что, вероятно, связано с неучтенным более сложным структурно-жимическим составом.

Литература

I. Алабужев Б.А. Установка дифференциального и производного термического анализа. – В кн.: Экспериментальные исследования по минералогии (1968–1969 гг.). Новосибирск: Изд-ние ИТъГ СО АН СССР, 1969, с.168–171. 2. Годовиков А.А., Куряева Р.Г. Влияние добавок р-элементов на свойства стеклообразного As_2s_3 . – В кн.: Исследование физических свойств и состава синтетических минералов и монокристаллов. Новосибирск: Изд-ние ИГиГ СО АН СССР, 1981, с.3-12.

3. Годовиков А.А. Химические основы систематики минералов. - М.: Недра, 1979, с.195.

4. Добротин Р.Б. Средняя энергия связи между одинаковыми атомами.- В кн.: Химия твердого тела. Л.: Изд-во ун-та, 1965, с.64.

5. Куряева Р.Г., Годовиков А.А., Елисеев А.В. Инфракрасные спектры поглощения стекол на основе As_2s_3 с добавками sb, Cr, Ge и Si . – В кн.: Исследования по экспериментальной минералогии. Новосибирск: Изд-ние ИГиГ СО АН СССР, 1978, с.3-II.

6. Миллер Р.Л. Химия твердого тела и стеклообразное состояние. – В кн.: Химия твердого тела. Л.: Изд-во ун-та, 1965, с.9.

7. Полинг Л. Общая химия. М.: Мир, 1974, с.514.

8. Реми Г. Курс неорганической химии. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1963, т.I, с.407.

9. Термические константы веществ. Справочник под ред. Глушко В.П., вып.Ш, 1968; вып. IУ, 1970; вып.У, 1971.

IO. Энергия разрыва химических связей, потенциалы ионизации и сродство к электрону. / Гурвич Л.В., Карачевцев Г.В., Кондратьев В.Н. и др.- М.: Наука, 1974.- 351 с.

УДК 541.123.3+549.3

Н.А.Илъяшева, Б.Г.Ненашев, И.В.Синяков ИССЛЕДОВАНИЯ В СИСТЕМЕ Hg-Ga-S

Изучение системы Hg-Ga-S предпринято в связи с тем, что монокристаллы тиогаллата ртути (Hg-Ga₂-S₄) перспективны для использования в нелинейной оптике [I]. В литературе имеются сведения главным образом о получении этих кристаллов методом газотранспортной реакции [6,8]. Высокая упругость паров серы и ртути над расплавом препятствует выращиванию кристаллов по обычной ампульной методиже. В работах [1,2,3,5,7,9] сообщается об изучении физических свойств кристаллов, выращенных в кварцевых ампулах с применением внешнего противодавления, однако, лишь в [1,3] приводятся некоторые данные по характеру плавления этого соединения, которые в значительной степени противоречат друг другу. Так, в [1] сообщается, что HgGa₂S₄ кристаллизуется конгруэнтно при температуре 880°C и образует с HgS непрерывный ряд твердых растворов с азеотропной точкой при 760° и приолизительном составе 70% HgS в разрезе HgS-Ga₂S₃. Согласно же [3], HgGa₂S₄ плавится конгруэнтно при температуре 882°, состав конгруэнтной точки 47,9% HgS, а область гомогенности лежит в пределах 50,5-45,1% HgS в разрезе HgS-Ga₂S₃.

45,1% HgS в разрезе HgS-Ga₂S₃. В нашей работе использованы следующие материалы: ртуть марки P-I после дополнительной очистки путем перегонки в вакууме при температуре I50-I80⁰; галлий марки Гл-000, сера марки ОСЧ I6-5 после дополнительной очистки.

Исследуемые образци были синтезированы в вакуумированных до 10⁻³ мм Нg ампулах из предварительно полученных HgS и Ga₂S₃. Высокая упругость паров ртути над HgS не позволяет нагре-

Высокая упругость паров ртути над HgS не позволяет нагревать навеску до плавления. Реакция же образования тиогаллата ртути в твердой фазе при 650°С (т.е. температуре, максимально допустимой для нагрева HgS в кварцевых ампулах) протекает, как показали предварительные опыты, крайне медленно (за 2 месяца образуется слой 0,02-0,05 мм). Вследствие этого Ga₂S₃ для синтеза обрался в виде тонкоистертого порошка, что позволяло проводить синтез в твердой фазе в течение двух-трех дней при 650°С, а затем полученный продукт медленно нагревался до плавления.

Для изучения образцов использованы минераграфический, термографический и рентгенографический методы. Составы, режимы синтеза и отдита образцов даны в таблице I.

В синтезированных образцах идентифицированы следущие фазы (табл. I):

TOOLOGING T	Tac	JUNIA	I
-------------	-----	-------	---

Состал	в, мол. Я		Темпера-	Режем охнавления после синтеза Фазовый состав		фазовый состав после отвига по режимамите				
HgS	Ga2S3	S	CRHTesa		HOCHE CERTESA	740 ⁰ , 60 суток	600 ⁰ , 24 суток	850 ⁰ , IO суток	870 ⁰ , I0 суток	915 ⁰ 2 сутор
59,97	40,03	-	930	5 ⁰ в час до 700 ⁰ , выдержка I4, суток, двлее за 5 часов до 20 ⁰	TT,β,β,Hg	TT. 5'	-	TT, \$	-	TT, a. B. Hg
54,96	45,04	-	930		TT & B, Hg	TT. o	-	-	-	-
54,08	45,92	-	970	IOO ^O B TAC	TT, B , B, Hg	TT. o	TT.S.Hg	-	TT. X. 4. 0. B. Hg	A.TT.X.~, \$
51,80	48,20	-	920			•	TT.5,Hg	TF. Ø	-	A.TT.X., 3, H
50,29	49.71	-	920	5° в час до 700°, выдержка 14 суток, далее за 5 часов до 20°	A.TT.,), Hg	TΓ, β΄	TΓ.β	-	TT.X. d. p. p. Hg	A.TT.X. 3.H
47,37	52,63	-	930	**	A,TT,X,B,Hg	-	A.TT.	-	-	-
45,12	54,88	-	930		A.TT.X.B.Hg	-	-	-	-	-
39,43	60,57	-	960	IOC ^O B TAC	A,TT,Xd ,Hg	-	A.TT.	-	-	A.TT.X
34,89	65,II	-	980		A,TT,X,Hg	-	A.TT.	-	-	-
25,20	75,80	-	1000	-	A,TT,Ga2S3,Q	-	A,TT,q	-	-	-
14,86	65,14	-	1000	-	A.TT. Ga2Sz.q	-	A,TT, GaoSz.g	-	-	-
5,08	94,92	-	1000		A,TT,Ga2S	-	A,TT, Ga2S3.9	-	-	-
52,54	41,35	6,II	930	5 ⁰ в час до 700 ⁰ , выдержжа 5 часов, далее за 5 часов до 20 ⁰ С	A, TT, A, B, B	-		-	-	-
48,55	43,53	7,92	930	-	A,TT, d, B, B'	-	TT, IP	-	-	-
41,89	45,47	12,64	930	5 ⁰ в час до 700 ⁰ , выдержка I4 суток, далее за 5 часов до 20 ⁰ С	A,TT, Ga2S3,S	-	A,TT,X,S	-	-	-

Составы, режными синтеза, отжига и фазовый состав образцов

Видерата при температуре скитеза 3-5 часов
Образци не расплавлени
Образци не расплавлени
Обозначения фаз: ПТ - тиогаллят; of , β , β' - соответствующие модификалии сульфила ртути или твердих растворов на его основе; "фаза А" и "фаза Х" "фаза q", см. текст; Ga₂S₃ - присутствует в низкотемпературной модификалии.

Taoma 2

Дебаеграмые тногаллата ртути (Со - излучение, Fe - фильтр)

Номер образца	d'n		d <u>n</u>		dn		dn
3	5,I3	2	I,924	4	I,442	3	I,200
5	4,87	9	I,878	I	I,417	3	Ì,162
5	3,90	2	I,822	3	I,397	2	I,146
10	3,II	2	I,8I3	3	I,38I	I	I,I22
6	2,91	3	I,744	3	I,33I	8	I,II2
5	2,76	I	I,7IO	I	I,30I	2	I,093
3	2,57	9	I,652	3	I,285	I	I,083`
5	2,43	I	I,622	5	I,260	6	I,072
5	2,40	2	I,578	2	I,247	6	I,059
5	2,143	5	I,566	I	I,234	2	I,05I
4	2,000	2	I,554	7	I,22I	6	I,035
7	I,950	2	I,5I6	I	I,2I5		

 β HgS - присутствует отдельно или вместе с фазой β HgS в виде толстих слоев на поверхности образцов или между изометричными зернами тиогаллата. В аншлифах фази β - и β' HgS неразличими. Между собой различаются величиной межплоскостных расстояний. На дебаеграмие для фази β' HgS характерны следующие линии, выделенные из смеси фаз: 3,30(10); 2,85(3), 2,02(7); 1,722(4).

HgGa₂S₄ - тиогаллат ртути - прозрачние кристаллы желтого, лимонно-желтого, буровато-желтого или оранжевого цвета на верхней поверхности образцов. Часто образует рыхлые желтые слои в верхней или средней частих образцов. В анытифах встречается как в виде изометричных зерен, так и в форме закономерно ориентированных тонких пластинчатых включений в матрице β' HgS.

Желтый или лимонно-желтый цвет характерен для разностей из низкотемпературных составов, содержащих избыток Hgs (см. табл. I), или кристаллов, конденсировавшихся при охлаждении из газовой фазы, обогащенной ртутью. Буровато-желтый цвет характерен для тиогаллата из образцов, богатых HgS или S , при 850 и 870°С, рыиий – для тиогаллата, находящегося в ассоциации с первичной фазо^{*} А (см. ниже). Рентгенограмма тиогаллата ртути ранее не публиковалась (табл.2). Индицирование выполнено на основании рентгеноструктурных данных работы [8].

Фаза-Х. Эту фазу в дакной работе в анплифах наблюдать не удалось. К ней отнесена группа линий, присутствущих на рентгенограммах некоторых разностей тиогаллатов, однородных при увеличении в 1000 раз и не идентифицирущихся в структуре тногаллата ртути¹⁷⁷ 7,01(3); 4,16(4); 3,78(1); 3,55(2); 2,51(1); Химический состав фазы неизвестев.

Фаза A – изоструктурна кубической модификации Ga₂S₃ (F43m), $\alpha = 5,22$ Å; характерным является размытие линий с нечетными индексами. Светло-желтая, прозрачная. Встречается в шлифах в виде первичных дендридов внутри изометричных зерен тиогаллата и как составлящия мелкоточечной структуры распада в образцах, богатых по составу Ga₂S₃, а также в виде желтых кристалликов размером до 0,I-0,2 мм на поверхности образцов. После отжига при 700⁰ распадается. Структура распада очень мелкодисперсна и до конца еще не расшафрована.

у Ga₂S₃ - низкотемпературная модицикация в не расплавившихся при синтезе образцах.

Фаза "q " - встречается в структурах распада богатых составляющей Ga₂S₃ образцов в виде мелких хоропо отражающих точечных включений.

Элементарная ртуть - в большинстве образцов в виде капель на стенках ампул, в порах и на поверхности образцов, не содержащих избыток серы.

Данные термического анализа полностью не приводятся в связи с тем, что они не могут быть объяснены в рамках двойной системы HgS-Ga₂S₃, а для сущдений о строении диаграммы состояния тройной системы данных пока недостаточно.

Наше исследование показало следущее:

Разрез HgS-Ga₂S₃ не является квазио́инарным. Этого следовало ожидать, поскольку состав исходного сульфида ртути, согласно данным [10], при повышении температуры обогащается серой. В сульфиде ртути, синтезированном из стехиометрической навески,

^{*} В выполняемой в настоящее время работе, в образцах, полученных методом направленной кристаллизации, нам удалось наблюдать включения в тиогаллате, которые, пока предположительно, отнесены к фазе X.

должна присутствовать свободная ртуть. Как видно из табл. I, свободная ртуть появляется в большем или меньшем количестве во всех образцах, не содержащих в исходном составе свободной серы по сравнению с сульфидной стехиометрией.

Тиогаллат ртути плавится инконгрузнтно по реакции тройного трехназного равновесия в интервале температур 882-896⁰, разлагаись на расплав, обогащенный HgS , и кубическую фазу А.

В разрезе HgS-Ga₂S₃ поле первичной кристаллизации тиогаллата из расплава лежит левее состава 55% HgS. У высокотемпературных разностей его при охлаждении, по-видимому, выпадает фаза "X" в мелкодисперсном состоянии. Составы, кристаллизующиеся из более низкотемпературных расплавов, остаются однофазными.

Для всех образцов, в состав которых входит более 50% HgS, характерен термический эффект, расположенный в интервале 755-770°, связанный с началом плавления. Поскольку микроструктура этих образцов представляет собой пластинчатые зерна тиогаллата ртути, пространство между которыми выполнено фазой HgS с последовательно уменьпанищимися ориентированными пластинчатыми выделениями тиогаллата ртути, этот эффект может быть связан с перитектической реакцией образования фази β HgS , из которой при охлаждении постепенно выпадают пластинки тиогаллата, подобно тому, как это происходит с кубической фазой на основе HgSe в системе HgSe-Ga₂Se₃ [4].

Для образцов 7,8 и 9 (см. табл.ї) характерен изотермический эффект 961+2°, природа которого пока не установлена. Эта реакция сопровождается выделением значительного количества газсвой фазы, о чем свидетельствует вспучивание расплавленной составляющей образцов после реакции.

Из приведенных результатов можно сделать следующие выводы: Разрез HgS-Ga2S3 не является квазибинарным. В изученной области состав тиогаллата ртути плавится инконгрузнтно в интервале температур 882-896°. Поле первичной кристаллизации его из расплава в разрезе лежит в области составов, содержащих HgS> 55 мол.%. При понижении температуры из некоторых составов тиогаллата, равновесных выше 850°С, выпадает неизвестныя "фаза "Х" в мелкодисперсном состоянии. Из зерен, образовавшихся при более низкой температуре, "фаза "Х" не выпадает.

I. Бадиков В.В., Матвеев И.Н., Панютин В.Л. и др. Вырацивание и оптические свойства тиогаллата ртути.- Квантовая электроника, 1979, т.6, № 8, с.1807-1810.

2. Бадиков В.В., Матвеев И.Н., Пшеничников С.М. и др. Выращивание и нелинейные свойства нgGa₂S₄ .- Квантовая электроника, 1980, т.7, № 10, с. 2235-2237.

3. Бадиков В.В., Портнов В.И., Рычик О.В., Тилопа А.Г. Исследование роста монокристаллов тиогаллата ртути. В кн.: Материалы для оптоэлектроники. Тезисы докл. Ужгород, 1980, с.24-25.

4. Метлинский П.Н., Тырзиу В.Г., Маркус М.М., Дерид О.П. Лиаграмма состояния системы Hgse-Ga₂Se₃. - Монокристаллы и техника, I(8). Харьков, I973, c.52-56.

5. Панютин В.Л., Понедельник Б.Э., Розенсон А.Э., Чижиков В.И. Зонная структура полупроводников HgGa₂S₄ и HgGa₂Se₄ .-Физ. и техн. полупроводников, 1979, т.13, # 6, с.1211-1213.

6. Beun J.A., Nitsche R., Lichtensteiger M. Optical and elektrical properties of ternary chalcogenides.- Physica, 1961, v.27, p.448-452.

7. Hahn H., Frank Y., Klinger W., Störger A.D., Störger G. Ternary chalcogenides of aluminium, gallium and indium with zinc, cadmium and mereury.- Zeitsch. Anorg. Allg. Chem., 1955, Bd.279, s.241-270.

8. Krausbauer L., Nitsche R., Wild P., Mercury Gallium Sulfide HgGa₂S_L, a new Phosphor.-Physica, 1965, v.31, p.113-121.

9. Levine B.F., Bethea C.G., Kasper H.M., Thicl F.A. Monlinear Optical Susceptibility of HgGa₂S₄. Journ. Quantum Electronics, 1976, v.12, N 6, p.367-368.

10. Potter R.W. II, Barres H.L. Phase relations in the Hg-S. - Amer. Min., 1978, v.63, p.1143-1152.

С.Н.Ненашева, Е.Ф.Синякова ТЕРМОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТИ СИСТЕМЫ АК-Ga-S

Системе Ag-Ga-S принадлежит фаза AgGaS₂, обладативя ценними электрооптическими свойствами. В литературе очень много данных по выращиванию кристаллов AgGaS₂, по их физическим свойствам, но данных по фазовой лиаграмме системи Ag-Ga-S мало. Нам известна только работа [3]. Несмотря на широкое исследование тиогаллата серебра – AgGaS₂, в литературе много противоречивых данных об этой фазе. Даже температура плавления AgGaS₂, по разным данным, различная: 900, 1040, 970, 998^оC [4-7].

В связи с этим была поставлена работа по изучению части системы Ag-Ga-S. Было синтезировано 40 образцов (табл.I,2). Способ синтеза описан в работе [2]. Термический анализ проводился на установке, описанной Б.А.Алабужевым [1].

Термические эффекты приведены в таблицах 2 и 3.

Для образцов системы Ag-Ga-S жарактерно довольно большое переохлаждение до 50-70°С, поэтому температуры плавления определяли по термограммам нагревания. Ошибка определения температур составляет $\pm 5^{\circ}$ С (табл.2,3). Для всех образцов снимали как кривне ШТА, так и ДТА, поскольку в большинстве случаев они дополняли друг друга. Например, в образдах составов от 10 до 50 мол.% Ga₂S₃ кривые ДТА не фиксировали более слабый, чем эффект эвтектического плавления и очень близкий к нему по температуре эффект распада фазы Ag₅GaS₄ (рис.1,а), а кривые ПТА, записывая вышеотмеченный слабый эффект, не фиксировали или фиксировали (в случае удачно подобранной скорости съемки) очень смазанным, нечетким пиком эффект плавления (рис.1,6).

Образци, имеющие состав от 3 до 8 мол.% Ga_2S_3 , как на кривих ПТА, так и ДТА имеют следукщие термические эффекти: при $35\pm5^{\circ}C$ эффект полиморфного превращения в фазе Ag_9Gas_6 , при I72 и $583\pm5^{\circ}C$ – полиморфное превращения в Ag_2S , при $730\pm2^{\circ}C$ – эвтектика между Ag_2S и Ag_9Gas_6 и эффект плавления. Эффект плавления по температурам близок к эвтектике, но тем не менее они очень хорошо разрешаются (рис.2) в отличие от термограмм всех других образцов системи Ag-Ga-S.

Taojinia I

Фазовый состав образцов разреза Ag2S-Ga2S3

Состав, мол.%	Тем	После синтеза					
¥£52	400	500	600	720	820	920	Скорость охлажде- ния, 1000/час
100					1.1		Aĸ
97	Ar+B	Ar+B	Ar+B	Aĸ+B	-	-	Ar+B
95	Ar+B	Ar+B	Ar+B	Aĸ+B	-	_	Aĸ+B
92	B+Ar	B+Ar	B+Aĸ	B+Ar	-		B+Aĸ
90	В	В	В	В	-	-	B+A
87,6	B+A	B+A	B+A	B+A	-	-	B+A
85	B+A	B+A	B+A	B+A	-	-	B+A+E
83,3	B+A	B+A	B+A	B+A	-	-	B+A+E
80	B+A	B+A	B+A	B+A	B+A	-	B+A+E
75	A+B	A+B	A+B	B+A	B+A		A+B+E
70	A+B	A+B	A+B	A+B	B+A	-	A+B+E
60	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B	A+B
50	Α	A	A	Α	Α	Α	A
40	A+C	A+C	A+C	A+C	A+C	A+C	A+C
35	A+C	A+C	A+C	A+C	A+C	-	A+C
30	A+C	A+C	A+C	A+C	A+C	-	A+C
29	C+A	C+A	C+A	C+A	C+A	-	A+C
25	C+A	C+A	C+A	C+A	C+A	-	C+A
20	C+A	C+A	C+A	C+A	C+A	C+A	C+A
I5	C+A	C+A	C+A	C+A	C+A	C+A	C+A
IO	C+A	C+A	C+A	C+A	C+A	C+A	C+A
9	C	C	C	C	С	С	C
5	C+K	C+K	C+K	C+K	C+K	C+K	C+K
0	-	-	-	-	-	-	К

Ak - Ag_2S , B - Ag_9GaS_6 , E - Ag_5GaS_4 , A - $AgGaS_2$, C - $Ag_2Ga_{20}S_{31}$, K - Ga_2S_3

Фазовый состав и температуры термических эффектов образцов части системы Ag-Ga-S

Номер Состав образца, образца мол.%			зца,	Состав образца, вы- раженный формулой	Фазовый Состав	Температура термических эффектов, °С						
	Ag	Ga	S		00pasua							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II		
6	25	25	50	AgGaS	A	_	-		995	1000		
9	24,92	25,05	50,03	AgGa 005S2 0075	A	-	-	-	99 5	1000		
2	24,84	25,09	50,06	AgGa, 015	A	-	-	-	995	1000		
IO	24,77	25,14	50,09	AgGa, 015S2 0225	Α		-	-	996	1006		
I	24,69	25,18	50,I2	AgGa, 02S2 02	A+C	-	-	9I0	996	I009		
38	24,62	25,23	50 , I5	AgGa, 025 ^S 2 0275	A+C	-	-	910	995	1000		
37	24,54	25,28	50,18	AgGa, 0252,0075	A+C	-	-	910	99I	998		
36	24,46	26,32	50,2I	AgGa, 03582 0525	A+C	-	-	9I 0	995	1000		
28	24,39	25,36	50,24	AgGa, CIS2 OF	A+C	-	-	9I0	995	1007		
29	24,24	25,45	50,30	AgGa, 05S2 075	A+C	-	-	902	994	998		
33	24,IO	25,54	50,36	AgGa, oc S2 00	A+C	-	-	890	990	1002		
3I	23,8I	25,7I	50,48	AgGa, 00 2,09	A+C	-		893	988	IOOI		
I4	24,98	24,98	50,04	AgGaS2 0005	A+s		-	-	994	I000		
12	24,97	24,97	50,06	AgGaS _{2,005}	A+s	-	·	-	996	1000		
II	24,94	24,94	50,12	AgGaS2,01	A+S	-	-	-	995	1000		

Продолжение табл. 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
23	24.84	24,97	50,19	Ag0, 995 ^{GaS} 2, 01	A+s	-	-	-	995	999
24	24,78	25,03	50,19	Ag0,99 GaS2,005	A+s	-	-	-	994	I000
32	24,24	25,25	50,50	Ago, 96 GaS2	A+s	-	-		995	I000
8	25.08	24,95	49,97	Ag1,005 GaS2,0025	A+B	757	-		994	999
5	25,16	24,91	49,94	Age or GaS	A+B	757	-	-	995	I000
7	25,23	24,86	49,9I	A64 045 GaS2 0005	A+B	758	-		995	I000
4	25.3I	24.8I	49.88	Age or GaS	A+B	757	_	-	995	999
19	25,19	24.69	50,12	Aga og Gao og So og	A+B+ S	757	-	-	993	996
17	25,02	25.02	49,97	ArGaS, 0075	А+Д	-	967	-	989	996
16	25.03	25.03	49.94	ArgaSa 005	A+Д	-	967	-	990	996
15	25.06	25.06	49.87	AgGaS, 00	А+Д		967	-	989	996
20	24,81	25,31	49,87	Ag0,99 ^G 1,01 ^S 1,99	А+Д	-	966	-	985	996
	А — ти Д — фа	Iorajuan 13a Ag _z G	cepeóp	а AgGaS ₂ желтого цвета - элементарная сера	; B - фа	38 Ag	9 ^{GaS}	6 ;	C - фаза Ag2Ga2	20 ⁸ 31

ယ္လ

Таблица З

Термические эффекты по системе Ag₂S - Ga₂S₃

120102000000		1000		10000	1000	18.810.00	1000					-	
rep aana	Состав в мол.%		T (ермич средн	ески	е эфі	berti cron		и наз терм	грево 10гра	e, C ^o) 8)	
E BOR	Ga2S3	Ι	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	12
	0	-	I70	583	-	-	-	-	-	-	-	-	824
22	3	35	I74	584	730	-	-	-	-	-	-	-	773
I	5	35	I72	583	729	-	-	-	-	-	-	-	767
23	8	34	I73	584	730	-		-	-	-	-	-	765
2	IO	32	-	**	-	-	-	-		-	-		767
3	12,4	35	- 1	-	-	757	-	-	-	-	-		767
4	I5	33	-	-	-	759	-	-	-	-	-	-	768
5.	I6 , 7	34	-	-	-	758	764	-	-	-	-	-	789
6	20	35	-	-	-	752	765	-	-	-	-	-	807
7	25	35	-	-	-	756	765		-	-	-	-	839
8	30	35	-	-	-	754	765	-	-	-		-	898
9	40	-	-	-	-	757	760	-	-	-	-	-	967
IO	50	-	-	-	-	-	-		-	-		-	995
II	60	26	-	-	-	-	-	910	-	-		-	968
12	65		-	-	-	-	-	915	-	-	-	-	95I
13	70	32	-	-	-	-	-	909	-	-	-	-	-
I4	7 I	-		-	-	-		906	-	-	-	-	917
I5	75	26	-	-	-	-		910	-	- '	-	-	946
16	80	28	-	-	-	-	-	915	-	-	-	-	986
17	85	26	-	-	-	-	-	<u>9</u> 10	-	994	-	-	I024
18	90		-	-	-	-	-	-	954	986	1025	5-	I046
19	91	-		-	-	-	-		969	986	1025	5-	1051
20	95	-	-		-	-	-		969	984	1025	5 1053	B I072
2I	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IOIS)_	III6

Образец, содержащий IO мол.% Ga₂S₃, плавится конгруэнтно при 765[°], имеет полиморфный переход при 35[°]С и соответствует фазе Ag₉GaS₆. Состав I2,4 мол.% Ga₂S₃ доэвтектический и поэтому имеет эффекты при 35[°]С, при 756[°]С – эвтектика между Ag₉GaS₆ и AgGaS₂ и при 767[°]С – эффект плавления.

Образцы состава от I5 мол. % Ga₂S₃ до 40 мол. % Ga₂S₃ имеют одинаковые термические эффекты: уже отмечавшийся эффект при 35⁰С,



Рис. І. Термограммы образца состава 20 мол. % Ga2S3. а - ДТА; 6 - ПТА



Рис. З. Термограммы образцов состава: I5 мол. % Ga2S3 (а), I6,7 мол. % Ga₂S₃ (d), 20 MON.[#] Ga₂S₃(B), 25 MON.[#] Ga₂S₃(r), 30 MON.[#] Ga₂S₃ (Π), 40 MON.[#] Ga₂S₃ (e)



Рис. 2. Термотраммы образцов 3, 5, 8 мол.% Ga2S3. ПТА

1400 T°C



Рис. 4. Термограммы образцов состава: 50 мол. % Ga2S3 (а), 60 мол. % Ga2S3 (б), 85 мол. % Ga2S3(в), 90 мол. % Ga2S3 (г)
эффект эвтектики между Ag₉GaS₆ и AgGaS₂ при 756⁰С, эффект распада фазы Ag₅GaS₄ на Ag₉GaS₆ и AgGaS₂ при 765⁰С, фиксирующийся только кривыми ПТА и эффект плавления (рис.3), который отмечается четче по кривым ДТА.

AgGaS₂ имеет эффект плавления при 995⁰С, осложненный дополнительным слабым эффектом при IOOO^OC. Его природу выяснить не удалось (рис.4,а).

Термограмми следущей области составов от 50,75 до 80 мол.% Ga_2S_3 имеют по три (за исключением образца состава 70 мол.% Ga_2S_3 , имеющего только два) эндотермических эффекта: эффект при $25\pm5^{\circ}C$ – полиморфное превращение в фазе $Ag_2Ga_{20}S_{31}$, эффект эв-тектики между $AgGaS_2$ и $Ag_2Ga_{20}S_{31}$ при $9I0^{\circ}C$ и эффект плавления. Образец состава 70 мол.% Ga_2S_3 – эвтектический, поэтому имеет только два эффекта – полиморфного превращения и эвтектического плавления (рис.4,6).

На термограммах образцов составов от 85 до 95 мол.% Ga_2S_3 появляется новый эндотермический эффект, при 987°С, соответствуищий реакции перитектического образования фазы $Ag_2Ga_{20}S_{31}$, эффект при 1020° С – полиморфного превращения в Ga_2S_3 и эффект плавления (рис.4, в, г). Ках видно из табл.2, соединение $AgGas_2$ имеет небольщур область твердых растворов, доходящую до 0,75 мол.% Ga_2S_3 в $AgGas_2$, т.е. область эта лежит в разрезе Ag_2S – Ga_2S_3 . Образцы, содержащие I мол.% Ga_2S_3 и больше, содержат вторую фазу – $Ag_2Ga_{20}S_{31}$ и на термограммах имеют дополнительный эффект при 910°С. Образцы, обогащенные серой по сравнению с составом $AgGas_2$, также двухфазные, хотя дополнительных эффектов на термограммах и не имеют (№ I4, I2, II, 23, 24, 32, табл.2). Образцы, обедненные серой (№ I7, I6, I5, 20, табл.2), содержат дополнительно интерметаллическую фазу – Ag_3Ga и имеют, кроме эффекта плавления, еще один термический эффект при 967°С.

По полученным результатам термического анализа можно построить фазовур диаграмму разреза $Ag_2S-Ga_2S_3$ (рис.5). В разрезе существуют четыре промежуточных соединения: два конгрузнтно плавящихся (Ag_9GaS_6 и $AgGaS_2$) и два инконгрузнтно (Ag_5GaS_4 и $Ag_2Ga_{2O}S_{31}$). Соединение Ag_5GaS_4 на рис.5 не показано, поскольку область его существования по температуре (~756-765°) очень узкая и нижняя граница устойчивости не определена. На диаграмме показана только перитектическая горизонталь (765°), отвечающая



Ряс. 5. Фазовая джаграмма разреза Agos - Gaosz

распаду Ag₅GaS₄ на AgGaS₂, и жидкость, обогащенную Ag₂S. Нижняя граница устойчивости очень близка по температуре к эффекту звтектического плавления, поэтому зафиксировать эффект распада фазы не удалось.

Термический анализ позволил зафиксировать три эвтектических горизонтали: 730, 756 и 910° С и две перитектических: 765 и 987° С, а также полиморфние превращения в фазах: Ag_2S , Ag_3Ga_5 , $Ag_2Ga_{20}S_{31}$ и Ga_2S_3 , равные: 172 и 584° С для A_{2S} , 34° С для Ag_3Ga_5 , Ag_3Ga_5 , 26° С для $Ag_2Ga_{20}S_{31}$ и 1025° для Ge_{-33} .

Приведенные термограмми указывают на то, что при исследовании систем далеко не всегда достаточно иметь кривые ДТА либо ПТА. Поскольку они часто дополняют друг друга, необходимо иметь как те, так и другие кривые, чтобы не пропустить эффектов слабих, но близких по температуре, к очень большим эффектам.

Литература

I. Алабужев Б.А. Установка дифференциального и производного термического анализа. – В кн.: Экспериментальные исследования по минералогии (1968–1969 гг.). Новосибирск. Изд-ние ИТыГ СО АН СССР, 1969, с.168–175.

2. Ненашева С.Н., Синякова Е.Ф. Фазовая диаграмма разреза Ag₂S-Ga₂S₃. – Изв. АН СССР. Неорганические материалы. (В печати).

3. Brahdt G., Krämer V. Phase investigations in the silver - galium - sulphur system.- Mat. Res. Bull., 1976, v.11, p.1381-1388.

4. Chedzey H.A., Marshall D.J., Parfitt H.T., Robertson D.S. A stidy of the melt growth of single-crystal thiogallates.-Jorn. Appl. Physics, 1971, v.4, N 9, p. 1320-1324.

5. Cound V.M., Davies P.M., Hulme K.T., Robertson D. The electrooptic coefficients of silver thiogallate (AgGaS₂).- Jorn. Phis. Chem., 1970, v.3, p.83-84.

6. Felgeson P.S. The growgth of ternary semiconductor crystals suitable for device applications.- Journ. de Physique,1975, t.36 N 9, p.5-14.

7. Von Harry Hahn., Frank G., Klinger W. Über einige ternäre chalkogenide mit Chalkopyrit - struktur.- Zeitsch. Anorg. Chemie. 1953, Bd.271, 8.153-170.

УДК 541.12.013

Ж.Н.Федорова

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗОЛОТА С МЫШЬЯКОМ И СЕРОЙ ПРИ НАГРЕВАНИИ

Поскольку золото в природных условиях часто ассоциируется с сульфидно-мышьяковыми минералами [3,6], а данных по изучению тройной диаграммы Au-As-S нет, то результаты изучения характера взаимодействия золота с мышьяком и серой при нагревании представляют интерес для металлургов, занимающихся технологией переработки сульфилных руд, содержащих золото и мышьяк, а также для геохимиков, решающих проблемы формирования золоторудных месторождений.

Экспериментально изучены только двойные диаграммы Au-S, Au-As и As-S.

С серой золото может образовывать сульфиды состава Au₂S, Au₂S₂ и Au₂S₃ [4]. Все

они были получены препаративным методом из растворов и обычно разлагаются при натревании до 470-5130К. Диаграмму состояния системы Au-S пытались изучать при атмосферном давлении [2]. Максимальная растворимость серы в расплаве золота составляла 0.84 вес.% (4.95 ат.%), а температура тройного равновесия: расплав ачтв + +S _{газ} - равна I321⁰К (рис. I).

Диаграмма состояния золото-мышьяк изучалась только в части. богатой золотом, и при атмосферном давлении [2]. Согласно этим исследованиям, мышьяк понижает температуру плавления золота до 938⁰К.



Рис. I. Диаграмма состояния системы Au-S при давлении I атм [2]

Эта температура отвечает эвтектической реакции кристаллизации расплава золота и мышьяка при содержании последнего 46-47 ат. %.

В системе As-S 5,8 мышьяк образует эвтектику с As₄S₄ при 452<u>+</u>4⁰К и содержании 56 ат.% As , а также область несмепивалицияся расплавов в интервале составов 2-23 ат.% S[8] и температуре IO48<u>+</u>3⁰K.

Естественнее всего предположить, что самые легкоплавкие сплавы в тройной системе Au-As-S должны лежать вдоль линии, соединяющей эвтектические точки на сторонах As-S и Au-S. Для исследования были приготовлены образцы, лежащие на линии Au_{0,6}As_{0,4}-As_{0,58}S_{0,42}.

Таблица I

ang	Содержание	элементов,	ат. %	Отношени	Me As:S
HOM	Au	As	S	As	S
I	5,8	56,5	37,7	60	40
2	I8,0	53,3	28,7	65	35
3	29,6	49,3	2I,I	70	30
4	37,I	47,2	15,7	75	25
5	44,0	44,8	II,2	80	20
6	48,4	43,8	7,8	85	I5
7	53,I	42,2	4,7	90	IO

Составы синтезированных образцов

Образцы массой ~3.2.10-2г были приготовлены из золота N сплавов мышьяка с серой, взятых в соотношениях, указанных в табл. І, а также точками на рис. З. Для этого использовали сплавы, полученные ранее при изучении системы Ав-S[5]. Шихту взвешивали HA BECAX OXDMH "Mettler" C TOTHOCTED +2.10⁻⁵r IDAMO B ампулах для термического анализа. Для уменьшения свободного объема внутрь каждой ампулы вставляли стержень из кварцевого стекла. После вакуумирования и запайки образци были нагрети до 1000°К. затем, после охлаждения для них были сняты кривые ПТА на **у**становке. конструкция которой описана Б.А.Алабужевым [I]. Полученные результаты приведены в табл.2. Все образцы имеют термический эффект при средней температуре 902+2°K. Изучение аншлифов, I и 5 показало, что для данной сисприготовленных из образцов темы характерна ограниченная смесимость в жидком состоянии. Жидкость Ж,, затвердевания при более высокой температуре, в аншлифе представлена главным образом эвтектической смесью золотомышьяк, а другая жидкость (Т), затвердевания позднее, представлена мышьяком и его сульфидами с очень мелкими (величиной ~ IM) вкличениями золота. Образец I в основном представлен фазой

Номер образца	Температ, натревани	TPA TEPA	полученных при				
I	408	-	453	487	900	-	-
2	406	-	454	-	902	913	949
3	407		453	-	902	9I0	-
4	403	-	-		902	-	-
5	403	4 I0	4 5I	-	900	-	939
6	403	4 I0	457	-	903	913	939
7	-	-	-	-	903	916	934

Результаты термографического анализа

E₂ и содержит редкие небольшие капли фазы E₁, а образец 5 обогащен Фезой E₁.

Чтобы интерпретировать полученные данные, необходимо суммировать все имеющиеся сведения по системе Au-As-S .

Поскольку фратмент системы Au-S (см. рис.I) [2] построен только при давлении I атм, его нужно рассматривать как изобарное сечение P - T - X -диатраммы системы Au-S.

Сера имеет критическую точку при 1313⁰К и 179,7 атм (18,2 MILa) [7]. Следовательно, при работе в герметичной ампуле с фиксированным объемом поле устойчивости твердого золота с жидкой фазой, богатой серой, может распространяться по крайней мере до IЗІЗ^ОК. Из лиатраммы Ал-S [2] следует, что при давлении I атм (lgP_{Па} = 5,00) тройное равновесие: Au_{TB} + расплав, богатый золотом, + газ - имеет температуру I321°К. Если из тройной точки золота (I336⁰K, 1g P_{Па} = -2,68) проведем линию через точку трехфазного равновесия (Au_{тв.} + E_(Au) + пар) при I атм, то заметим, что с увеличением дабления пара температура трехфазного равновесия уменьшается незначительно, содержание серы в расплаве VBeличится тоже незначительно. Можно также далее предположить, что при встрече этой линии с линией трещазного равновесия, включаюцей расплав, богатый серой, мы получим точку четверного рановесия I(Au) + I(S) + Au_{TR} + газ. Таким образом, для системы Au-S MORHO Ожилать наличие области сосуществования двух жилкостей с температурой монотектической реакции ~1300°К.

Если считать, что на тройной диаграмме поле сосуществования



Рис. 2. Схема плоской диаграмми состояния системи Au-As-S Точками обозначены составы исследованных образцов

расслаивающихся жидкостей сливается с аналогичным полем СИСТЕМЫ As-S (рис. 2), то область расслаивания пересекает два поля кристаллизации (золота и мышьяка). В этом случае термический эффект при Т = 902⁰К можно отнести к монотектическому четырехфазному равновесию Ж_I = Au_{тв.} + Аз_{тв.} +Ж₂. Термический эффект, свойственный этой реакции, будут иметь все образцы, лежащие в треугольнике Ац-Аз-Д2. На основе выбранной нами схемы можно построить политермическое сечение системы Au-As-S по линии AuO.6-SO.4 -Ав0. 58S0.42 (рис. 3). Как видим, данные термического анализа не противоречат выбранной нами схеме.

Итак, данное исследование показало, что мышьяк и сера могут понижать температуру плавления золота до 902°К (629°С) и этот

ЗОЛОТО-МЫШЬЯКОВОсульфидный расплав солержит не менее 53 ат.% (75 вес.%) золота. Сульбилно-мыльяковый расплав, затвердеварний окончательно при ~ 450°К, растводяет очень небольшое количество золота. по крайней мере по предварительным данным, не более 0.2 ат.% при 700°K.



Рис.3. Политермическое сечение через диаграмму состояния Au-As-S по линии Au_{0,6}As_{0,4}-^{As}0,58^S0,42

Хочу поблагодарить Г.Р. Колонина за проявленный интерес к

данной работе, детальное ее обсуждение и полезные замечания.

Литература

I. Алабужев Б.А. Установка диференциального и производного термического анализа.- В кн.: Экспериментальные исследовачия по минералогии (1968-1969 гг.). Новосибирск: Изд-ние ИГиГ СО АН СССР, 1969, с.168-171.

2. Вол А.Е., Каган И.К. Строение и свойства двойных металлических систем.- М.: Наука, 1976, т.П.- 814 с.

3. Петровская Н.В. Самородное золото.- М.: Наука, 1973. - 347 с.

4. Самсонов Г.В., Дроздова С.В. Сульфиды. – М.: Металлургия, 1972. – 303 с.

5. Федорова Ж.Н., Эпова Е.И. Термографическое исследование системы As-S. – В кн.: Исследования по экспериментальной минералогия. Новосибирск: Изд-ние ИГиГ СО АН СССР, 1978, с.12-18. 6. Boyle R.W. The geochemestry of gold and its deposits. Ottawa, 1979.- 584 p.

7. Rau H., Kutty T.R.N., Guede de Carvalho J.R.F. High tem perature saturated vapour pressure of sulphur and the estimation of its crytical quantities. - Journ. Chem. Thermodynamics, 1973, v.5, p.291-302.

8. Rene C., Bernard L., Parviz K. Sur la systeme arsenic soufre: etude entre 500 et 950°C des equilibres des phases dan le sectur le mite par l'arsenic et le sulfure As₂S₂.- Compte Rendu Acad. Sci Sec. C., 1977, v.284, N 13, p.495-498.

УДК 549.3+536.244

Ж.Н.Федорова, М.В.Михайлик

УПРУГОСТЪ И МОЛЕКУЛНРНЫЙ СОСТАВ ПАРОВ СЕРЫ НАД КОВЕЛЛИНОМ ПРИ 669-772⁰К

Ковеллин (CuS) является членом системи Cu-S. Он устойчив до температури 507<u>+</u>3^OC [5], выше которой плавится инконгруэнтно с образованием дигенита (Cu_{2-x}S) и жедкой сери. При более низких температурах ковеллин диссоциирует с образованием дигенита и паров сери.

Упругость пара над ковеллином определяли разными методами [2,4,6], (рис.1). Нами для определения упругости паров серы над ковеллином был использован кварцевый мембранный манометр [I]. Давление компенсирующих газов (воздух, аргон) измеряли с помощью катетометра КМ-8. Объем рабочей камеры ~7 см³. Вес образца, взятого для исследования, ~2 г. Для более бистрого достижения равновесия образец был растерт в порошок. Температуру измеряли термопарой ПП-I с помощью потенциометра ЕZ-8. Стабильность поддержания температуры $\pm 1^{\circ}$ С. После первого цикла измерения остаточные газы были откаченые после второго цикла, быле введена поправка. Точность измерения давления $\pm I$ мм (I30 Па). Результаты измерений приведены в табл. I и на рис. I. Полученные результаты описываются уравнемием:



Рис. I. Температурная зависимость упругости диссоциации ковеллина

I – наши данные, мембранный манометр; 2 – данные [2], в двухтемпературных печах, когда давление паров серы задается температурой жидкой серы,находящейся в более холодной зоне; 3 – данные [6], кварцевый спиральный манометр; 4 – данные [2], метод потока; 5 – данные [4], метод точки росы

 $lgp(IIa) = \frac{71220}{T} + II3,496 lnt - 842,009.$

При низких температурах основная погрешность вносится за счет неточности измерения давления, а при более высоких - за

Таблица I

Результаты измерения давления паров серы над ковеллином

Т ^о К	Ризм. мм рт.ст.	Р <mark>изм.</mark> , Па	1g (Р, Па	1g а) (Р,Па) _{расч.}	<u>∧(</u> 1gP)	<u>+</u> a(1gP) _p	<u>+</u> _(1gP) _T
669	4,29	57I	2,757	2,829	0,072	0,087	0,010
692	II,45	I523	3,183	3,127	-0,056	0,044	0,015
708	20,49	2725	3,435	3,395	-0,040	0,023	0,018
727	40,34	5365	3,730	3,772	0,042	0,010	0,021
743	90,96	I2098	4,083	4,133	0,050	0,005	0,024
749	I42 , 75	I8986	4,278	4,278	0,000	0,003	0,025
749,5	I46,88	I9535	4,291	4,290	-0,00I	0,003	0,025
752,5	163,41	21734	4,337	4,365	0,028	0,003	0,025
759	24I,2I	3208I	4,506	4,53I	0,025	0,002	0,026
760	264,12	35128	4,546	4,557	0,0II	0,002	0,026
76I	284,06	37780	4,577	4,582	0,005	0,002	0,026
762	328,10	43637	4,640	4,609	-0,03I	0,002	0,026
764	372,06	49484	4,694	4,662	-0,032	0,002	0,027
765	391,4	52056	4,716	4,688	-0,028	0,002	0,027
766	409,II	544I2	4,736	4,715	-0,02I	0,001	0,02?
768,5	446,I	59 33 I	4,773	4,777	0,004	0,00I	0,027
769,0	468,43	6230I	4,794	4,790	0,004	0,00I	0,028
77I	529,32	70400	4,848	4,851	0,003	0,000	0,028
77I, 5	557,39	74133	4,870	4,864	-0,006	0,000	0,028

 $P_{\text{изм.}}$ - давление внутри манометра с учетом поправки на остаточные газы; $\Delta(1gP) = 1g(P_{pacy.}) - 1g(P_{изм.}); \Delta(1gP)_{p}$ погрешность, вносимая ошибкой измерения давления ± I мм рт. ст. (I30 Па); $\Delta(1gP)_{T}$ - погрешность, вносимая ошибкой измерения температуры ± I^OC

счет неточности в измерении температуры (см. табл. I).

Для практического использования данных по определению упругости пара необходимо знать состав газовой фазы.

В изучаемом интервале температур газовая фаза представлена парами серн. Вакихара и др. [8] на основе экспериментальных данных Брауна [3] и Роу [7], измерявших плотность ненасыщенных паров серы при разных давлениях и температурах, рассчитал и привел в виде таблиц парииальные давления всех молекулярных форм серы (S2,S3,S4,S5,S6, S7,S8) для температур и давлений, приведенных в работе Брауна и др. [3].

На основе этих таблиц нами онли рассчитаны константы писсоциации серы по реакциям типа Si = 1/2S2 для TeMIleратур 623-1273°К.

$$K_1 = P_{S_2}^{*'}/P_{S_1}$$

(1 — количество атомов серн в молекуле
газа). Затем были рассчитаны темпера-
турные зависимости этих констант. Они
выражаются следущими уравнениями:
 $lgK_3 = -2920/T - 0,136lnT + 4,766$
 $lgK_4 = -6189/T - 0,429lnT + 10,5275$
 $lgK_5 = -11607/T - 0,782lnT + 18,9495$
 $lgK_6 = -15500/T - 1,105lnT + 24,682$
 $lgK_7 = -18405/T - 1,437lnT + 30,075$
 $lgK_8 = -22525/T - 1,748lnT + 36,928$
Исходя из того, что общее давление серы
является суммой парциальных давлений

]

1

]

1

1 1



Рис. 2. Мольная RIOI молекулярных видов серы в газовой фазе, равновесной с ковеллином и пигенитом

всех молекулярных видов и принимая Ni парциальной долей молекул, содержащих і атомов серы, можем выразить константу равновесия через общее давление и парциальные доли:

 $K_i = N_2^{1/2} \cdot P_{m_i}^{(1/2-1)} / N_s$ Решая систему уравнений: $N_i = 1$

 $\lg N_{i} = i/2 \cdot \lg N_{2} + (i/2 - 1) \lg P_{OOM} - \lg K_{i}$

для молекул, содержащих от 2 до 8 атомов, можем рассчитать COCтав газообразной серы при заданных температурах и давлениях. В табл. 2 приведены результаты расчета состава газовой фазы, равновесной с ковеллином и дигенитом.

Как видим (рис.2), в газовой фазе почти во всем изучаемом интервале температур преобладают шестиатомные молекулы серы, хотя их содержание почти не превышает 30%. С повышением температуры и соответственно общего давления паров возрастает мольная доля семи- и восъмиатомных молекул серы, в то время как резко уменьшается мольная доля молекул S_.

Общее давление, состав и плотность газовой фазы, равновесной с ковеллином и диагенитом при температурах 673-773⁰К

ток	673	698	723	748	773
Робщ Па(ат)	629 (0,006)	I666 (0,0I6)	4872 (0,048)	17934 (0,177)	80475 (0,796)
N2	0,288	0,269	0,229	0,161	0,094
N ₃	0,035	0,036	0,035	0,030	0,02I
N ₄	0,015	0,017	0,018	0,018	0,015
N ₅	0,053	0,050	0,048	0,043	0,035
N ₆	0,303	0,305	0,299	0,294	0,277
^N 7	0,167	0,178	0,204	0,243	0,285
N ₈	0,I39	0,I45	0,167	0,212	0,273
γ	5,105	5,200	5,433	5,860	6,327
<i>Р</i> г/см ³	I,846.IO ⁻⁵	4,802.10-5	I,4I6.10-4	5,44I·I0 ⁻⁴	2,548.10

 N_1 — мольная доля молекул, содержащих і атомов серы; V — усредненное число атомов серы в молекуле газа; ρ — плотность газа

Итак, в данной работе измерена упругость диссециации ковеллина и рассчитан состав газовой фазы для исследуемого интервала температур. Данные по определению упругости пара для температур выше 720°К довольно хорошо согласуются с литературными данными.

Литература

I. Суворов А.В. Термодинамическая химия парообразного состояния.- Л.: Химия, 1970.- 208 с.

2. Allen E.T., Lambard R.H. A method for determination of dissociation pressures of sulphides and its aplication to covellite (CuS) and pyrite (FeS₂). - Amer. Journ . Sci., 1917, v.43, p.175-195.

3. Braune H., Peter S., Neveling V. Dissoziation des Schwefeldampfes.- Zeitsch. Naturforschung, 1951, Bd. 6A, s.32-37.

4. Dickson F.W., Shields L.D., Kennedy G.S. A method for the determination of equilibrium sulphur pressures of metal sulphide reactions. - Econ. Geol., 1962, v.57, N 7, p.1021-1030.

5. Kullerud G. The upper stability curve of covellite - In.: Carnegie Inst. Wash. Year. Book, 1957, v.56, p.195-197.

6. Preuner G., Brockmöller J. Gasdruckmessungen mit spiralmanometr aus Quarzglas. - Zeitsch. Phys. Chem., 1912, Bd. 81, s. 129-170.

7. Rau H., Kutty T.R., Guede de Carvalho J.R.F. "Thermodynamics of sulphur vapour". - Journ. Chem.Thermodynamics, 1973, v.5, p.833-844.

8. Wakihara M., Nii G., Uchida T., Tanigushi M. Calculation of partial pressures on each sulfur species in total sulfur vapour at temperatures from 350 to 1000⁰C under one atmospheric pressure. - Chemistry Letters, 1977, p.621-626.

УДК 550.41:553.21/24

Г.Р.Колонин, О.В.Артеменко, Ю.В.Лаптев, М.С.Сахарова

УСЛОВИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СЕРЕБРА В РАСТВОР ИЗ СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩЕРО **ГАЛЕНИ**ТА

В гидротермальных месторождениях серебро обично присутствует в нескольких минеральных формах: в виде серебросодержащего галенита, сульфидов и сульфосолей серебра, самородных минералов золото-серебряного ряда и других. Отложение этих минералов обично происходит неодновременно и охватывает две или несколько стадий. При этом более ранними образованиями являются серебросодержалий галенит и аргентит, тогда как поздние минералы представлены сульфосолями и самородной формой. Многостадийность процесса рудообразованиям и взаимодействие последующих порций гидротер-

мальных растворов, неравновесных с ранее образованными минералами, должны приводить к переотложению их компонентов в виде новообразованных фаз. Примером подобной перегруппировки может служить заимствование серебра из ранних серебросодержащих галенитов и образование собственно серебряных минералов на одном из сереброносных месторождений на Востоке СССР [2].

Целью настоящей работы была экспериментальная проверка возможности селективного извлечения серебра из серебросодержащего галенита гидротермальными растворами. Одновременно наиболее благоприятные условия выноса серебра оценивались путем термодинамических расчетов через сравнение величин растворимости галенита и аргентита.

Эксперименты при температурах 200 и 300°С проводились в титановых автоклавах объемом около 40 см³, футерованных фторопластом-4, при обеспечении поддержания и регистрации температуры С помощью регуляторов ВРТ-З и самописца КСП лучше, чем в пределах +5°C. Использовался метод "закалки" высокотемпературных растворов. После охлаждения автоклава в течение 5-7 минут холодной водой содержание серебра и свинца в отобранных аликвотах определялось атомно-абсорбционным анализом на приборе Perkin-Elmer-400 при чувствительности порядка I·IO⁻³ мг/л для рь и 5·IO⁻⁴ мг/л цля Ag с воспроизводимостью в среднем ~15%. Концентрация сульридной серы устанавливалась иодометрическим методом [I]; pH растворов измерялся до и после опыта на приборе рН-340. Давление з автоклавах задавалось степенью их заполнения и было близко к зеличине 50 МПа (около 500 атм). В качестве шихты использовался галенит одного из сереброносных месторождений с содержанием ceребра около 700 г/т.

Основная часть экспериментов проведена в одномолярном растворе NaCl, исходное значение pH которого изменялось в диапазоне от 3 до II добавлением определенных концентраций HCl и NaOH. Для сравнения были поставлены также опыты в растворах H₂S, NaHS, Na₂S. NaHCO₃, Na₂CO₃ и NaOH, не содержащих хлор-иона, а также в миллимолярном растворе HCl. На основания предварительно полученных данных о времени достижения равновесия, продолжительность большинства экспериментов составляла 4-5 суток. Для оценки влияния на растворимость сульйидов окислительно-восстановительных условий для одномолярного раствора NaCl проведены три серии экс-



Рис.І. Зависимости концентраций свинца от конечных pH при растворения серебросодержащего

галенита в одномолярном растворе Nacl. Сплошние линии – для 300⁰, пунктир – для 200⁰С. Заполнение автоклавов: I,2 – на воздухе; 3,4 – в атмосфере аргона; 5,6 – на воздухе при добавлении H₂S до концентраций 0,02--0.05 мол/л



Рис.2. Зависимости концентраций серебра от конечных pH при растворении галенита в случае заполнения автоклавов в атмосфере аргона (кривая 3 – для 300°С, кривая 4 – для 200°С). Дополнительно показано изменение от pH логарифма соотношения концентраций серебра и свинца (кривая З' – для 300°, кривая 4' – для 200°С). ▲- 300°С; △ – 200°С



Рис. 3. Зависимости изменения коэффициента извлечения серебра из галенита для разных серий опытов. Усл. обозн. см. рис. J

периментов: I с герметизанией автоклавов на воздухе: 2 - с заполнением и герметизацией их в боксе в атмосфере аргона: 3 с предварительным продуванием раствора сероводородом до концентрации 0,02--0,05 моль/л при последующей герметизации ABTO-

клавов на воздухе.

Результаты экспериментов по изучению растворимости галенита в одномолярном хлоридном растворе показаны на рис. I и 2. На рис. З приведены зависимости от pH для разных серий опытов частного от деления отношения содержания серебра и свиния в растворе на величину их отношения в шихте, которое мы называем далее "коэффициентом извлечения" серебра из галенита. В качестве примера в таблице представлены также условия и результаты одной из серий опытов.

Как вилно из рис. І. в опытах с заполнением автоклавов на воздухе галенит обнаруживает наиболее высокую растворимость, которая довольно слабо зависит от рН раствора. Специальные меры по ограничению воздействия кислорода воздуха на условия эксперимента (атмосфера аргона или сероводорода) во всех случаях, кроме исходных кислых растворов, вызывают заметное уменьшение растворимости. Важно также, что в этих двух сериях кривые растворимости приобретают "нормальный" у -образный характер, связанный С преимущественным переходом сви:ща в раствор в кислой среде в виде клорокомплексов и в форме анионных гидроксокомплексов - в щелочных условиях [5]. Добавки сероводорода приводят к постоянному СНИЖЕНИЮ РЕСТВОРИМОСТИ ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМИ ОПЫТАМИ В АТмосфере аргона, Указывая на отсутствие заметного вклада в IDO-

Растворимость серебросодержащего галенита и коэффициент извлечения из него серебра в одномолярном растворе NaCl с добавками HCl, NaOH при температурах 300 и 200⁰С и давлении 50 MIa (заполнение автоклавов в атмосфере аргона)

Добавка к раствору NaCl	рН до/после	Состав раствора после опыта,			Leg $\frac{C_{Ag}}{C_{m}} \frac{p-p}{p-p}$	Lg CAg/CPb P-P		
моль/л С.		C _{H2S}	LgC'Pb	LgCAg	PDII	Ag/Po waita		
			300	0 ^o C				
10 ⁻³ HC1	3,21/3,12	0,002	-2,5	-5,4	-2,9	0,0		
-"	3,2I/5,36	0,002	-2,8	-5,I	-2,3	0,6		
5.IO-5HC1	5,54/5,52	0,001	-3,0	-5,8	-2,8	0,I		
без доба- вок	6,87/5,63	0,002	-2,9	-4,8	-I,9	I,0		
-"-	6,87/5,96	0,002	-3,I	-4,9	-I,8	I,I		
-"	6,87/7,I2	0,001	-5,5	-5,4	-0,I	2,8		
10^{-4} NaOH	IO,40/9,IO	0,00I	-5,3	-5,7	-0,4	2,5		
_"	9,97/9,82	0,003	-4,9	-5,7	-0,8	2,I		
2.10-3 NaOI	HII,37/II,3I	0,002	-4,3	-6,9	-2,6	0,3		
			200	0 ⁰ C				
10 ⁻³ нс1	3,36/3,4I	0,00I	-2,8	-5,7	-2,9	0,0		
_"	3,36/3,02	0,001	-2,8	-5,8	-3,0	-0,I		
5•10 ⁻⁵ нс1	5,07/5,53	0,001	-5,0	-7,4	-2,4	0,5		
без доба- вок	6,83/6,37	0,002	-5,5	-6,4	-0,9	2,0		
-"-	6,83/6,I3	0,00I	-6,2	-6,I	0,I	3,0		
IO-4NaOH	9,87/9,24	0,001	-6,0	-5,7	0,3	3,2		
2.10 ⁻³ NaOF	II,04/I0,88	0,002	-5,9	-7,4	-I,5	I,4		

цесс переноса гадросульфадных и сульфадных комплексов свинца. Подобный эффект влияния избыточного количества сероводорода был обнаружен в своё время в работе [6]. Аналогичный характер воздействия воздуха и сероводорода на процесс растворения галенита наблюделся нами и в экспериментах с использованием спектрофотометрических кювет. Существенно иной характер имеет растворимость серебряной компоненты галенита (рис.2 и табл.). В растворах, содержащих кислород, извлечение серебра из галенита было минимальным. Коэффициент извлечения серебра возрастает в опытах, проведенных в атмосфере аргона и достигает максимальных значений в сероводородных средах. Максимум содержания серебра приходится на нейтрально-слабощелочные растворы.

В дополнение к экспериментальным исследованиям были проведены расчеты растворымости аргентита с привлечением следущих термодинамических характеристик комплексов серебра:

а) по хлорокомплексам AgCl⁺¹⁻ⁿ с n = I-4 - данные [7];
б) по гидросульфидным комплексам AgHS[®] и Ag(HS)₂ - константы реакций растворения Ag₂S, полученные в [3] на основании данных [4]. Результаты этих расчетов позволяют связывать экспериментально обнаруженный нами максимум с репанциям вкладом в материальный баланс серебра гидросульфидных комплексов AgHS, Ag(HS)₂. Это хорошо подтверждается и отсутствием, в отличии от свинца, снижения содержания серебра в растворе при добавках в него H₂S в интервале pH=6-8.

Таким образом, проведенные исследования показали принципиальную возможность извлечения серебра из серебросодержащего галенита гидротермельными растворами при температурах 200-300°С. Оптимальными условиями для этого являются близнейтрально-слабоцелочные значения pH растворов, присутствие в системе сероводорода. Однако даже в этом случае из-за низкого уровня содержания серебра для переноса его больших масс требуются внушительные объемы таких растворов.

Литература

I. Алексеев В.Н. Количественный анализ. - М.: Госхимиздат, 1958. - 393 с.

2. Артеменко О.В. Признаки регенерации рудних минералов на золото-серебряном месторождении. - В кн.: Геохимия и полезные ископаемые. М., 1979. (Деп. в ВИНИТИ, № 3132-79).

3. Кольцов А.Б. Об условиях переноса и отложения и в

некоторых низкотемпературных гидротермальных процессах. - Докл. АН СССР, 1981, т.261, № 5, с.1231-1234.

4. Мелентьев Б.Н., Иваненко В.В., Памфилова Л.А. Раствори – мость некоторых рудообразущих сульфидов в гидротермальных условиях. – М.: Наука, 1968. – 103 с.

5. Тугаринов И.А. Экспериментальное изучение роли процессов гидролиза в гидротермальных системах, содержащих свинец и бериллий. Автореф. дисс. на соиск. учен. степ. канд. геол.-мин. наук. - М.: Изд-во МГУ, 1976. - 26 с.

6. Хитаров Н.И., Козинцева Т.Н. Об устойчивости галенита в гидротермальных растворах. - В кн.: Экспериментальные исследования в области глубинных процессов. М.: Изд-во АН СССР, 1962, с. 117-121.

7. Seward T.M. The stability of chloride complexes of silver in hydrothermal solutions up to 350° . - Geoch. et Cosmochim. Acta, 1976, v. 40, N 11, p. 1329-1341.

УДК 548.58+549.512

А.П.Калалников

КИНЕТИКА РАСТВОРЕНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ ПАРАТЕЛЛУРИТА В СИЛЬНЫХ ЩЕЛОЧАХ

В работе [I] были описаны методика химического травления при комнатной температуре, а также характер и кинетика растворения в водных растворах КОН, RbOH и CsOH наиболее важных в практическом отношении граней монокристаллов парателлурита.



Проведенный позднее анализ эмпирического числового материала работы [I] показал, что экспериментальные данные, связывающие нормальные скорости растворения с исходной концентрацией соответствующей шелочи, могут быть достаточно хорошо представлены с по-мощью функции

W(C) = k C exp (p₁ + p₂C + p₃C²), (I)
 где W(C) - нормальная скорость растворения данной грани, мкм/мин;
 С - концентрация целочи. моль/л; p₁...p₃ - параметры процесса;
 k = I мкм.моль/(моль.мян) - коэфрицент пропорциональности.

Функция W(C) (рис. I) непрерывна и дифференцируема во всей области определения 0 ≤ C < ∞, имеет один нуль при C = 0, максимум W_{max} в точке

$$C_{max} = -(p_2 + \sqrt{p_2 - 8p_3}) / p_3$$

и одну точку перегиба в области С > С_{max}. Ось ос – асимптота. В интервале [О, С_{max}] функция монотонно возрастает, а в интервале [С_{max}, ∞] монотонно падает. Естественным ограничением аргумента в данном случае является С_{lim} – концентрация насытенного раствора. Начальный наклон графика определяется безразмерным параметром р.

Выравнивание результатов измерений осуществлялось методом наименьших квадратов с помощью аппроксимирующего полинома

$$F \equiv \ln \frac{W}{KC} = p_1 + p_2 C + p_3 C^2, \qquad (2)$$

затем вычислялась квадратичная погрешность Т_F аппроксимации и квадратичная погрешность Т_w функции W(C). Расчеты для каждой комбинации щелочь-грань проводились на основании I6-45 циклов измерений, каждый из которых включал в себя тонкую плифовку, травление образца и определение под микроскопом толщины стравленного слоя в четырех-пяти точках на исследуемой грани. Вычисленные параметры и погрешности функций приведены в таблице.

Гидроксид (раствор)	Индекс грани крис- талла	P ₁	Р ₂ , л/молъ	р ₃ °10 ² , (л/моль) ²	С _{шах} , моль/л	₩ _{паж} , мкм/мин	TF	T _w , mkm/mh	т _с •10 ² н л/моль
KOH	001	3,612	-0,1400	-0,749	4,7	76,4	0,08	3,5	0,66
**	IIO	3,348	-0,1514	-0,466	5,0	59,3	0,10	5,0	0,48
ROH	001	3,868	-0,1859	-0,392	4,5	86,8	0,I4	6,9	0,50
**	IIO	3,402	-0,1729	-0,250	5,0	59,4	0,09	3,3	0,21
CsOH	00I	3,686	-0,0181	-2,234	4,5	I05,0	0,I5	7,4	5,60
	IIO	3,268	-0,0515	-I,683	4,7	66,8	0,16	4,I	4,90

Параметры и квадратичные погрешности эмпирических функций

Для графического сопоставления эмпирической формулы (I) с экспериментальными данными использовалась линейная функция $G = p_2 + p_2 C_2,$ (3)где $G \equiv -B \sqrt{|B|} / |B|; B \equiv 4p_3 (F - p_1) + p_2^2$ (ри Формула (3) легко может быть получена из предыдущей, если (puc.2). вершину параболы (2) перенести в начало координат. Некоторое увеличение разброса экспериментальных точек на графиках в координа-(и, следовательно, возрастание квадратичных погрешнос-Tax G-C функций G) в случае сильно разбавленных растворов тей Тс Свон связано с тем, что для этой щелочи абсщиссы максимумов функций F мало отличаются от P1, а ординаты максимумов - от C = 0

Сглаживание экспериментальных данных с помощью эмпирической



Рис.2. Сравнение эмпирических формул (3) с экспериментальными данными работы [1]. I и 2 – растворение парателлурита в кон, 3 и 4 – в кьон, 5 и 6 – в свон. Для линий I-5 ординаты увеличены на ΔG, равные I,00; 0,90; 0,75; 0,65 и 0,10 л/моль, соответственно формули позволило уточнить сделанние ранее Выводи [I] о некоторых особенностях кинетики растворения парателлурита в щелочах.

I. В интервале концентраций (0, C,) грань (00I) Dactbodgetся быстрее, чем грань (IIO) при тех же условиях. При С., равных II.9; I4, I и I2.3 моль/л LIII растворов КОН , RbOH M CsOH,, COответственно, скорости растворения обеих граней одинаковы, а при C > C происхолят инверсия скоростей.

2. В интервале концентраций приблизительно от I до 7,5 моль/л скорости растворения граней парателлурита разными целочами одинаковых молярных концентраций увеличиваются в направлении КОН -- RbOH -- Свон. Вне указанного интервала такая последовательность скоростей растворения не сохраняется. Следует заметить, что скорости растворения грани (IIO) значительно менее чувствительны к типу щелочи, чем для граней (OOI).

3. Максимумы скоростей растворения грани (IIO) в каждой щелочи сдвинуты по отношению к максимумам для грани (OOI) в область более высоких концентраций.

В заключение автор выражает благодарность А.М.Дорошеву за

полезные обсуждения математической обработки результатов и В. В. Назарову за оперативное проведение вычислительных работ на ЭВМ "Мир-2".

Литература

I. Калашников А.П., Шкуратова Е.Б. Травление монокристаллов парателлурита в водных растворах сильных щелочей. - Рукопись деп. в ВИНИТИ, № 2255-81, 1981. - 8 с.

УДК 549.07+549.02

Л.К.Казанцева

ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ АМОРФНОГО КРЕМНЕЗЕМА ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ

Аморфный кремнезем, представленный монодисперсными сферическими частицами кремнезема имеет определенный практический интерес во многих областях народного хозяйства, например для получения адсорбентов, носителей катализаторов, фоточувствительных материалов, а также при синтезе редкого в природе минерала – благородного опала. Основу благородного опала составляют монодисперсные сферические частицы аморфного кремнезема размером 150-350 нм, уложенные в основном в кубическую гранецентрированную упаковку, что создает естественные дифракционные решетки для света, которые обуславливают харайтерную для опала иризацию [4]. Во всех случаях использования структур, состоящих из сферических частиц аморфного кремнезема, необходимо обеспечить прочную связь между частицами и жесткость всей структуры.

В настоящей статье обсуждены вопросы механизма спекания (цементации) регулярных структур, состоящих из сферических частиц аморфного кремнезема, изменение некоторых физических свойств аморфного кремнезема в процессе термообработки, определены граничные параметры термообработки, позволящие сохранить первоначальную упаковку сферических частиц. Исследовались те физические свойства термообработанного аморфного кремнезема, которые дают представление о механизме его цементации.

Исследование физических свойств термообработанных продуктов проводилось различными методами: показатели преломления определялись иммерсионным методом, микротвердость – на микротвердометре ПМТ-З, ИК-спектрометрические исследования проводялись на приборе Specord-75 по стандартной методике, электронно-микроскопические исследования – на электронном сканирукщем микроскопе JSM-35.

Исследуемые образцы сложены правильно упакованными монодисперсными сферическими частицами кремнезема, которые получены путем гидролиза эфира ортокремневой кислоты – Si(OC₂H₅)₄ в органических средах. Образцы высущивались в сущильном шкафу при температуре IOO^OC до остаточной влажности 6-7%.

В работе [3] удалось получить достаточно прочные структуры аморфного кремнезема с регулярной пространственной решеткой в диапазоне температур 800-1000°С в атмосферных условиях, при этом получение сферических частиц кремнезема основано на концентрировании водных растворов SiO₂, а их осаждение производилось в коллоидном растворе кремнезема с размером частиц 0,1-0,3 нм, что способствует упрочнению структуры.

Твердость образцов, сложенных из сфер кремнезема, полученных в органических растворах, незначительна и не превышает после обжига, как правило, 70 кГ/мм². Низкая твердость образцов объясняется структурными в морфологическими особенностями сферических частиц SiO, , полученными в органических средах. Однако получение сферических частиц кремнезема в органических средах обладает многими преимуществами (высокая однородность частиц SiO₂, значительное сокращение времени роста сферических частиц, удобство контроля за процессом роста сфер и т.д.), поэтому задача сводится к получению прочных структур аморфного кремнезема с регулярной пространственной решеткой из частиц, выращенных в органозолях. Обжиг таких образцов в атмосферных условиях затруднен в связи с тем, что часть воды и органическая компонента в связанной форме находятся внутри сфер. С повышением температуры девление внутри сфер повышается, что приводит к разрушению некоторых из них и растрескиванию образцов.

Ранее [2] рассматривалось каталитическое действие водяного

Пара на процесс твердофазового спекания, приводящего к упрочнению структуры. Сущность процесса спекания сферических частиц аморфного кремнезема состоит в образовании прочных связей Si-O-Si между частицами в достаточно пирокой зоне механического контакта как за счет сил капеллярной контракции, так и за счет пневматолического переноса вещества в зону контакта. Этот процесс должен предполагать определенную подвижность кремнезема,зависящую от присутствия водн. Было найдено, что на процесс тверпения при 900-I000⁰C при наличии в системе водяного пара при малых давлениях (до 5 атм) оказывает влияние не только пневматолический перенос кремнезема в зону контакта, но также кристаллизация аморфного кремнезема в L -кристобалит [2]. Раскристаллизация в объеме отдельных сфер SiO2 не будет вызывать увеличения прочности всей структуры в целом, так как она зависит от прочности соединения сферических частиц друг с другом. Повышение прочности всей структуры за счет раскристаллизации возможно в том случае. если будут появляться кристаллы, соединяющие соседние сферические частицы кремнезема. Это возможно при условии высокой степени спекания частиц друг с другом до начала раскристаллизации, **UTP** достигается термообработкой при 900-1000°С при наличии в системе водяного пара. Процесс раскристаллизации, кроме положительного зффекта повышения прочностных свойств, вызывает объемные изменения, что может явиться причиной образования вторичных дефектов в объеме образца и растреокивания. Термообработка при данных температурах с большим давлением водяного пара вызывает полную раскристаллизацию аморфного кремнезема и нарушение правильной упаковки. Степень раскристаллизации аморфного кремнезема без нарушения регулярной пространственной решетки должна быть в пределах нескольких процентов.

Дополнительные эксперименты по цементации аморфного кремнезема показали возможность получения материала с твердостью 400-500 кГ/мм² с сохранением регулярной структуры при температуре 500-600⁰С с более высокими давлениями водяного пара.

Исследование изменения физических свойств аморфного кремнезема, сложенного из монодисперсных сферических частиц SiO₂, в процессе спекания проводилось при температуре 600⁰С с давлением паров воды от 20 до I60 атм. Образцы, термообработанные с давлением паров воды до 50-60 атм.не соответствуют требуемой прочнос-

ти, выше 160 атм представляют полностью спекшийся, непроницаемый кремневый материал. Использование другой температуры привсдит к изменению оптимальных давлений пара. Повышение давления в указанном интервале приводит к увеличению твердости, уменьшению внутреннего объема пор и повышению объемного веса образцов (рис. I).



Рис. І. Зависимость твердости H(I), объемного веса & (2), внутреннего объема пор V(3) от давления Р

Значительные изменения Физических свойств аморфного кремнезема должны сопровождаться изменениями внутренней структуры материвла. Последующие электронно-микроскопические исследования, ИК-спектры и другие исследования термообработанного кремнезема были проведены для выяснения механизма цементации аморфного кремнезема с регулярной пространственной решеткой.

Прочность связи аморфных сферических частиц кремнезема зависит от степени химического вваимодействия их друг с другом, что в свою очередь зависит от полноты конденсации силанольных групп и образования связи S1-O-S1. По панным Ю.М.Бойкова и пр.

[I], ИК-спектры термообработанного чистого силикагеля в вакууме и в парах водн при температуре 730°С показывают наличие свободных поверхностных силанольных групп, которые дают полосу поглощения 3750 см⁻. Увеличение температуры до I090°С приводит к полному исчезновению этой полосы. Проведенные нами спектроскопические исследования образцов, термообработанных при 600°С с принятыми давлениями пара, показывают отсутствие ОН-групп. Это может свидетельствовать о полностью завершенных процессах конденсации силанольных групп. Отсутствие ОН-групп при более низкой температуре можно объяснить более открытой структурой аморфного кремнезе-

ма, особенностями методов получения сферических частиц кремнезема, а также медленным режимом подъема температуры, что способствует более эффективному дегидроксилированию.

Сравнение ИК-спектров термообработанных образцов с сырыми показывает, что смещение основных полос поглощения в области колебаний связей Si-O не происходит. ИК-спектры термообработанных образцов имеют более узкие и интенсивные полосы, что свидетельствует о большей упорядоченности его структуры. Однако полоса поглощения 625 см^{-I}, соответствующая упорядоченному **L**-кристобатолиту и полоса 600 см^{-I}, относящелся к разупорядоченному L -кристобалиту, не наблюдается. Для термообработанных образцов

характерны полосы поглощения в области колебаний связей Si-0 отонформа кля аморфного опала. Наиболее сильные полосы наблюлаются в диапазоне частот 1200-1080 см (валентные колебания) SiOSi . конденсированные посредством мостиков Si-O-Si тетраздров SiO_A) и 460-480 см (деформационные колебания SiOSi). а также полоса средней интенсивности 800-810 см (валентные колебания V_sSiOSi) (рис. 2). Рентгенофа-



Частота, см-Рис. 2. ИК-спектры сырого (I) и термообработанного (2) аморфного крем-

неэёма

зовый аналия также показывает аморфное состояние образцов, термообработанных при 600⁰С во всем интервале давлений. Данные спектроскопических и рентгенофазовых исследований свидетельствуют о том, что при выбранных рабочих параметрах температуры и давлений, в связи с отсутствием процессов раскристаллизации между соседними сферами, на прочностные свойства всей структуры кристаллизация не оказывает влияния. По данным Ю.И.Бойкова и др. [I], на процесс спекания силикагеля при высокой температуре существенное влияние оказывает вязкое течение вещества, связанное с появлением низкотемпературного расплава, причина образования которого объясняется наличием остаточных ОН-групп в составе аморфного кремнезема. Эффективное дегидроксилирование при относительно низких температурах, что проявляется в отсутствии ОН-групп на ИК-спектрах, предполагает отсутствие процессов плавления вещества. Определение показателя преломления термообработанного аморфного кремнезема во всем интервале давлений дает одинаковое значение, равное I,459. Это также свидетельствует о том, что на процесс цементации вязкое течение вещества влияния не оказывает.

Таким образом можно сказать, что процесс спекания аморфного кремнезема, состоящего из монодисперсных сферических частиц, уложенных по принципу плотнейшей упаковки при принятых рабочих параметрах давления водяного пара и температуры, протекает за счет поверхностной дифузии кремнезема и его переноса в зону контакта, а также за счет полной конденсации силанольных групп и образования силоксановой связи.

Процесс переноса кремнезема значительно увеличивается с повышением давления пара. Электронно-микроскопическое исследование показывает, что при давлениях до 50 атм значительных изменений в регулярной структуре аморфного кремнезема не наблющется, с 50 до 80 атм происходит сращивание сферических частиц друг с другом и уменьшение объема пор без нарушения регулярности упаковки. Более высокие давления приводят ко все более значительным нарушениям регулярной упаковки, появлению отдельных спекшихся участков и при 160 атм – к полному перераспределению кремнезема и потере иризации.

Выводы

I. Процесс термообработки аморфного кремнезема с регулярной структурой при наличии в системе водяного пара позволяет получить материал с твердостью 400-500 кГ/мм².

2. Процесс спекания аморфного кремнезема при принятых рабочих давлениях водяного пара и температуры протекает за счет диффузии кремнезема и его переноса в зону контакта сфер, а также за счет полной козденсации силанольных групп.

I. Бойков Ю.И., Волков А.В., Кисилев А.В. и др. Исследование дегидроксилирования и спекания силикагелей методом ИК-спектроскопии. – Коллоид. журн. 1976, т.38, № 2, с.240-244.

2. Казанцева Л.К., Денискина Н.Д., Калинин Д.В. О цементации аморфного сферического кремнезема с регулярной пространственной решеткой. - В кн.: Исследования по экспериментальной минералогии. Новосио́ирск: Изд-ние ИГиГ СО АН СССР, 1978, с.72-76.

3. Gaskin A.I., Darragh P.I. Opaline materials and method of preparation. - U.S. Patent 3 497367, 1970.

4. Sanders I.V. Structure of precious opals.- Electron. Microscopy, 1966, v.1. p.37-40.

УДК 549.07+543.422

Е.И.Сысоева, Н.Д.Денискина, Д.В.Калинин, Л.К.Казанцева

ИК-СПЕКТРОСКОПИЯ ИСКУССТВЕННЫХ БЛАГОРОДНЫХ ОПАЛОВ

Основой структуры искусственного благородного опала является опаловый материал (кремнезем I генерации), состоящий из однородных fлобуль кремнезёма размером в пределах I50-350 нм, и кремнезём П генерации, заполнящий пространство между глобулями кремнезёма.

С целью получения искусственного благородного опала с заданными свойствами, создания технологического процесса и выяснения зависимости его свойств от способов приготовления и термообработки были проведены ИК-спектрометрические исследования как конечных продуктов синтеза, так и промежуточных, каковыми являются опаловый материал (термообрабостанный и нетермообработанный) и кремнезем II генерации. Также исследованы природный благородный эпал и разновидность природного аморфного кремнезема - гейзерит. Для более полной информации об объектах исследо-

вания, проводилось их электронно-микроскопическое изучение.

<u>Методи исследований</u>. Образцы исследовались на приборах UR -20 и Specord-75 по стандартным методикам. Электронно-микроскопическое изучение проводилось на электронном микроскопе JSM , природный благородный опал предварительно протравливался IO%ным раствором HF в течение IO-30 сек. Исследуемые образцы накдеивались на латунные подложки и напылялись тонким слоем золота.

Характеристика материалов

<u>Синтетические материали</u>. Поскольку опаловый материал сложен однородными глобулями кремнезёма, первым этапом в его получении является выращивание этих глобуль, которое проводилось двумя способами. Способ I-гидролиз эфира кремневой кислоты в органической среде описан в работе [I2], размер частиц кремнезема прямо зависит от количества вводимого аммиака. Другой способ (II) разработан авторами и закличается в поэтапном выращивании частиц в той же системе компонентов.

Для получения опалового материала суспензии кремнезёма центрифугировались при ускорениях 400-800g или отстаивались в стеклянных цилиндрах в течение длительного времени. В результате в обоих случаях получали осадки, которые после высушивания при комнатной температуре представляли хрупкий мелоподобный материал, игранций с поверхности яркими пветами. Образцы опалового материала высушивались в эксикаторах до постоянного веса при комнатной температуре в течение двух месяцев и затем подвергались исследованию. Некоторые образны термообрабатывались и также изучались.

Часть термообработанного опалового материала пропитывалась 20%-ным раствором SiO₂. Этот раствор при медленном испарении образует прозрачный стекловатый гель (кремнезём II генерации), который частично (на 50-70%) заполняет поры термообработанного опалового материала. При небольшой стецени заполнения опаловый материал становится полупрозрачным и близким к молочным разностям природного опала, при полном заполнении пор – материал аналогичен по многим свойствам природному благородному опалу.

<u>Природные материалы</u> представлены гейзеритом из долины Гейзеров полуострова Камчатка и благородным опалом с зеленовато--красной иризацией из Забайкалья.

Общим для всех исследуемых образцов является положение основных полос поглощения в области колебания связей Si-O. Наиболее интенсивные полосы наблюдаются в диапазонах частот I200-I080 см^{-I} (валентные асимметричные колебаься V_{ав}SiOSi , конден-

сированных посредством мости-KOB SI-O-SI TETраздров SiO4,) и 460-480 см-1(деформационные колебания SiOSi). a Takke полоса средней ИНТЕНсивности 800-810 (валентные симметричные колеdahun Va SiOSi) (pmc.).

ИК-спектры опалового материала и кремнезёма П генерации практически идентичны межлу собой (см. рис. а. б. в. г). Сравнение ИК-спектров полученных опаловых материалов обнаруживает некоторые различия в NHтенсивностях их полос (IIOO.800. 470 cm^{-1}). B спектре опалово-



Рис. ИК-спектры опаловых материалов и природных опалов.

а – иризирующий опаловый материал, полученный способом I, осаждение центрифугированием; б – опаловый материал, полученный способом II, осаждение центрифугированием; в – опаловый материал, полученный способом II, осаждение отстакванием; г – кремнезем II генерации; д – термообработанный при 900°С опаловый материал; е – опаловый материал с порами, заполненными кремнеземом II генерации; ж – благородный опал (Забайкалье); з – гейзерит

вого материала П основные полосы более узкие и интенсивные, чем

В спектре опалового материала I, что свидетельствует о большей упорядоченности в структуре опалового материала П. В спектрах опалового материала на левом плече полосн IIOO см^{-I} имеется дополнительный максимум II80-I2OO см^{-I} (так называемая опаловая компонента [9]), за счет чего полоса IIOO см^{-I} уширяется. Образцы, полученные как путем центрифугирования, так и длительного осаждения сферических частиц кремнезёма, дают практически идентичные спектры (см. рис. б, в). Во всех спектрах непрокаленного опалового материала наблюдается перегиб в области 560-580 см^{-I}. Согласно данным И.И.Плюсниной [9], его можно рассматривать как след тридимитового мотива сочленения тетраздров SiO₄.

В спектрах нетермообработанного опалового материала и кремнезема П генерации помимо основных полос поглощения имеются полосы, связанные с деформационными и валентными колебаниями молекул H₂O и гидроксильных групп. Эти полосы поглощения представляют особый интерес, поскольку характер H₂0 в иризирующем опаловом материале влияет существенно на его свойства (удельный вес. показатель преломления, прочность) и определяет его поведение NUI термообработке. В области 3000-3700 см-І имеется широкая асимметричная полоса с максимумом 3400-3450 см⁻¹, относящаяся, как установлено многочисленными работами, к колебаниям молекул физически адсорбированной H₂0. Интенсивности этих полос 3450 см⁻¹ в спектрах опалового материала I, П и кремнезема П генерации близ-ки. Наибольшая интенсивность полосы 3450 см^{-I} в спектре опалового материала П, полученного методом спонтанной седиментации, наименьпая - в спектре кремнезема П генерации. На левом плече полосы 3450 см⁻¹ наблюдаются два дополнительных максимума большей интенсивности 3650 см⁻¹, меньшей – 3750 см⁻¹. В соответствии с данными [1,8] первая полоса принадлежит колебаниям ОН-групп, расположенным внутри глобуль кремнезема и входящим в состав групп Si-OH и молекул H₂O. Вторая полоса принадлежит ко-лебаниям поверхностных единичных групп OH, связанных с кремнеземом и не участвущих в образовании водородных связей. В работе [7] методом дейтерообмена с масс-спектрометрическим контролем установлено наличие на поверхности силикателей гидроксильных групп, связанных водородной связью, и определена соответствуищая им полоса поглощения 3550 см-I. В имеющемся спектре данная полоса складывается с соседними 3650 см⁻¹, 3450 см⁻¹ и не идентифицяруется. Полоса I640-I650 см^{-I} принадлежит деформационным колебаниям молекул физически адсорбированной H₂0. А полоса поглощения в области 900-950 см^{-I} связана с валентными колебаниями связи Si-OH. Очень слабая полоса I440 см^{-I} принадлежит связи Si-OH

внутри тетраздров SiO4. Однако в об насти I3OO-I450 см⁻¹ лежат деформационные колебания связи С-Н [2], поэтому для исследуемых образцов, полученных в органической среде, отнести указанную полосу к определенной связи не представляется возможным.

Полосы 2960, 2930, 2870-2900 см^{-I} по данным А.В.Волкова и А.В.Киселева [2], принадлежат связи С-Н, т.е. связаны с присутствием органической компоненты в опаловом материале, полученном в органической среде. Наиболее чёткие полосы связи С-Н в спектрах опалового материала I и кремнезёма II генерации, в иризирурцем опаловом материале II полосы поглощения в указанной области наблюдаются на уровне фона.

Данные ИК-анализов термообработанного опалового материала. В спектре этих образцов исчезают полосы, связанные с валентным и деформационным колебаниями H₂O, групп ОН и связи Si-OH (см. рис. кривая д).Интенсивность основных полос по сравнению с непрокалённым опаловым материалом заметно возрастает. Перегиб в области 570 см^{-I} выполаживается, что свидетельствует об исчезновении тридимитового мотива в структуре опалового материала после термообработки. В чёрном иризирующем опаловом материала сплошной фон поглощения в области I500-3000 см^{-I}, что связано, вероятно, с наличием рассеянного аморфного углерода в образце.

<u>ИК-опектры искусственных благородных опалов</u>. При слабой степени заполнения порового пространства опалового материала существенных изменений по отношению к ИК-спектрам термообработанного опалового материала, кроме уменьшения интенсивности основных полос, не происходит. По мере увеличения степени заполнения наблюдается сужение основной полосы IIOO см^{-I} из-за исчезновения дополнительной полосы I2OO-II8O см^{-I} и лёткое смещение её максимума в область II40 см^{-I} (см. рис, кривая е).

Полосы, связанные с H₂O и группами OH, в искусственных благородных опалах не проявляются, что связано с тем, что после термообработки в жестких условиях образцы не регидроксилируются при прошитке, а количество кремнезема П генерации, отложившегося В порах, по отношению к массе опалового материала слишком мало (~10-15%).

<u>Данные ИК-анализов природных образцов</u>. ИК-спектры природного гейзерита и благородного опала наиболее близки к спектрам иризирующего опалового материала. Отличие заклычается в отсутствии в природных образцах полосы поглощения в области 950 см^{-I}, связанной с валентными колебаниями Si-OH (см. рис., кривая ж). В природных материалах также имеются полосы поглощения, обусловленные органической компонентой (2960, 2930, 2870 см^{-I}) и значительная по интенсивности полоса 3450 см^{-I}, осложнённая на левом илече дополнительными максимумами 3650 см^{-I} и более слабым максимумом 3750 см^{-I}.

В ИК-спектре благородного опала узкие основные полосы поглощения значительно более интенсивные, чем у гейзерита. Полосы поглощения, связанные с валентными колебаниями связи С-Н (2930, 2870 см⁻¹)в благородном опале более интенсивные, чем_в гейзерите. Основная полоса поглощения в области 800-810 см-1 раздваивается, что указывает согласно данным [2] на наличие кристаллической фазы. Появлящаяся заметная полоса поглощения 620 см⁻¹ свидетельствует на основании данных [9] о наличии кристобатолитового мотива в сочленении тетраздров SiO4 . ИК-спектр этого опала позволяет отнести его к промежуточному члену ряда кристобатолитовый опал - рентгеноаморфный опал, в соответствии с данными выпеупомянутой работы. В области валентных колебаний молекул воды и ОН-групп (3000-3800 см⁻¹) указанные природные образцы имеют полосы поглощения меньшей интенсивности, чем в спектрах опалово-1ºо материала. На девом плече полосы 3450 см⁻¹ дополнительный максимум 3650 см⁻¹ интенсивнее в спектре гейзерита, чем в спектре благородного опала. Как уже говорилось, наличие этой дополнительной полосы свидетельствует о присутствии в ультрапорах природных опалов внутриглобулярных гидроксильных групп. Полоса 3750 см⁻¹ в природных кремнезёмах очень незначительна по интенсивности.

Обсуждение

Структура из дискретных глобулярных частиц кремнезема является общей чертой синтезированного благородного опала и природных образцов. Отличающимися параметрами являются размеры, сте-

пень однородности и упаковки частиц, степень заполнения пор кремнезёмом П генерации. Размеры глобуль, из которых состоит опаловый материал, несколько варьируют от образца к образцу. Гейзерит сложен также глобулярными частицами кремнезёма, размеры которых варьируют от 200 до 400 нм, они состоят из первичных частиц величиной от 60 до 70 нм. Упаковка вт ричных частиц беспорядочна; кроме глобуль, в гейзерите обнаруживаются бесформенные массы, сложенные частицами неправильной или слабоудлиненной формы размером от 50 до 100 нм.

Благородный опал из Забайкалья состоит из глобуль диаметром 250-300 нм, которые сложены первичными частицами размером около 50-70 нм. Эти частицы сцементированы кремнезёмом второй генерации, структура которого под злектронным микроскопом не проявляется.

Таким образом, электронно-микроскопические данные показывают, что во всех исследуемых образцах как искусственного, так И природного опалового материала глобули, слагающие их, **HBARDTCH** вторичными, так как состоят из более мелких первичных частиц. На основании данных [3] в синтезированном опаловом материале можно предполагать наличие третьей системы пор на уровне размеров молекул H₂O, кроме двух систем пор, выявленных электронномикроскопическим изучением. Первая и вторая системы пор содержат физически адсорбированную и химически связанную поверхностную $\rm H_2O.$ Физически адсорбированная $\rm H_2O$ имеет свойства молекулярной жидкой $\rm H_2O$ (полоса поглощения 3450 см $^{-1}$), поверхностная химически связанная Н20 представлена изолированными ОН-группами (полоса поглощения 3750 см-1) и, судя по литературным данным, связанными водородной связью ОН-группами (полоса поглощения 3550 см⁻¹).

Внутри глобуль в третьей системе пор находятся гидроксильные группы, давщие в ИК-спектре полосу поглощения 3650 см^{-I}. Незавершенность реакции конденсации кремнезёма – причина присутствия в ультрапорах ОН-групп. Содержание внутриглобулярных ОН--групп является возрастающей функцией размера глобуль [5], лиаметр которых в синтезированных образцах 250-350 нм. Содержание поверхностных ОН-групп – возрастающая функция удельной поверхности, которая в опаловом материале при указанных размерах глобуль сравнительно мала. Изложенные выше данные объясняют большую интенсивность полосы 3650 см^{-I} по сравнению с 3750 см^{-I}.

7I
Жёсткая термообработка, которой подвергается иризирующий опаловый материал, приводит к дегидроксилированию кремнезёма, поэтому в ИК-спектре термообработанных образцов поглощение в области колебаний молекул H₂O и OH-групп отсутствует. А наличие этих полос поглощения в спектре природного благородного опала свидетельствует о невысоких температурах и давлениях, которым подвергался опал в процессе образования и диагенеза. Меньшая интенсивность полос поглощения в водной области в спектре природного опала, чем в спектре синтезированмого опалового материала, говорит о менее плотной структуре последнего.

В работе [II] физико-химическими методами исследован природный благородный опал и изучены ИК-спектры как ненагретых 00разцов, так и прокаленных в течение 24 часов при IOO, 200, 400. 700°С. Интерпретация ИК-спектров в области колебаний молекул H₀0 и ОН-групп проведена согласно представлениям работы IO ,где изучалась поверхностная гидратация кремнезёма. На основании этого установлено [II], что доля химически связанной H₂O в природном благородном опале при подсчете, по данным термогравиметрии и площали поверхности образца, составляет 20%, при подсчете, по данным ЯМР, - 70%. Вопрос о причине расхождения результатов авторы оставили открытым. Интерпретация ИК-спектров природного благородного опала из работы [II] на основе представлений [I, 5. 7, 8] с учетом внутриглобулярных ОН-групп позволяет объяснить возникшее противоречие и отнести 50% химически связанных ОН--групп к внутриглобулярным. По данным термогравиметрии, в работе [II] подсчитали только количество химически связанной поверхностной H₂O, которое составило 20% в исследуемых образцах. Таким образом, как в природном благородном опале, так и в синтезированном опаловом материале химически связанная Но0 представлена главным образом внутриглобулярными ОН-группами. Характер ИКспектра в области валентных колебаний молекул H₂0 и OH-групп, как следует из изложенного выше, будет определяться величиной глобуль кремнезёма, слагакщих структуру, завершенностью процессов конденсации кремнезема и зависеть от температур и давлений, которым подвергается опал в процессе своей истории.

Особенности характера ИК-спектров в области 520-900 см^{-I} (валентные колебания связи Si-O-Si) определяются топологической группировкой тетраздров SiO₄. Природный благбродный опал по полссе 620 см^{-I} относится к промежуточному члену ряда кристобатолитовый – аморфный опал, выделенному в работе [9]. В спектре опалового материала перегиб 570 см^{-I}, по данным этой же работы, говорит об *с*-традимитовом мотиве сочленения тетраэдров SiO₄. В спектре термообработанного опалового материала этот перегиб выполаживается и появляется полоса 620 см^{-I}, свидетельствуя о перестройке традимитового мотива и о преобладании кристобатолитового.

Полосы поглощения, связанные с органической компонентой, присутствуют не только в спектре опалового материала, но и в спектрах природных кремнезёмов. Этот факт подтверждает предположение [6] об участии органических комплексов в составе опалообразующих растворов. То, что органический материал сингенетичен опалам, а не пропитывает уже сформировавшиеся структуры, доказано в работе [4].

Характер ИК-спектров искусственного благородного опала по основным полосам близок к таковым природных образцов. Отсутствие полос поглощения в водной области ИК-спектра свидетельствует о жёстких условиях термообработки, которые можно смягчить уменьшением её температуры или проведением её при наличии паровой водной фазы.

На основании проведенных исследований можно сделать выводы теоретического, технологического и геологического характера.

I. Выяснение природя H₂0 в синтезированном опаловом материале даёт ключ к пониманию её характера в природном благородном опале и позволяет разрешить противоречие, возникшее при изучении химически связанной H₂0 в последнем.

2. Использование результатов алектронно-микроскопического, ИК-спектроскопического исследований, а также литературных данных позволили выделить в опале три системы пор и установить характер H₂O в них.

3. Различные способы приготовления сферических частиц кремнезёма, из которых состоит опаловый материал, влияют в некоторой степени на упорядоченность в структуре.

4. Способы осаждения глобуль кремнезёма не влияют на карактер связи тетраздров SiO₄.

5. Характер полосы IIOO см^{-I} (в частности появление дополнительной полосы на её левом плече II80-I200 см^{-I}) может слу-

кить показателен неоднородности (пористости) опалов и кремнезёма.

6. Для полной идентичности спектра искусственного благородного и природного опала необходима термообработка опалового материала в более магких условиях и при наличии H₂0 (в виде паровой фазы).

7. В образовании природных благородных опалов и кремнезёмов активное участие принимает органика.

8. Наличие в ИК-спектре природного благородного опала полос, связанных с H₂O, свидетельствует о невысоких температурах и давлениях, которым подвергался спал в процессе образования и диагенеза.

Авторы выражают благодарность м.н.с. ИГыГ СО АН СССР В.Н.Столповской за проведение работ по ИК-исследованию представленных образдов.

Литература

I. Барушина Т.Н., Колычев В.И., Стрелко В.В. Сравнительное исследование де- и регидратации силикагеля и аэросила методом ИК-спектроскопии. - Коллоидн. журн., 1976, т.38, вып.4, с. 777-781.

2. Волков А.В., Киселёв А.В. Определение содержания поверхностных и объемных гидрокси- и этокси-групп в кремнезёмах методом инфракрасной спектроскопии. - Коллоидн. журн., 1976, т.38, вып. I, с.32-37.

3. Высоцкий З.З., Каниболоцкий В.А., Мицик Б.М. и др. О строении первичных частиц, составлящих скелет гелей поликремниевой кислоты. - В кн.: Адсорбция и адсорбенты, Киев, 1972, вып. I, с.63-67.

4. Гиташвили Г.М., Калижный В.А. Чёрные опалы из пегматитов Волыни, содержащие органическое вещество. — Докл. АН СССР, 1969, т.186, № 5, с.1154-1157.

5. Давыдов В.Я., Киселёв А.В. Инфракрасные спектры поверхностных и объемных гидроксильных групп кремнезёма. - ЖФХ, 1963, т. 37, с. 2593.

6. Денискина Н.Д., Эпова Е.И., Калинин Д.В. Генезис благородного опала. І. Устойчивость золей кремнезема в природе и условия образования сферических частиц кремнезема. - Геол. и геофиз., 1981. № 12. с. 87-91. 7. Туравлев Л.Г., Киселев А.В., Найдина В.П. Определение поверхностной и внутренней структурной воды силикагеля методом дейтерообмена с масс-спектрометрическим контролем. - ТФХ, 1963, т.37, № 10, с.2258-2265.

8. Мицик Б.М., Маланик А.Н., Гомельская И.И. Структура и свойства гидротермальных силикагелей, полученных в установке внсоких давлений. - В кн.: Адсорбция и адсорбенты. Киев, 1975, вып. 3, с.26-29.

9. Плоснина И.И. Инфракрасные спектры опалов. - Докл. АН СССР, 1979, т.264, № 3, с.606-609.

IO. Hockey J., Pethica B. Surface hydratation of silica. -Trans. Faraday Soc., 1961, v.57, p.2247-62.

11. Segnit E., Stevens T., Jones J. The role of water in opal. - Jour. Geol. Soc. Austr., 1965, v.12, N 2, p.211-226.

12. Stöber W., Fink A., Bohn E. Controlled growth of monodisperse silica spheres in the micron size range.-Jour. Coll. and Interface Sci., 1968, v.26, p.62-69.

УЛК 549.07+543.226

Е.И.Сысоева

ТЕРМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИРИЗИРУЮЩЕТО ОПАЛОВОГО МАТЕРИАЛА

Физико-химические исследования иризирующего опалового материала, составляющего основу структуры благородного опала, выполнены с целью выяснения зависимости его свойств от способов приготовления и осаждения слагающих его сферических частиц кремнезёма, установления оптимальных режимов термообработки, упрочняющей структуру. Наибольшее внимание уделено изучению процессов дегидратации и деэтоксилирования в полученных образцах, что важно для отработки технологического процесса синтеза благородного опала и получения конечного квелирного материала с заданными свойствами. В данной статье представлены результати термогравиметрического и дилатометрического анализов, обсуждение которых проводится на основе результатов по ИК-спектроскопии и электронной микроскопии исходного иризирующего материала, а также термомассспектрометрии отдельных образцов.

<u>Методы приготовления иризирующего опалового материала</u>. Синтез сферических частиц кремнезема проводился двумя способами. Первый способ описан в работе [7], второй является вариантом первого и заключается в выращивании глобуль кремнезёма от зародышей IO-I5 нм до размеров 250-350 нм при постепенном многократном (2 и более этапов) концентрировании суспензии кремнезёма. Осаждение глобуль кремнезёма осуществляется центрифугированием при ускорении 400-800g.

После висущивания при комнатной температуре образуются меловидные иризирующие осадки, в которых сферические частицы кремнезема уложены в структуру по принципу плотнейшей кубической упаковки. После термообработки полученного опалового материала и заполнения пор в нем кремнеземом второй генерации окончательно формируется искусственный благородный опал.

<u>Аппаратура</u>. Термогравиметрическое исследование выполнено на дериватографе системи Паулик-Эрдеи при скоростях нагрева IO и I8^OC/мин. В качестве инертного материала использовалась прокаленная окись алиминия. На этом же приборе с применением дилатационной приставки выполнены дилатометрические исследования образцов иризирующего опалового материала цилиндрической формы.

ИК-спектроскопия образцов выполнена на приборах ИR-20 и Specord-75 по стандартной методике, термомасс-спектрометрия образцов выполнена В.Н.Мелиневским в СНИПТиМСе.

Электронно-микроскопическое изучение опалового материала проведено на сканирующем микроскопе JSM-35, образцы предварительно напылялись золотом.

Экспериментальные данные

Данные термогравиметрии. Потеря веса при нагревании опалового материала до 900°С происходит в два этапа; на кривой ДТГ имеется два прогиба. На кривых ДТГ одной части образцов второй прогиб непосредственно следует за первым; на кривых ДТГ другой

части образцов между прогибами существует температурный интервал, когда уменьшения веса не происходит. Кривая ТГ в одном случае представляет собой пологую линию с непрерывным понижением (рис. I,a), в другом – на кривых ТГ в интервале температур 220– 300°С горизонтальная ступень (рис. I, в). По этому признаку, т.е. по характеру взаимоотношения между двумя этапами потери веса, образцы подразделены на две группы (А и В). В группу А попадают образцы, приготовленные первым способом, и вторым способом в два этапа, а в группу В – образцы, приготовленные вторым способом.

Как для группы А, так и для группы В первый прогиб на ДТГ глубокий, интенсивный, с максимумом при температуре I20-I30°С,

Способ риготов- ления	Группа по дтГ и ТГ	Первый интер- вал потери веса (ДТГ, С)	т ^о с макся- мума	Потеря веса в первом интервале, \$	Второй ин- тервал по- тери веса (ДТТ, °С)	Т ^О С МЕКСИ- МУМА	Потеря веса во втором интер- вале,%	Групца по типу ДТА	ТОС макси- мума энлотер- мическо- го эффек- та	Т ^О С макси мума экзо термичес~ кого эф- čекта
Первый в	A	50-220	I20	10,07	306-800	300-350	3,44	I	120	520
OTER STAR	A	50-220	I20	6,76	300-800	400-580	3,38	I	I20	320,520
Эторой в	A	50-220	IIO	10,86	300-900	420-140	4,74	2	I20	400-580
два эта а	A	50-200	120	IC, 97	280-800	440-520	3,99	2	120	400-580
Второй в	B	50-220	130	5,69	220-820	440	4,83	3	I20	440
три этапа	В	50-240	I3 0	6,99	240-820	440	5,99	З	I30	320,440
Второй в	В	50-240	I20	6,75	240-820	440-540	4,64	4	120	
четыре- шесть эта- пов	- -	50-240	120	8,2	240-820	440	4,91	4	120	

Данные по результатам ДТА и термогравиметрии опалового материала

второй — неинтенсивный, растянут в широком интервале температур, редко с выраженным максимумом, чаще максимальная скорость потери веса в интервале 300-500°С. Для группы А первый этап потери веса от 50 до 220°С, второй — от 300 до 800°С. Для группы В первый этап в интервале 50-240°С, второй 240-820°С. Конкретные цифры потери веса при нагревании в каждый этап в пересчёте на проценты представлены в таблице.

<u>Данные ДТА</u>. Первому прогибу на кривой ДТГ всех исследованных образцов соответствует на кривой ДТА эндотермический эффект с максимумом I20⁰C. Второму прогибу на ДТГ соответствует на кривой ДТА один или два экзотермических эффекта; на ДТА образцов, приготовленных вторым способом в четыре-шесть этапов в интервале 300-800⁰C эффекты отсутствуют.

Первый экзотермический мелоинтересный эффект с максимумом 300°С наблядается на ДТА трех образцов, причем при скорости нагревания 10 град/мин он не появляется, а становится заметным при скорости нагрева 18 град/мин. По положению второго экзотермического эффекта образци можно расположить в ряд: І. Образци, приготовленные первым способом, на ДТА имерт высокотемпературный, хорошо выраженный эффект с максимумом 520°С (рис. 2, a); 2. Образцы, приготовленные вторым способом в два этапа, имеют на ДТА пологий экзотермический эффект, без выраженного максимума, растянутый в интервале температур 400-580°C (рис. 2,в); 3. Образцы, приготовленные вторым способом в три этапа, на ДТА - экзотермический эффект с выраженным максимумом 440°С (рис. 2,с); 4. Образцы, приготовленные вторым способом в четыре этапа - шесть этапов KOHцентрирования суспензии, на ДТА эффекты в интервале 300-820°C отсутствуют (рис. 2.d).

Обсуждение

Обсуждение ДТГ и ТГ. Как показывает ИК-спектроскопическое изучение образцов, а также литературные данные [4], первый этап потери веса соответствует удалению физически адсорбированной Н20. По поводу температуры, до которой происходит удаление всей физически адсорбированной H₂O, согласия в литературе нет, указы-вается температура от 200 до 300°C. Вероятно, она изменяется, как предполагают в работе [4], при изменении типа изучаемого силикагеля. В изученных образцах, отнесенных к группе А, удаление всей физически адсорбированной H₂0 происходит до 200-220°C, поэтому в интервале (200-220) - (280-300)°С на их кривых ТГ появляется горизонтальный участок. В образцах группы В в связи с их более плотной структурой, что установлено путём электронно-микроскопического изучения, процесс дегидратации Н20 затягивается до 240-250°С. Количество физически адсорбированной H₂0 может варьи вать (в ИК-спектре интенсивная полоса 3450 см⁻¹) и зависит от варьировремени, температуры высушивания. Образцы, сушившиеся одинаковое время в идентичных условиях, содержат адсорбированной H₂O тем больше, чем больше радиус глобуль кремнезёма, слагающих структуру, и соответственно, чем больше радиус пор.

• Второй этап потери веса обусловлен двумя параллельно проте-

катини процессами - процессом дальнейшей дегидратации опалового материала, происходящей за счет удаления химически связанной Н20, и процессом разложения этоксигруши в результате гидролиза SiO-C₂H₅ связей. Об одновременности выпеупомянутых процессов ка-чественно свидетельствует термомасс-спектрометрическая кривая (рис. 3). В результате ИК-спектроскопического изучения образцов установлено [5], что химически связанная H₂0 представлена главным образом внутриглобулярными ОН-группами (полоса поглощения 3650 см⁻¹) и в меньшей степени поверхностными ОН-группами ДВУХ типов: изолированными с полосой поглощения 3750 см-1, связанными водородной связью с полосой поглощения 3550 см-І, которая в полученном спектре не проявляется, так как складывается с соседними 3650, 3450 см⁻¹. Согласно данным [2] выделение химически связанной H₂0 с максимальной скоростью происходит в интервале 400-600°С. Разложение большей части этоксигруши происходит при температуре 450°С [3]. Суммарный эффект описанных двух процессов на кривой ДТТ определяет интервал температур 300-500°C, где скорость потери веса максимальна на втором этапе, реже этот максимум выражен (440°C) и коррелируется с экзотермическим эффектом на ДТА. Большая плотность структуры образцов группы В будет способствовать увеличению количества связанных ОН-групп против количества изолированных ОН-групп. По данным [6] удаление связанных водородной связью ОН-групп начинается уже около 200°С, поэтому вторая предполагаемая причина отсутствия горизонтального участка между двумя прогибами на ТГ - наличие относительно больпего количества последних. Вероятно, количество связанных и изолированных ОН-групп будет определяться плотностью глобуль кремнезёма и структуры. В целом количество химически связанной H20 в опаловом материале составляет треть от её общего количества.

<u>Обсуждение ДТА</u>. Дегидратации физически адсорбированной H₂O (первый прогиб на ДТГ) в интервале 50-240^OC соответствует на ДТА эндотермический эффект с максимумом I20^OC. В интервале температур 220-820^OC происходит два параллельных процесса с противоположными тепловыми эффектами – эндотермическая реакция дальнейшей дегидратации и экзотермическая реакция удаления органики. На ДТА в указанной области один, реже два экзотермических эффекта либо тепловые эффекты процессов нивелируют друг друга.

Экзотермический эффект с максимумом 300°С связан со сгора-

нием небольшых количеств непрореагировавшего исходного тетраэтоксисилана (ТЭОС). Второй экзотермический эффект свыше 400°С обусловлен удалением этоксигрупп, химически связанных с поверхностью кремнезёма. Согласно данным [3], разложение основной части этоксигрупп происходит при 450°С, а условия реакции этоксилирования влияют на её степень и на смещение интервала температур их разложения, в результате смещаются максимумы на ДТА. Отличия в температурах экзотермических эффектов на кривых ДТА опаловых материалов, приготовленных разными способами, объяснимы при учёте неполноты и ступемчатости реакции гидролиза ТЭОС.

Анализ литературного материала [1,3] и изложенные выше результаты исследований позволяют предположить наличие как поверхностных этоксигрупп, так и внутриглобулярных, аналогично типам ОН-групп, установленным в изучаемых образцах. Такое представление позволяет объяснить смещение максимума экзотермического эй− фекта в сторону более низких температур в описанном выше ряду от преимущественно внутриглобулярных этоксигрупп в опаловом материале, приготовленном первым способом, до преимущественно поверхностных в опаловом материале, приготовленном вторым способом. Чем более многостацийно проведена реакция гидролиза, тем, вопервых, в системе больше H₂O, во-вторых, более полно протекает реакция гидролиза в силу её длительности, тем меньшая вероятность наличия внутриглобулярных С2Н5 - групп, разлагающихся при 520°С (кривая ДТА опалового материала, полученного первым способом). В образцах, приготовленных вторым способом в два этапа, согласно предполагаемой интерпретации присутствуют как поверхностные, так и внутриглобулярные С2Н5 - группы. В опаловом материале, приготовленном вторым способом в три этапа, выраженный максимум 440°С свидетельствует о поверхностном характере содержащихся этоксигрупп. Отсущствие эффектов в интервале 300-800°С на ДТА образцов, полученных вторым способом в четыре-шесть этапов, говорит об уменьшении этоксилирования поверхности кремнезема и об увеличении её гидратации вплоть до их нивелирования друг с другом. В ИК-спектре опалового материала, приготовленного первым способом, отчетливые полосы поглощения связи С-Н 2960, 2930, 2870 см⁻¹. В спектре опалового материала, приготовленного вторым способом при многократном концентрировании, поглощение в области колебаний связи С-Н на уровне фона.

Обсуждение результатов дилатометрии. Термомеханическому

анализу подвергнут опаловый материал, приготовленный вторым способом, хрупкость опалового материала, полученного первым способом, не позволяет получить его дилатограмму. При нагревания от 20 до 900°С суммарное уменьшение высоты образца составляет IO-I2% от её первоначального значения. Процесс изменения объема происходит в два этапа, что выражается двумя прогибами на кривой ДТД. Первый прогиб в интервале (90-I00)-(240-260)°С с максимумом I20-I40°С, усадка при этом составляет 2-4%, а потеря веса 6-II%. Второй прогиб на ДТД от 260- до (800-820)°С с максимумом в области 440-600°С, причём после 700°С усадка очень незначительна, процент усадки в указанном интервале температур – 9% (рис. 4).

Полученный после осаждения опаловый материал обладает неплотной структурой, такую рыхлую упаковку обуславливает наличие гидрокси- и этоксигрупп в глобулях кремнезёма и на их поверхности вследствие небольшой конденсации кремнезёма. Твердость опалового материала при его термообработке увеличивается за счет удаления ОН и С₂н₅ групп и образования силоксановых связей. По этой причине нагревание сопровождается усадкой глобуль в размерах - нежелательным изменением параметров дифрагирующей решетки. что приводит к ухудшению иризации и появлению микротрещин. Усадка, обусловленная удалением физически адсорбированной H20, составляет 2-4%; обусловленная удалением гидрокси- и этоксигрупп -7-9%. Сравнение температуры начала объемных изменений 90-100°С и температуры начала потери веса 50-60°С говорит о том, что до 100°С удаляется капиллярная молекулярная H₂0 из внутренней части вторичных пор и её удаление не сказывается на линейных параметрах структурв. Начиная со 100° и до 220-260°С удаляется H₂0, находящаяся в виде свободно связанных мультслоёв, которые являются завершающим слоем гидратной оболочки глобуль, что согласуется с представлениями, изложенными в работе [6].

Наиболее существенна усадка в опаловом материале, полученном первым способом, поскольку при термообработке иризация его изменяется от красной до фиолетово-голубой. При обжиге обнаружено, что усадка его главным образом происходит при температуре свыше 300°С. Большая величина усадки связана, исходя из данных ИКспектроскопии, термогравиметрии, ДТА с высокой концентрацией внутриглобулярных этоксигрупп, которые, удаляясь, способствуют

8I



Рис. І. Кривые ДТГ и ТГ иризирующего опалового материала, приготовленного первым способом (а), вторым способом (в)









собом

Рис.З. Термомасс-спектрометрическая кривая иризирующего опалового материала

уменьшению размера глобули, снижению твёрдости, появлению крайней хрупкости. Следовательно, для получения качественного ювелирного искусственного благородного опала предпочтительнее второй способ выращивания сферических частиц кремнезёма.

На основе полученного материала можно сделать следующие выводы:

I. Независимо от способа приготовления основная масса H₂O удаляется при нагревании до 200⁰C, что позволяет её отнести главным образом к молекулярной, физически адсорбированной.

2. Привлечение термомеханического анализа позволяет выделить молекулярную H₂O, физически адсорбированную во вторичных порах, удаление которой происходит до IOO^OC и не влияет на усадку структуры. После IOO^OC удаляется молекулярная H₂O, находящаяся в иризирующем опаловом материале в виде свободно связанных сложных слоёв, входящих в гидратную оболочку глобули, и молекулярная H₂O – из порового пространства внутри глобуль, что ведет к началу усадки структуры.

3. В интервале температур 200-320⁰С происходят два параллельных процесса – конденсация гидроксильных групп и удаление органики. Доля химически связанной H₂O составляет около трети всей H₂O. Термомеханический анализ показывает, что допустимая усадка при термообработке опалового материала, полученного вторым способом, происходит главным образом за счет конденсации H₂O в виде внутриглобулярных OH-групп. В опаловом материале, приготовленном первым способом, существенная усадка происходит при удалении этоксигрупп, по предположению больщей частью внутриглобулярных, вследствие гидролиза SiO-C₂H₅ связей.

 4. Характер дегидратации контролируется общей пористостью опалового материала.

5. Способы получения опалового материала влияют на его физико-жимические свойства.

6. Полученные данные позволяют сделать рекомендации, касающиеся режима термообработки опалового материала.

Литература

I. Айлер Р. Коллоидная химия кремнезёма и силикатов. — М.: Госстройиздат, 1959.— 288 с.

2. Журавлёв Л.Г., Киселёв А.В., Найдина В.Г. Определение поверхностной и внутренней структурной воды силикателя методом дейтерообмена с масс-спектрометрическим контролем. - ЖФХ, 1963, т.37, № 10, с.2258-2265.

З. Киселёв А.В., Лигин В.И., Рябенко Е.А. и др. Исследование деэтоксилирования методами ИК и ЭПР-спектроскопии. - Коллоидн. журн., 1976, т.38, вып.2, с.347-350.

4. Оккерсе К. Пористый кремнезём. - В кн.: Строение и свойства адсорбентов и катализаторов. М.: Мир, 1973, с.233-284.

5. Сысоева Е.И., Денискина Н.Д., Калинин Д.В., Казанцева Л.К. ИК-спектроскопия искусственных благородных опалов. --См. статью в настоящем сб., с.65.

6. Segnit E.R., Stevens T.J., Jones J.B. The role of water in opal. - Journ. Geol. Soc. Austr., 1965, v.12, v.2, p.211-226.

7. Stöber W., Fink A., Bohn E. Controlled growth of monodisperse silica sphere in the micron size range. - Journ. Colloid and Interface Sci., 1968, v.26, p.62-69.

УДК 539.893+536.45

А.М.Дорошев, В.М.Логвинов, М.Олеш, П.Ю.Нехаев

ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В 2nSi03 И 2n2Si04 ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ

Для освещения вопроса минерального состава глубинных 30H Земли в последнее время интенсивно исследуются фазовые превращения при сверхвысоких давлениях в большом числе силикатных систем. При этом ценную информацию о возможных превращениях в породообразующих силикатах дают исследования на модельных системах при относительно низких давлениях. На примере таких исследований уже предсказано большое число фаз высокого давления в породообразующих системах, устойчивых однако лишь при значительных давлениях. Таким образом, знание фазовых взаимоотношений в модельных системах позволяет прогнозировать те или иные превращения в породообразующих минералах, что облегчает фазовый анализ и, соответственно позволяет существенно уменьшить число экспериментов при экстремальных условиях. Кроме того, исследование однотишных соединений помогает понять общие закономерности поведения кристаллических тел при высоких давлениях и температурах и объяснить конкретные различия фазовых взаимоотношений в подобных системах. Поэтому представляет интерес более детальное исследование VCтойчивости силикатов цинка, которые при высоких давлениях испытывают превращения, аналогичные превращениям у силикатов магния.

Экспериментальная часть работы выполнена на аппарате высокого давления типа "поршень-цилиндр" и двухступенчатом аппарате типа "разрезной куб".

Эксперименты на аппарате "поршень-цилиндр" проведены по стандартной методике. Основной отличительной особенностью нагревательной ячейки, использованной в данной работе, является замена деталей из талька на Прессованный мас1, что существенно снижает внутреннее трение в ячейке [4,9].

Принципиальная конструкция аппарата "разрезной куб" привецена в работе [2]. Вторая ступень данного аппарата состояла из 8 кубических пуансонов из твердого сплава ВК-ЗМ с ребром 27 мм. Одна из вершин каждого пуансона второй ступени усечена таким образом, что при их сложении в центре образуется октаэдрическая полость, которая служит рабочим объемом. В диапазоне павлений дс 80 кбар использовали пуансоны с ребром усечения 8 мм. Более высокие давления создавали на пуансонах с ребром усечения 3,5 мм. В качестве рабочего тела до 80 кбар применяли OKTADID из талька, прокаленный при 850°С в течение часа (рис. I). Длина ребра октаздра составляла I2 мм. Исследуемое вещество помешалось в пилин прический графитовый нагреватель, внешний диаметр которого равен 3,5 мм, толщина стенки - 0,2 мм, высота - 4 мм.



Рис.І. Нагревательная ячейка аппарата "разрезной куб"

Обозначения: I - пуансон 2-ой ступени, 2 - прокладка, 3 - рабочее тело (октаэдр из талька или MgO), 4 - датчик давления, 5 - термопара, 6 образец, 7 - нагреватель, 8 - металлический электроввод, 9 - теплоизоляция из обожженного талька

Пря давлениях выше 80 кбар в качестве рабочего тела применяли октаэдр из полуспеченной окиси магния с ребром 7,6 мм. Нагревателем служили в. цилиндр из платины (диаметр I,7 мм,высота 2,5 мм, толщина стенки 0,03 мм) или механическая смесь платиновой черни и исследуемого вещества. В последнем случае нагреватель отделяли от стенок октаэдра тонкой пленкой графита. Калибровку по давлению проводили по переходам в следующих

веществах: Bi (25,5 и 77 кбар), Sn (96 кбар) [8], ZnTe (I20 кбар) [II], FbSe (40 и 68 кбар) [3]. Для коррекции давления относительно предварительно установленной зависимости в каждом опыте использовали одно или два реперных вещества. Поскольку при давлениях выше IOO кбар нет общепринятой кал бровочной зависимости для определения поправки на термическое расширение рабочего тела, приведенные нами значения давления соответствуют калибровке в холодном состоянии.

Температуру измеряла Pt-PtRh10 термопарой диаметром 0,2 π 0, І мы. В опытах в большом рабочем объеме (ребро усечения пуансонов 8 мм) спай термопары нахопился на внешней поверхности нагревателя, при ребре усечения пуансонов 3,5 мм спай термопары помещаля в центр образца. Поправки к показаниям термопары вводили с учетом температуры рабочей поверхности пуансонов второй ступени и соответственно, ЭДС, возникарщей на контакте пуансонов и "холодных" концов термопары. Для большой ячейки определена разница температур центральной и наружной частей нагревателя. Величина температурной поправки проконтролирована по плавлению металлов (Au, Ag, Cu) под давлением. С учетом этих поправок точность измерения температуры составляла +25°С для большой π +50°С для малой рабочей ячеек.

В качестве исходных материалов использовали предварительно синтезированные фазы, виллемит (Zn_2SiO_4 -I) и илинопироксен (ZnSiO_3). Синтез проведен из смеси оксидов, ZnO спектральной чистоты, торговая марка JMC 115 (Johnson Mattney Chemicals Ltd.) и SiO₂ марки ОСЧ- I2-4. Виллемит синтезирован при T = I400^OC за 20 часов при атмосферном давлении, клинопироксен при P = 33 кбар и T = I200^OC за 4 часа. Мономинеральность фаз подтверждена оптически и рентгенографически. Смесь виллемита с кварцем в отношении I:I синтезирована из смеси оксидов при P = 27 кбар и T = I200^OC за 4 часа.

Исходные вещества и все детали рабочих ячеек тщательно просущивали непосредственно перед постановкой опытов. Исключения составляют опыты по изучению устойчивости клинопироксена ZaSiO₃ в области давлений 27-45 кбар и температур ниже IOOO^OC, в которых исходные вещества содержади небольшое количество воды (< I вес. %).

Рентгенографическое исследование проведено на дифрактометре

"ДРОН-I,5" с медным антикатодом, при скорости счетчика I^O в минуту для фазового анализа и 0,5^O в минуту для расчета параметров ячейки синтезированных фаз. В последнем случае съемку проводили с внутренним стандартом, кремнием марки ОСЧ I2-5, $\alpha_{z} = 5,43054$ А. Параметры рассчитывали методом наименьших квадратов на ЭВМ "МИР-2" по алгоритму, предложенному в работе [I].

Полиморфные модификации ZnSiOz

<u>Клинопироксен</u>. Индицирование дифрактограмми клинопироксена проведено на базе ячейки с пространственной группой с₂/с, при этом отражений, не отвечающих данной пространственной группе, не обнаружено. Параметри элементарной ячейки вычислены по 50-ти рефлексам и составляют $a_0 = 9,7863(16)$ Å, $b_0 = 9,1749(20)$ Å, $c_0 = 5,2963(12)$ Å, $\beta_0 = III,46^{\circ}(2)$, $v_0 = 442,59(II)$ Å, теоретическая плотность $\beta = 4,245$ г/см³. Показатели преломления, измеренные с помощью иммерсионных жидкостей, составляют Ng = = I,760(5), Np = I,708(2). Показатели преломления и параметры ячейки практически постоянны во всей области устойчивости клинопироксена.

Нижняя по давлению граница поля устойчивости клинопироксена представлена реакцией Cpx = W + Q , которая изучена нами методом моновариантной ассоциации в диапазоне температур 750°С – I450°С. Исходным веществом служила механическая смесь клинопироксена и ассоциации виллемита с кварцем. Во всей области температур в опытах четырехчасовой длительности наблюдали практически полное превращение в ту или иную сторону. Результати экспериментов отражени на рис.2. Линия реакции Cpx = W + Q расположена в области давлений 27-30 кбар и имеет небольшой отрицательный наклон. Вычислено уравнение эсой реакции P_(Kбар) = 32,5 - 3,6·10⁻³T (°С). В целом, величина давления превращения Cpx = W + Q, установленная нами, на 4-4,5 кбар ниже ранее установленной в работе [13].

Нижняя по температуре граница поля устойчивости клинопироксена, по данным работи [I3] расположена в области 850⁰С, не зависит от температуры и представлена реакцией срх = zn_2sio_4 (П.Ш., IV) + sio_2 . Поскольку в нашем опыте при T = 750⁰С и P = 3I кбар (рис. 2) вместо виллемита с кварцем образуется клинопироксен, что противоречит данным работи [I3], нами предпринята попытка зафиксировать нижного по температуре границу при P = 45 кбер. При этом установлено, что при IOOO и 750°С в шести – и восьмичасовом опытах соответственно клинопироксен синтезируется как из смеси, оксидов, так и за счет виллемита с кварцем. Таким образом следует констатировать, что установленная в работе [I3] граница является кинетической границей синтеза клинопироксена в опытах небольшой длительности (менее 2-х часов).

При обсуждении фазовых взаимоотношений в исследуемой системе в области давлений выше IOO коар необходимо подчеркнуть, что все известные из литературы и полученные нами данные характеризуют поля <u>синтеза</u> фаз и ассоциаций, поэтому следует иметь в виду, что при различии методик эксперимента возможны различные результаты.

Верхняя по давлению граница клинопироксена установлена в работе [I2] в интервале температур 1030-1600°С и представлена прамым превращением в влъменитоподобную модификацию. При температурах ниже II00°C данное превращение зафиксировано рентгеновским методом in situ [5]. Однако в работе [I3] при T = I000°C, P = IO4 коар и T = 850°C, P = IO0 коар вместо ильменитоподобной модификации получена ассоциация Zn2SiO4-VI + стишовит. Для проверки характера реакции разложения клинопироксена нами проведена серия опытов в интервале давлений 100-125 кбар. Исходным веществом служил предварительно синтезированный клинопироксен. Во всех опытах использовали нагреватель из платиновой черни. Ллительность экспериментов составляла I-4 часа. Полученные результаты приведены на рис 3 При 1200°С клинопироксен разлагается При P = I05 + 5 кбар, что находится в хорошем соответствии с данными [12]. Однако характер зайиксированных нами реакций совершенно иной. По нашим данным, примое превращение клинопироксена в ильменитоподобную модификацию имеет место только в области высоких температур, T > I450°C. При более низких температурах клинопироксен разлагается на смесь стиповита и неизвестной ранее фазы. обозначенной нами Zn2SiO4-VI . Ильменитоподобная модификация синтезируется за счет ассоциация Si0₂(St)+Zn₂Si0₄-VI при давлениях выше 120 кбар. Таким образом, между полем клинопироксена и полем ильменитоподобной модификатии ZaSiO3 существует зона в I5-20 коар распада клинопироксена по реакции Cpx = St+2n2SiOu-VI .



Рис.2. Нижняя по давлению граница поля устойчивости клинопироксена ZnSiO₃.

Обозначения: Срх – клинопироксен, W – виллемит (Zn_2SiO_4-I), α' -, $\beta-Q - \alpha', \beta$ кварц, Со – козсит. Залитые кружки – клинопироксен устойчив, пустые кружки – устойчива ассопиация виллемита с кварцем. Кружок, залитый наполовину – клинопироксен синтезирован из смеси оксидов



Рис.3. Верхняя по давлению граница поля устойчивости клинопироксена Обозначения: I - клинопироксен устойчив, 2 - СРх— Zn₂SiO₄-VI+St (стишовит), нагреватель - платиновая чернь, 3 - СРх — Zn₂SiO₄-VI+St +IIm, нагреватель - платиновая чернь, 4 - СРх— IIm нагреватель платиновая трубка, 5 - Zn₂SiO₄-IV+St синтезирована из смеси виллемита с кварцем [I3]

Вычисленчые нами рентгенографические характеристики ильменитоподобной молификации ZnSiO_{5} ($a_{o} = 4,7446(5)\text{Å}$, $c_{o} = 13,7474(24)\text{Å}$, $v_{o} = 268,0(1)\text{Å}$, теоретическая плотность $\mathcal{P} = 5,258 \text{ г/см}^{3}$) находятся в хорошем соответствии с известными ранее [6].

<u>Ортопироксен</u>. При T = 650⁰C и P = 45 кбар исходный клинопироксен за 24 часа частично превратился в другув, предположительно ортопироксеновую модификацию. На дифрактограмме продуктов

данного опыта наряду с клинопироксеном зафиксировано десять дополнительных отражений (табл. I), которые проиндицированы нами на базе орторомбической ячейки.

Таблица I

I/I _o	<u>hkl</u>	20CuKg M3Mep.	20CuKo. BLT.	I/I _o	<u>hk1</u>	2 0 CuK _x Измер.	20CuK _x Bhy.
25	32I	29,75	29,740	45	5 3 I	42,45	42,277
IO	511	3I,37	31,386	IO	72I	43,48	43,523
IO	42I	32,54	32,517	I5	63I	45,58	45,53I
I00	I 3I	34,305	34,329	I5	702	49,10	49,142
15	52I	3 5,8I	35,805	IO	902	57,36	57,342

Рентгенографические характеристики орторомбической модификации 2nSiO₃

 $a_o = I8,22I(I8)\text{\AA}$, $b_o = 9,I4I(7)\text{\AA}$, $c_o = 5,282(9)\text{\AA}$, $V_o = 879,(8)\text{\AA}$, $\rho_{\text{TeOP.}} = 4,271 \text{ r/cm}^3$

Вичисленные параметры элементарной ячейки находятся в хороцем соответствии с данными, полученными при монокристальной съемке в работе [I0]. Отдельные монокристаллы орторомбической модификации ZnSiO₃ найдены авторами этой работы в иродуктах синтеза Zn₂SiO₄-III при P = 84 кбар, T = I400⁰C из шихты с соответствующей стехнометрией. Следует отметить, что при синтезе из шихты, соответствующей ZnSiO₃, проведенном этими исследователями в более ранней работе [I3] в широком диапазоне давлений 30-IOO кбар и температур 850-I400⁰C, ортопироксеновая модификацяя не получена. При этих условиях образуется только клинопироксен. Судя по нашим данным, ортопироксеновая модификалия ZnSiO₃ является фазой низких температур и высоких давлений. Линия превращения CPx = 0Px при P = 45 кбар проходит в диапазоне температур 650-750⁰C и, поскольку теоретическая плотность ортопироксена примерно на I% выше плотности клинопироксена, она должна иметь небольшой положительный наклон dT/dP

Полиморфные модификации Zn2SiO4

Б работе [I3] определены поля синтеза четырех модификаций Zn₂SiO₄ (I-IV). Ни одна из этих модификаций не имеет аналогов среди ортосиликатов магния, кобальта и никеля. Синтез пятой модификации (2n₂SiO₄-V), изоструктурной модифицированной шпинели β-Mg₂SiO₄ и β-Ni₂SiO₄ осуществлен в работах [6,I3] при T = IOOO^OC в интервале давлений II5-I20 кбар. При I35 кбар вместо



Рис. 4. Поля синтеза модификаций Zn₂SiO₄ Сбозначения: I – нагреватель-платиновая трубка, исходный состав – виллемит, 2 – исходный состав – смесь оксидов, 3 – нагреватель-платиновая чернь, исходный состав-виллемит, 4 – нагреватель-платиновая чернь,исходный состав-клинопироксен, 5 – Zn₂SiO₄, – V-IIm+St по данным работы [6], 6 – синтез Zn₂SiO₄-IV по данным работы [13], 7 – синтез Zn₂SiO₄-VI по данным работы [6]

Zn2SiO4-V CMHTE3Mрована смесь ильменитоподобной ZnSiOz Z ZnO (3Haчения давления, приведенные в работе [6] скорректированы в COOTветствии С новой шкалой давлений, используемой в нашей работе). Peзультаты синтеза модификаций Zn₂SiO₄ приведены на рис. 4.

Синтез не известной ранее фазы Zn₂SiO₄-VI осуществлен нами в широком интервале температур и области давлений IIO-I25 кбар.Прежде всего отметим, что данная фаза получена нами без

примесей других модификаций Zn₂SiO₄ только при разложении клинопироксена при использовании нагревателя из платиновой черни. В опыте, проведенном на том же нагревателе из виллемита (Zn₂SiO₄-I), получена смесь Zn₂SiO₄-V и Zn₂SiO₄-VI. Продуктами опытов с трубчатым нагревателем из платины (T = I500^OC),является смесь Zn₂SiO₄IV и Zn₂SiO₄-V, при снижении температуры вначале образуется практически мономинеральнай фаза Zn₂SiO₄-V и при дальнейшем снижении температуры вместе с Zn₂SiO₄-V синтези-

Рентгенографические характеристики Zn2SiO4-VI

I/I _o	hkl	29СиК, экспер.	20CuK _{&} Bhy.	2 ⁰ CuK _× [6] ^Ξ
I5	200	19,51	I9,544	(+ <u>Ilm</u>)
25	210	21,30	21,272	21,3
25	030	25,14	25,126	(+11m)
60	300	25,50	29,499	29,5
15	0,02	30,00	29,998	
20	012	31,18	31,166	
I5	I02	31,56	3I,594	
60	II2	32,78	32,726	32,8
60	320	34,05	34,074	(+Ilm)
I5	I40	35,14	35,177	
25	23I	35,50	35,481	
55	122	35,82	35,93I	35,8
40	212	37,035	37,055	37,0
	041		37,029	
30	321	37,45	37,358	37,4
IO	302	42,59	42,562	
	401		42,60 I	
40	4 II	43,48	43,48I	
I00	I50	43,75	43,718	43,6
IO	440	53,00	53,036	
I5	I33	53,85	53,851	
15	014	63,00	62,986	

 $a_0 = 9,084(5)$ Å, $b_0 = 10,632(6)$ Å, $c_0 = 5,960(2)$ A, $\nabla_0 = 575,7(4)$ Å

* Данные сняты с двфрактограммы, приведенной на рис. I в работе [6].

руется небольшое количество Zn₂SiO₄-VI. Отмеченные обстоятельства не позволяют пока сделать вывод о соответствии состава Zn₂SiO₄-VI стехнометрии оливина. Рентгенографические карактеристики Zn₂SiO₄-VI приведени в табл.2. Индипирование рентгенограмми и расчет параметров решетки этой фази проведени нами на базе орторомонческой ячейки. Следует отметить, что фазу Zn₂SiO₄-VI синтезировали, по-видимому, и ранее. На призеденной в работе [6] днфрактограмме опыта при P = I60 кбар (?) по синтезу ильменитоподобной модификации кмеется ряд рефлексов небольмой интенсивности, одущенных авторами этой работы, которые соответствуют стиновиту и $2n_2SiO_4$ -VI (табл.2). Исходя из этих данных можно констатировать, что поле синтеза $2n_2SiO_4$ -VI гораздо шире поля синтеза $2n_2SiO_4$ -V.

Граница между полями синтеза $2n_2SiO_4$ -IV и $2n_2SiO_4V$ имеет положительный наклон dT/dP и может быть описана уравнением P (кбар) = 82 + 0,025 T(^OC).

Обсуждение результатов

Сравним общую последовательность фазовых превращений для орто- и метасиликатов магния и цинка. Р – Т-лиаграммы для этих соединений исследованы еще далеко не полно, поэтому приведенные на рис. 5 схеми фазовых переходов имеют обобщенщий характер. Каждую последущую фазу или ассоциацию можно получить из предидущей при постоянной температуре только при повышении давления.

Соединения типа ASio, в области давлений ниже IOO коар имеют структуру пироксена, при этом магнезиальные пироксены устойчивы уже при I атм, тогда как ZnSiO3 устойчив только при давлениях выше 26-27 коар. Отличается и соотношение плотностей ортои клинопироксенов магния и цинка, ортопироксен цинка плотнее соответствуищего клисопироксена и является в противоположность магнезнальному ортопироксену, фазой низких температур и високих давлений. Примечательным фактом является обнаруженная нами реакция 2ZnSi03 = Zn2Si04-VI + Si02 , HOCKONERY KODORO RESECTER AHANOгичная реакция разложения магнезиального пироксена 2MgSiOz = $Mg_{2}SiO_{4}(\beta, p) + SiO_{2}$. С повышением давлентя из ассоциации² типа $A_{2}SiO_{4}+SiO_{2}$ образуется соединение $ASiO_{3}$, имеющее структуру ильменита или перовскита для MgSiO3 и ильменита для ZnSiO3. Кроме того, для ZnSi0, при высоких температурах набладается прямое превращение Срх => 11m , при более высоких давлениях для ZnSiOz зафиксировано разложение на смесь оксидов. По-видимому, возможно разложение на смесь оксидов и силикатов магния [7], однако пока неясно соотношение между полные устойчивости перовскитоподобной смеси и смеси оксидов периклаз+стишовит,поскольку плотности их близки. Таким образом, направление и характер фазовых перехо-



Рис. 5. Схема превращений в орто- и метасиликатах магния и цинка

дов для ZnSiO₃ и MgSiO₃ в области высоких давлений подобны, поэтому можно ожидать, что новые возможные полиморфные модификации этих соединений будут иметь близкие структуры, при этом появление новых фаз ZnSiO₃ должно происходить при более низких давдениях.

Фазовые соотношения для соединений цинка и магния типа A₂SiO₄ при давлениях ниже IOO ко́ар существенно отличаются. Zn₂SiO₄ в этом диапазоне имеет четыре полиморфные модификации, и ни одна из них не имеет оливиноподобной структуры. Только при давлениях выше IOO ко́ар становится устойчивой Zn₂SiO₄-V, изоструктурвая с β-Mg₂SiO₄. Аналог синтезированный нами фазы Zn₂SiO₄-VI в системе MgO-SiO₂ не известен.

Таким образом, анадиз фазовых превращений в системах ZnO -SiO₂ и MgO-SiO₂ позволяет сделать вывод о том, что мета- и ортосиликаты данных систем в области высоких давлений в целом претерпевают ряд подобных превращений, при этом фазовые переходы для силикатов пинка имеют место при более низких давлениях, поэтому ZnSiO₃ и Zn₂SiO₄ могут рассматриваться как модельные системы для MgSiO₃ и Mg₂SiO₄ при давлениях выше IOO кбар, соответствущих мантик Земли.

Литература

I. Дорошев А.М., Кузнецов Г.Н. Уточнение параметров элементарной ячейки кристаллов методом наименьших квадратов. - См. статью в настоящем сб., с.131-141.

2. Ран Э.Н., Малиновский И.В. Кубический двухступенчатый аппарат с гидростатическим приводом. - В кн.: Экспериментальные исследования по минералогии (1974-1975 гг.). Новосибирск: Издние ИГиГ СО АН СССР, 1975, с.149-154.

3. Шипило В.Б., Плишевская Е.М., Бельский И.М. Реперние точки для аппаратов высокого давления с твердой средой, передающей давление. - В кн.: Эксперимент и техника высоких газовых и твердофазных давлений. М.: Наука, 1978. с.202-203.

4. Akella J. Quartz - coesite transition and the comparative friction measurement in piston-cylinder apparatus using talcalsimag glass (TAG) and NaCl high pressure cells.- N.Jb. Miner. Mh., 1979, N 5, s.217-224.

5. Akimoto S., Yagi T., Inoue K. High temperature-pressure phase boundaries in silicate systems using in situ x-ray diffraction. - In: High - Pressure Research Application. N.Y.: Acad.Press., 1977, p.585-602.

6. Ito E., Matsui Y. High - pressure synthesis of ZnSiO₃ ilmenite. - Phys. Earth. Planet. Inter., 1974, v.9, p.344-352.

7. Kumasawa M., Sawamoto H., Ohtani E., Masaki K. Postspinel phase of forsterite and evolution of the Earth's Mantle. -Nature, 1974, v. 247, N 8, p.356-358.

8. Lloyd E.C. (ed) The Accurate Characterisation of the High pressure Environment. - National Bureau of Standards, Spec. Publ., 1971, N 326, p.333.

9. Mirwald P.W., Massonne H. Quartz - coesite transition and the comparative friction measurements in piston-cylinder apparatus using talcalsimag-glass (TAG) and NaCl high pressure cell: A discussion. - N.Jb. Miner. Mn., 1930, N 10, s. 469-477.

10. Morimoto N., Nakajama Y., Syono Y., Akimoto S., Matsui Y. Crystal structures of pyroxene - type $2nSiO_3$ and $2nMgSi_2O_6$ - Acta Cryst., 1975, v. B 31, p.1041-1049.

11. Neindre B., Suito K., Kawai N. Fixed points for pressure calibration above 10 GPa. - High Temp. - Hing Pressures, 1976, v. 8, p.1-20.

12. Ohtani E. Melting Relation of Fe₂SiO₄ upto about 200 kbar. - Journ. Phys. Earth, 1979, v. 27, p.189-208.

13. Syono Y., Akimoto S., Matsui Y. High pressure transformations in zinc silicates. - Solid State Chem., 1971, v.3, p.369-380.

В.Г.Томас, А.С.Лебедев

КИНЕТИКА ГИДРОТЕРМАЛЬНОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ БЕРИЛЛА ИЗ ОКСИЛОВ

Известно, что проведение синтеза берилла из оксидов в кислых хлоридных растворах осложняется параллельно протекающими реакциями образования хризоберилла и фенакита [3,7], которые в дальнейшем практически не участвуют в реакциях. В связи с этим представлялось интересным изучение кинетики реакций, протекающих при синтезе берилла в кислых фторсодержащих растворах, для которых образование хризоберилла не характерно.

Методика экспериментов

Опыты проводились в автоклавах из стали I2XI8HI0T объемом I4-I6 мл при 600° C и I000 атм по известной методике [2]. В автоклав помещалась смесь оксидов Вео, Al_{203} , SiO₂ в стехиометрии берилла из расчета 0,I25 г смеси на I мл объема и компоненты целочно-фторидного минерализатора с водой, количество которой определялось коэффициентом заполнения $\mathbf{F} = 0,5$. Время выхода автоклавов с опытами в режим составляло 5-7 минут, закалка в холодной воде до нормальной температуры длилась I-3 минуты. Температурный режим автоклава в процессе опыта поддерживался системой ВРТ-3, с точностью $\pm 5^{\circ}$ C. Исходными материалами для синтеза служили: керамика Вео марки "ч" (фракция I-2 мм), Al_{203} – электрокорунд (фракция 0,02-0,04 мм), кварц из месторождения Волынское (фракция 2-3 мм и 0,5-I,0 мм).

Количественное изучение фаз после опыта проводилось методом внутреннего стандарта [5] на дифрактометре TUR-62M. Количество фазы в смеси определялось по отношению интенсивности в максимуме рефлексов фазы (\mathcal{J}_{φ}) и эталонного вещества (\mathcal{J}_{φ}) на дифрактограмме

$$X_{\Phi} = \kappa X_{\Im} \frac{\Im \Phi}{\Im_{\Im}},$$

где Х_ф и Х_э - весовые проценты фазы и эталонного вещества в пробе, а к - постоянный коэффициент, который определялся по трем--четырем калибровочным смесям. Состав калибровочных смесей включал исследуемое вещество, реактив ZnO марки "хч", выбранный в качестве эталона, и кварц для стандартизации степени истирания пробы. Проба истиралась в агатовой ступке со спиртом в течение 17 мянут, при этом небольшие отклонения в степени лисперсности частиц смеси не оказываля существенного влияния на интенсивность получаемых рефлексов. После четырехкратной съемки калибровочной смеси коэффициент К определялся методом наименьших квадратов (табл. I) по измерению интенсивностей соответствующих рефлексов в максимуме[#]. Рефлексы, по которым проводилась количественная оценка фаз, выбирались в соответствии с общими требованиями, предъявляемыми к данной методике. Их интенсивность снималась по точкам через 0,01° с помощью цифропечатающего устройства. Экспозиция счета - IO сек. Значение интенсивности фона усереднялось по десяти замерам. Режим съемки: излучение Cu K, U = 30kv, I = I5 ma. Высота входной и выходной щели дифрактометра 9 мм, ширина соответственно 0,5 и I,0 мм. Полученные значения констант К для выбранных фаз приведены в табл. І. В табл. 2 приведены погрешности количественного определения фаз при их малых содержаниях в пробе, близких к порогу чувствительности прибора.

В процессе количественного определения проб, полученных при проведении экспериментов, была отмечена сильная зависимость рефлекса d_{ot} = 3,II фенакита от времени его кристаллизация, что,вероятно, обусловлено особенностями зародышеобразования его кристаллов на первых этапах синтеза. При обработке результатов опытов пробы приготавливались так же, как и при нахождении констант К.

^{*} Специальные исследования с кварцем показали, что при измерении интенсивностей в максимуме, вместо собственно интенсивностей характеристических рефлексов, понижается точность его количественного определения с 2 до 2,6 вес.%. Однако, это вполне оправдано значительным сокращением времени обработки получаемых данных.

Таолица I

Значение	констант	К	для	различных	фаз
N	точность	ИХ	опре	еделения	

Фазы	đ	-	Точность опреде- ления к %	Интервал измерения фона, (град)	Интервал из- мерения пика, (град)
ALF3	3,53	0,820	2,6	12,20-12,30	I2,58-I2,66
BeO	2,06	0,3I0	6,0	22,20-22,30	2I,90-22,00
LiF	2,0I	0,450	2,0	21,70-21,80	22,45-22,55
SiO2	4,26	0,304	2,5	IO,IO-IO,I5	IO,38-IO,46
Бертрандит	4,44	0,I50	8,9	9,50-9,60	9,95 — I0,05
Берилл	7,26	0,456	6,7	5,20-5,30	5,47-5,57
Топаз	3,19	0,282	5,6	14,15-14,20	I3,90 - I4,00
Al203	3,48	0,240	7,2	I2,88-I2,98	12,70-12,80
Криолит	4,II	0,352	2,8	IO,87-IO,92	I0,70-I0,80

Таблица 2

Погрешности при определении малых количеств фаз на пороге чувствительности прибора

Фаз н	Среднее из- меренное содержание, г	Ошибка из- мерения со- держания,	Истинное содержа ние, г	Отклонение среднеизме- ренного со- держания от истичного,
Al203	0,0295	4,2	0,0309	4,5
AlFz	0,0227	2,17	0,0230	I,2
LiF	0,0264	2,4	0,0244	8,2
BeO	0,0224	4,8	0,024I	7,2
Si02	0,3450	4,6	0,0395	I3,8
Берилл	0,0293	4,5	0,0297	I,3
Криолит	0,0I59	7,6	0,0I34	I3 , 7
Топаз	0,0278	4,4	0,0263	5,7
Бертрандит	0,0358	4,4	0,0318	12,6

Данные по изучению количественных взаимоотношений исходных продуктов и кристаллических фаз, образуищихся в изучаемой системе на протяжении 14 суток, представлены на рис. І. Из этих дан-

ных следует, что это сложный многосталийный процесс образования берилла с участием ряла промежуточных фаз: фтортопаза -Al_SiO4(F,OH)2, propoeptpangura BeuSi207(OH,F)2, фенакита - ВезSio, и фазы типа криолита. Отсутствие на приведенном графике А1203 связано с его переходом в растворенное состояние уже в первые часы эксперимента. Первой кристаллической фазой, появляющейся в системе, является фтортопаз, который к истечению вторых суток связывает уже около 90% AJEMAния. Топаз образуется R виде тонкокристаллического порошка на поверхности шихтн. Согласно IAHRHM. представленным на рис.2, с уменьшением исходной фрак-



Рис.І. Выход фаз (Р) в зависимости от времени (t)

Бе – берилл, Фен – фенакит, Тп – фтортола́з, Брт – бертрандит, Кр – фаза типа криолита

ции SiO₂ от 2-3 до 0,5-I,0 мм увеличения скорости образования топаза не происходит. В случае помещения SiO₂ вверху автоклава, отдельно от остальной шихти, основная масса фтортопаза все равно находилась на дне автоклава. Спустя I5 часов после начала эксперимента в составе образовавшихся продуктов появляются берилл и фторбертрандит, который впоследствии сменяются фенакитом. Скорость выхода берилла и фенакита в интервале от 2 до I0 суток поетоянна и равна примерно 6 мг/мл сут. Количество топаза в ин-

IOI



Рис.2. Зависимость выхода фтортопаза (M) от времени (t) х - шихта si0₂ фракции 2-3 мм; . - шихта si0₂ фракции 0,5-I,0 мм тервале от 2 до 10 суток также линейно убывает со скоростью 2 мг/мл сут. К десятым суткам исчезает ВеО, что приводит к уменьшению скоростей всех реакций с участием бериллия. Количество фенакита начинает уменьшаться.

Обсуждение результатов

Полученные данные показали, что процесс фазообразования в изученной системе может быть представлен в виде

последовательно-параллельных реакций с тремя характерными этапами. В первые двое суток происходит насыщение раствора компонентами шихты и интенсивное образование фтортопаза, фторбертрандита и берилла из оксидов со скоростями, характеризующимися экспоненциальной или степенной зависимостью от времени. К концу этого этапа весь Al₂O₃ связывается в топазе, а фторбертрандит начинает растворяться с образованием фенакита или берилла по реакциям:

$$Be_4Si_2O_7F_2+H_2O \longrightarrow 2Be_2SiO_4+2HF$$
(I)

$$3Be_4Si_2O_7F_2 + 4Al_2SiO_4F_2 + 14SiO_2 + 7H_2O - 4Be_3Al_2Si_6O_{18}^+$$
 (2)
14HF.

Второй этап (3-10 суток) характеризуется постоянными скоростями реакций выхода берилла, фенакита и расхода BeO, SiO₂ и топаза, являющегося источником алюмяния, необходимого для роста берилла по реакции:

 $Al_2SiO_4F_2+3BeO+5SiO+H_2O \longrightarrow Be_3Al_2S_{16}O_{18}+2HF$ (3)

Наступление третьего этапа (после IO суток), обусловлено исчезновением из системы исходного ВеО. Он характеризуется тем, что единственной кристаллизующейся фазой становится берилл, который образуется со скоростью I мг/мл.сут за счет фенакита и топаза:

3Be₂SiO₄+2Al₂SiO₄F₂+7SiO₂+2H₂O -->2Be₃Al₂Si₆O₁₈+4HF (4) Линейный характер изменения скорости роста берилла от времени на втором и третьем этапе показывает, что лимитирующими стадиями для реакций (3) и (4) являются реакции растворения соответственно топаза и фенакита. Независимость скорости реакции образования топаза от скорости растворения SiO₂ позволяет предполагать, что она определяется активностью фтора и алыминия.

Таким образом, в изученных кислых фторсодержащих растворах так же, как и в хлоридных, синтез берилла из оксидов происходит с образованием побочных фаз: фтортопаза и фенакита. Однако в отличие от хлоридных систем, где параллельно кристаллизующиеся с бериллом хризоберилл и фенакит практически не встпупают во взаимодействие, в изученных растворах образование берилла за счет растворения фтортопаза и фенакита продолжается с достаточно высокой скоростью.

Метастабильныя устойчивость хризоберилла с фенакитом и кварцем при T = 400°С в экспериментах с хлоридными растворами и чистой водой подтверждает возможность совместного нахо...дения этих минералов в пегматитах [6] при низкой активности углекислоть и фтора, обычно связанного во флюорите. Напротив, неустойчивость топаза по отношению к бериллу в экспериментах, при повншенной активности бериллия и фтора, согласуется с данными о пространственной и временной разобщенности этих минералов в пегматитах и грейзенах [I,4].

Авторы признательны В.С. Павлюченко за консультацию и помощь в отработке методики количественного рентгенографического анализа и В.А.Кляхину за проявленный интерес к данному исследованию.

Литература

I. Беус А.А. Геохимия бериллия и генетические типы бериллиевых месторождений. - М.: Изд-во АН СССР, 1960. - 330 с.

2. Калинин Д.В. Механизм и кинетика гидротермальных реакций силикатообразования.-Новосибирск: Наука, 1973. - 104 с.

3. Кляхин В.А., Лебедев А.С., Рагозина Т.П., Родионов А.Я. Поведение берилла в гидротермальных растворах. - В кн.: Физикохимические условия процессов минералообразования по теоретическим и экспериментальным данным. Новосибирск: Изд-ние ИТиГ СО АН СССР, 1976, с.82-105. 4. Лазаренко Е.К., Павлишин В.И., Латиш В.Т., Сорокин Ю.Г. Минералогия и генезис камерных пегматитов Волыни. - Львов: Вища школа, 1973. - 359 с.

5. Хайкер Д.М., Зевин Л.С. Рентгеновская дифрактометрия. -М.: Физматгиз, 1963. - 380 с.

6. Burt D.M. Multisystems analysis of beryllium minerals stabilitesathe system BeO-Al₂O₃-SiO₂-H₂O. - Amer. Mineral.,1978, v. 63, p.666-676.

7. Nassau K. Synthetic emerald: the confusing history and the Current technologies. - Journ. of Crystal Growth., 1976, N 35, p.211-222.

УДК 549.07.

Д.А.Фурсенко

ЗАВИСИМОСТЬ СОСТАВА ГЕЛЬВИНОВ ОТ КИСЛОТНОСТИ-ЩЕЛОЧНОСТИ МИНЕРАЛИЗУЮЩИХ РАСТВОРОВ

Минералы группы гельвина образуют непрерывную серию твердых растворов с общей формулой (Mn , Fe, Zn)₄[BeSiO₄]₃S. Крайние члены: гельвин (Mn), даналит (Fe) и гентгельвин (Zn).

Изучение условий синтеза гельвина, даналита и гентгельвина показало, что они образуются в различных кислотно-щелочных условиях [I,2]. Так, даналит синтезируется только в кислых и слабокислых растворах, а гельвин и гентгельвин – в широком интервале. Максимальный выход даналита наблюдается в кислых, гельвина – в близнейтральных, а гентгельвина в щелочных растборах. Из вышеизложенного было сделано предположение, что из шихти смешенного состава Mno-Feo-Zno-SiO₂-Beo-S в различных кислотно-щелочных условиях будут синтезироваться различные составы серии твердых растворов гельвинов.

Синтез на затравки из природного гельвина осуществлялся по общепринятой гидротермальной методике, непосредственно в автоклавах из стали I2XI8НІОТ и в золотых плавающих вкладышах. Температура в опытах поддерживалась около 600°С. Температурный пе-

IC4





----- 2 ... 3

Рис. I. Зависимость состава синтезированного гельвина от кислотности-целочности минералооб-

разующего раствора I – гельвиновый (Mn) минал, 2 – даналитовый (Fe) минал, 3 – гентгельвиновый (Zn) минал

> Рис.2. Сводный график зависимости состава синтезированного гельвина от кислотности-щелочности минералообразующего раствора

репад составлял до 50⁰С. Автоклави и вкладиши заполнялясь водой на 0,5 свободного объема.

Синтез осуществлялся из смеси оксидов, соответствующей смешанному составу (Mn_{1,3}Fe_{1,3}2n_{1,3})S[BeSiO₄] з S.Кислотность-щелочность растворов задавалась различными соотношениями NaOH и HCl, которые добавлялись к минерализатору, ведущему себя как очень слабая кислота.

Минерализатор сложного состава вводился, чтобы получить прирост на затравку, достаточный для последующего изучения состава наросшего слоя. Состав наросшего слоя определялся полуколичественно электронным микроанализатором КЕVEX. pH растворов измерялся только для опытов из золотых вкладышей, после их полного остывания.

Состав наросшего на затравки слоя гельвина в миналах представлен на графиках а, б и в (puc.I).

Опыты, приведенные на графике а, проводились в золотых вкладышах, все остальные – непосредственно в автоклавах из стали I2XI8HIOT. Состав растворов, которыми задавались кислотность-щелочность, приведены на графиках в молях на литр рабочего объема.

Для большей наглядности результаты всех трех серий объединены в одном сводном графике, рис. 2.

Изучение зависимости состава гельвинов от кислотности-щелочности среды синтеза показало, что доля даналитового минала уменьшается от кислых к нейтральным условиям и в щелочных его совсем нет. Гельвиноватая и гентгельвиновая составляющие присутствуют в кристаллах, выращенных во всех условиях, однако, максимальное содержание гельвинового минала соответствует слабокислым и нейтральным условиям, а гентгельвинового – растет от кислых к щелочным.

Полученные данные позволяют в ряде случаев объяснять зональность природных гельвинов изменением кислотности-щелочности минералообразующих растворов.

Литература

I. Фурсенко Д.А., Кляхян В.А. Синтез минералов группы гельвина. – В кн.: Х Всесоюзное совещание по экспериментальной и технической минералогии и петрографии. Киев: Наукова думка, 1981, c.119-126. 2. Фурсенко Д.А. Гадротермальный синтез гельвина. - В кн.: Геология, методы поисков, разведки и оценки месторождений камнесамоцветного сырья. М.: ВИЭМС, 1978, с.112.

УДК 549.07

С.В.Каргальцев, А.С.Лебедев, В.С.Павлюченко

O CUHTEINGECKOM EPEMEEBNTE

Еремеевит – Al₆B₅O₁₅(OH)₃ крайне редкий и относительно малоизученный минерал, имеет уникальное строение кристаллов. Внешняя часть их оптически одноосна, а внутреннее ядро двуосно и названо эихвальдитом [3]. С практической точки эрения, еремеевит представляет интерес как драгоценный камень [I]. В настоящей работе дана сравнительная характеристика некоторых свойств еремеевита, синтезированного в гидротермальных условиях, с известными свойствами этого минерала.

Методика эксперимента

Синтез еремеевита осуществлялся во фторсодержащем минерализаторе сложного состава, в котором варьировалось мольное соотношение катионов щелочного металла - (К) к суммарному количеству анионов кислот - (А). Пятнадавти- и трипцатисуточные опыты были проведены в автоклавах из стали I2XI8HIOT объемом 200 см³ в печи с донным нагревом. Исходными компонентами для синтеза служили реактивы 2Al₂O₃·B₂O₃·5H₂O и B₂O₃, причем суммарное количество в них оксида бора было взято в два раза больше, чем требуется по стехиометрии еремеевита. Компоненты минерализатора вводились прелмущественно в виде солей хрома и железа. Средняя температура, измеряемая сверху и снизу рабочего объема по оси автоклава, составляла 610⁰С. Козфициент заполнения (F) автоклава волой брался 0,5. Для визуализации взаимоотношений растущих поверхностей кристаллов на различных стадиях эксперимента в них искусственно создавалась периодическая зональность [7,4]. Процедура

I07
эта сводилась к регулярному отключению питания нагревателя печи на 20-30 мянут через каждые 24 часа. Это вызывало кратковременное понижение средней температуры кристаллизации на 20-30°С и odpaзование маркирующей зоны в растуших кристаллах. Лиагностика синтезированного еремеевита проведена рентгенографически методом порошка на медном фильтрованном излучении. Лауэграммы снимались при параллельной и перпендикулярной ориентации шестерной оси кристаллов по отношению к рентгеновскому пучку. Параметр "а" элементарной ячейки еремеевита определен методом Вайсенберга, а параметр "с" по рентгенограммам вращения. Гранные формы кристаллов изучались на гониометре ZRG-3. Определение содержания фтора в образцах проведено потенциометрическим методом фторселективным электродом. Аналитик О.А.Козьменко.

Результаты исследований

В серии экспериментов с различным соотношением К/А получены короткопризматические и удлиненно-призматические (до игольчатых)



Рис. I. Зависимость размера, облика и преимущественной окраски синтезированных кристаллов еремеевита от мольного соотношения катионов щелочного металла (К) и анионов кислот (А) в исходном мянерализаторе спонтанные кристаллы еремеевита размером до 3-4мм, ограненные пинакоидом, гексагональными призмами и бипирамидой.

Зависимость их облика, размера и преимуцественной окраски от исходного соотнопения К/А, схематично изображена на рис. І. В кристаллах отчетливо видна искусственно

созданная ростовая зональность, с помощью которой на различном расстоянии от центра зародыша (рис. 2) были сделаны срезы по (0001).

I08



Рис.2. Искусственная зональность в кристалле еремеевита, видимая в плоскости (IOIO) и уровни изученных срезов по (ОООI)



Рис. 3. Оптическая неоднородность в кристалле еремеевита, видимая в плоскости (0001) на уровне 3-3. Щифрами обозначены одновременно погасающие участки

Оптические исследования таких срезов обнаружили их неоднородность, аналогичную описанной иля эйхвальдита. В сечении I-I' (рис. 2) выделяется практически не просветлякщаяся в скрещенных николях центральная часть кристалла, совпадающая с пирамидой роста пинакоида, и шесть попарно гаснущих через 30° секторов, совпаданиях с пирамилами роста граней {IOII}. В сечениях 2-2'и 3-3', близких к центру зародыша, видны уже двенадцать попарно гаснущих через 15° секторов совпадающих с пирамидами роста призмы {1010} и призмы {II20}. Для пирамиды роста пинакоида, представленного пестигранником 7 в центре кристалла (рис. 3), также характерно секториальное строение. Однако, по сравнению с пирамилами роста призм и баширамилами, она просветляется значительно слабее и, судя по коноскопическим наблюдениям, имеет меньший угол 2V. В срезах по {1010} подобных оптических аномалий не обнаружено. На лауэграммах, снятых с кристаллов, в которых наблюдалось секториальное погасание в плоскости (000I) не обнаружено признаков двойникования. В таблице приведены некоторые свойства синтезированного и природного еремеевита.

Как видно из приведенных выше данных, для огранки искусственного и природного еремеевита характерны такие простые формы, как призма первого рода {IOIO} и гексагональная билирамида {IOII}. Однако на синтетических кристаллах, кроме этого, часто развита притуплишая призма второго рода {IIZO} и пинакоид {000I}. Характерна взаимосвязь облика кристаллов с развитием

пекоторые	CB	лства	крис	LATRIOR	синтетич	ieckor()
	И	природ	цного	еремее	евита		

Крис- талл	Парамет- ры эле- ментарной ячейки А ^о	Показатели преломле- ния	Простые фор- мы, обляк кристалла	Цвет	Примеча ния
Синтез прованный	a=8.55 c =8.22	N _o =1.646 N _e =1.633 N _o -N _e =0,013	{IOĪO}, {IIĪO} {IOĪI}, {000I} Игольчатый, удлиненно- призматичес- кий, коротко- призматичес- кий	Бесцвет- ный, зелено- ватый, голубой, сирене- вый, розовый	Содержа- ние фтора не менее 5,8 мас.%
llриродный	a=8.59 c=8.19 [2] a=8.56 c=8.18 [3]	$N_0 = 1.653$ $N_e = 1.640$ $N_0 - N_e = 0,013$ 2	Гексагональ- ная поизма бипорамыла [5]	Бесцвет- ный, желтовато коричне- вый [2])~

простых форм. У игольчатых и удляненно-призматических индивидов главную роль играет биширамида с призмой первого рода, а у короткопризматических эта же призма с пинакоидом. Синтезированные кристаллы еремеевита, как и природные, обнаруживают специфическую оптическую аномальность, но в отличие от последних не имеют ^ж Учитывая двуосность секторов роста призм 2V-IO-30⁰ [5], можно записать N_D=I,633, N_m≈ N_g = I,646. вношней одноосной зоны. Изучение выращенных зональных кристаллов показало, что попарно погасающие в скрещенных николях секторы, связанные с пирамыдами роста обеих призм и биширамицы, имеют угол 2 V больший, чем центральная часть, овязанная с зоной роста пинакоида.

Наблюдаемые, в силу аномальной двуосности кристалла, закономерные срастания не фиксируются на лауэграммах и развертках нулевой и первой слоевых линий в пространственной группе Рь/п. Природа аномальной двуосности пока не ясна. Параметры элементарной ячейки у выращенного и природного еремеевита совпадают в пределах ошибки измерения, а показатели преломления у синтетических кристаллов меньше. По всей вероятности, это является следствием вхождения в его структуру фтора [6], который, судя по химанализу, замещает более половины позиций ОН групп. Следовательно, можно считать экспериментально подтвержденным предположение [3] о возможности такого замещения в еремеевите. Эксперименты показали, что еремеевиту свойственно гораздо большее D83нообразие окраски, чем это наблодалось на естественных кристаллах. На данном этапе природа окраски специально не изучалась. Преимущественное же окрашивание зависит от состава минерализатора и в частности, от соотношения К/А, которое определяет поведение присутствующих в растворе хромофоров (Fe, Cr и др.), извлекаемых из материала контейнера.

Литература

I. Балицкий В.С., Лисицьна Е.Е. Синтетические аналоги и имитация природных драгоценных камней. - М.: Недра, 1981. - 158с.

2. Винчелл А.Н., Винчелл Г. Оптические свойства искусственных минералов. - М.: Мир, 1967. - 526 с.

3. Головастиков Н.И., Белова Е.Н., Белов Н.В. Кристаллическая структура еремеевита. - Зап. Всесока. минерал. о-ва, 1955, ч. 84, вып.4, с.405-414.

4. Кляхин В.А. Метод изучения скоростей роста гидротермальных кристаллов. - В кн.: Выращивание кристаллов бериллиевых минералов и исследование их свойств. Новосибирск: Изд-ние ИГиГ СО АН СССР, 1980, с.30-34.

5. Лазаренко Е.К. Курс минералогии. Киев, 1951.- 687 с.

6. Соболев В.С. Введение в минералогию силикатов. - Львов: Изд-во ун-та, 1949. - 332 с.

7. Damen J.P.M., Robertson J.M. Induced Mon-Periodic Growth Strations in Flux-Grown magnetic oxide single crystals. - Journ. Crystal Growth, 1972, v.16, N 1, p.50-53.

УДК 532.13:54-31+531.756:54-31

А.Ф. Мундус-Табакаев

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПОНЕНТОВ В СИСТЕМЕ V205-V02-PDO ПРИ БОЛЬШИХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ V205

Система $V_2O_5-VO_2$ -Рьо изучена мало. Имеются данные об образовании оксидных ванадиевых бронз $\measuredangle - и \beta$ -типа с общей формулой $Pb_xV_2O_5$, где x = 0+0,0I для \measuredangle и x = 0,15+0,33 для β [9]. Построены диаграммы состояния двойных систем $V_2O_5-VO_2$, $V_2O_5-PbO.$ Анализ результатов исследований физико-химических свойств расплавов, содержащих эти компоненты, позволил сделать вывод о противоречивости данных. Например, появление экстремумов на изотермах электропроводности [7], значительные отрицательные отклонения молярных объемов от аддитирных значений молярных объемов (рис. I), особенности изменения растворимости берилла [8] не согласуются с характером диаграммы состояния системы V_2O_5 -Pbo.

С целью изучения взаимодействия компонентов были проведены подробные исследования физико-химических свойств расплавов, содержащих 0+66 мол.% Ръо (в работе указывается исходный состав образцов для системы V_{205} -Рьо, а концентрация V_{02} зависит от термической истории образца), изучены продукты кристаллизации. Измерения свойств проводились в интервале температур от плавления до $I300^{\circ}$ С. Концентрация 2. V_{02} в расплавах V_{205} достигала 8 мол.% и определялась температурой нагрева, так как зависела от степени диссоциации V_{205} по реакции $V_{205} = 2V_{2}+1/2\cdot 0_{2}$. Были измерены плотность и вязкость расплавов. Для изучения продуктов кристаллизации использовались оптическая микроскопия, рентгеновский и химический анализы, для определения положения ликвидуса в системе V₂O₅-VO₂ — вибрационный вискозиметр, температуры плавления - ДТА.



Рис. I. Изотермы молярного объема расплавов системы V₂O₅-Pb, содержащих до 8 мол.% 2.VO₂: а - данные работ [2,4] приведены соответственно на кривых I и 2, 3, кривая 3 для расплавов, содержащих 27,6 мол.% SiO₂; 6 - данные автора.Указан исходный состав для системы V₂O₅-PbO

Методика измерений

Методика измерений вязкости и плотности расплавов описана в работах [5,6], методика химического анализа в работе [3], методика определения ликвидуса вибрационным вискозиметром [I] была значительно изменена и оказалась пригодной для изучения диссоциирующих расплавов.

Начало кристаллизации или конец плавления фиксировались сетчатым зондом, установленным в расплаве возле дна тигля. В сетке зонда вискозиметра устанавливалась затравка кристаллизующейся фазы. Затравка вводилась в расплав в процессе охлаждения при температуре, на несколько градусов превышающей температуру

начала кристаллизации. Этот прием позволял устранить переохлаждение расплава, возникавшее до начала кристаллизации, и тем самым с большей точностью определить температуру ликвидуса.

В расплавах V205-PbO кристаллизация фазы VO2 всегда происходила возле дна тигля, так как из-за окисления верхних слоев расплава максимальная концентрация VO2 оказывалась в нижних слоях, и плотность нижних слоев и кристаллов VO2 превышала пло ность верхних слоев расплава. Исследования кинетики окисления плот-VO2, содержащегося в расплаве в избыточном по отношению к DaBновесному количеству, показали, что равновесие в образце устанавливается в течение длительного времени, более IO ч при температурах 700-800°С и высоте образца 40 мм [6]. Это позволило проводить определение температур кристаллизации расплава в HURHINX слоях возле дна тигля, не опасаясь изменения состава в области расположения зонда за счет поглощения кислорода из воздуха. Taким образом, верхние слои расплава использовались в качестве защиты от поглощения кислорода нижними слоями, что позволяло IDOводить измерения в неконтролируемой атмосфере.

Заданная концентрация vo устанагливалась в расплаве нагревом его до определенной температуры. Зависимость содержания VO2 в расплаве от температуры при постоянных парциальных давлениях кислорода в газовой фазе приведена в работе [3]. Сохранение неизменной концентрации кислорода в расплаве возле зонда вискозиметра контролировалось следузшим образом: после выпадения некоторого количества кристаллов VQ на сетке зонда вискозиметра и заметного снижения амплитуды колебаний зонда прекращалось снижение температуры, и производилась выдержка при постоянной температуре. Если в течение нескольких часов выпавшие кристаллы не растворялись, то результаты определения температуры начала кристаллизации расплава считались правильными. Погрешность определения ликвидуса оценивается в ±5°С. Растворение кристаллов на сетке зонда происходит при более высокой температуре, чем их выпадение. Разница между этими температурами уменьшается с понижением скорости нагрева и уменьшением количества выпавших кристаллов. При нагреве со скоростью IO^OC/ч разница между температурами не превышала 5⁰С. Истинная температура начала кристаллизации находится внутри этого интервала, так как для заметного снижения амплитуды колебаний зонда необходимо закристаллизовать некоторое

количество VO₂, понизив температуру на несколько градусов после начала кристаллизации. Небольшая разница между температурами начала кристаллизации и плавления выпавших кристаллов при нагреве свидетельствует о достаточно высокой чувствительности метода. Об этом же говорит резкое снижение амплитуды колебаний зонда после внесения затравки в расплав при температуре, мало отличающейся от температуры начала кристаллизации. Увеличению чувствительности метода определения момента начала кристаллизации способствует прорастание выпалащих на сетке зонда вискозиметра игольчатых кристалловVO₂ в направлении дна тития и блокирование ими зонда. VO₂ является бистрорастворимым веществом, так как не удает-

VO₂ является быстрорастворимым веществом, так как не удается значительно перегреть расплав выше температуры начала кристаллизации - не более IOO^OC и сохранить VO₂ в твердом состоянии.

Образцы приготавливались сплавлением навесок порошков V205 "ОСЧ" и Рьо "ЧДА".

Результать определения ликвидуса в системе V₂O₅-VO₂ вибрационным вискозиметром в области составов 4-8 мол. % 2·VO₂ приведены в табл. І. Положение ликвидуса оказалось значительно (концентрации VO₂ более чем в 3 раза меньше) смещенным в область более низких концентраций VO₂ по сравнению с его положением на приведенной в литературе диаграмме состояния [9]. Удовлетворительное согласие получено с экстраполированными данными из работи [I0].

Таблица I

Ликвидус	В	CUCTEMEV205-V02	при концентрациях	2. vo2,
		равных 4-8	мол. %	

Температура нагрева расплава, ^о С	Температура ликвидуса,	Концентрация 2. VO ₂ в распла- ве, мол.%
I026	724	4,8
I068	789	5,7
II25	844	6,9
II52	897	7,5

Результаты исследования плотности и вязкости расплавов

Полученные в работе экспериментальные данные по плотности были пересчитаны в молярные объемы (см. рис. I). При исследовании плотности применялись две методики подготовки расплавов: либо производился отжиг расплавов при низких температурах в течение суток без перемешивания, либо отжиг сочетался с перемешиванием. Обычно для восстановления равновесия достаточным являлось проведение отжига. Для расплавов, содержащих 20-22 и 44 мол.% Рьо, оказалось необходимым использовать также перемешивание. В этих образцах после плавления сохранялся в течение более 3 суток значительный градиент концентрации РbO в вертикальном направления, появление которого связано с кристаллизацией В-бронзы при затвердевании образца. При этом равновесное содержание кислорода устанавливалось менее чем за сутки. Например, по результатам измерений плотности одного из расплавов. содержащих 20 мол. % Рьо, было установлено, что в верхних слоях расплава концентрация Рьо составляла около I4, в нижних слоях - 28 мол. %. 0 кристаллизации *В*-бронзы свидетельствовали вспучивание образца в результате выделения кислорода и данные рентгенофазового анализа.

На изотермах молярного объема расплавов, подвергнутых перед началом измерений отжигу и перемешиванию, отсутствуют экстремумы, на политермах не обнаружены аномалии.

Если перед началом измерений производился только отжиг расплавов, то результать измерений плотности зависели от особенностей кристаллизации расплавов (см. рис. I). На изотермах молярного объема в области составов 20-22 мол. % Рьо выявлены минимум и рядом с ним максимум и при 44 мол. % - минимум молярного объема. Минимум и максимум при 20-22 мол. 7 Рьо проявляются только в области низких температур и исчезают на высокотемпературных ИЗОтермах. Минимум при 44 мол. % четко проявляется в относительно широком интервале температур. Экстремумы располагаются в УЗКИХ интервалах составов. Отклонение величин свойств в экстремальных точках не связано с разбросом экспериментальных точек, так как величина отклонений более чем в три раза превышает погрешность измерений плотности. В расплавах, отвечающих по составу минимумам молярного объема, изменялся характер отжига, произволимого . после охлаждения от высоких температур. В расплавах обычно имеется дефицит кислорода, при отжиге происходит его поглощение ИЗ воздуха, и плотность расплава уменьшается. При концентрациях Рьо, равных 20 и 44 мол. %, плотность при отжите изменялась ано-

мально - возрастала.

На политерме плотности, отвечающей по составу 22 мол.% РЪО, обнаружен скачок плотности при температурах 900-1000⁰C.

На изотермах расплавов вязкости V205-РЬО имеется МИнимум при концентрашии РЪО , равной около 40 мол. %. Наиболее чувствительна к струк турным изменениям вязкость расплавов. содержащих 0+20 мол.% РЪО (рис. 2). При изменении концентрации РЪО ОТ 20 ДО 40 МОЛ.% вязкость на изотермах уменьшается менее интенсивно. На изотерме вязкости, полученной при 1000°С, колебания вязкости являются более значительными при варьировании состава. чем на изотерме при 700°С. Обнаружено возрастание энергии активашии вязкого течения при концентрашиях Рьо , равных 24-26 мол.%. Колебания



Рис.2. Изотермы вязкости расплавов системы V₂O₅-РьО, содержащих до 8 мол.% 2·VO₂: а – данные из работы 2; б – данные автора. Указан исходный состав для системы V₂O₅-РьО

вязкости на изотермах несколько превышают ошибку измерений. Расплавы для измерений вязкости были однородными по составу и равновесными по содержанию кислорода.

Изучение кристаллизации расплавов

Первыми при кристаллизации расплавов V205, содержащих 0+ 40 мол. % Рьо, выделяются красноватые прозрачные кристаллы OKсидной ванадиевой бронзы d-типа, плоские, удлиненные по форме. Затем формируется эвтектика. Из расплавов, содержащих 40-44 мол. % Рьо, сразу выпадает эвтектика. При изучении продуктов кристаллизации расплавов, содержащих менее 40-44 мол. % Рьо , было обнаружено два пути кристаллизации, по которым может IIDOXOдить образец, вероятно, в зависимости от содержания VO2. Каждому пути кристаллизации отвечает присущая ему совокупность фаз в продуктах кристаллизации. В одной совокупности наблюдались под увеличением 7^X кристаллы бронзы « -типа, сростки плоских « игл черного цвета (А) и мелкие игольчатие кристалли желтого цвета (С). При измельчении кристаллов А в ступке цвет становится темно-желтым. При другом пути кристаллизации выпадают бронза 🗸 -типа, темно-красные кристаллы (Б), отличающиеся по внешнему виду от кристаллов А. и мелкие игольчатые кристаллы желтого цвета (С). Для рентгеновского и химического анализов были отобраны кристаллнА, БиС.

В продуктах кристаллизации расплава состава пированадата свинца видны под увеличением светлые прозрачные кристаллы и кристаллы розового и черного цвета. Смесь этих кристаллов дает рентгенограмму, совпадающую с приведенной в ASTM рентгенограммой пированадата. Рентгенограмма порошка пированадата свинца мало отличается от рентгенограммы порошка ортованадата свинца.

Представляло интерес определить фазовый состав кристаллов А, Б и С. Были получены рентгенограммы порошков этих веществ (табл.2).

При сопоставлении рентгенограмм и сравнении полученных межплоскостных расстояний с приведенными в литературе для бронз и β -типа, метаванадата свинца и пированадата свинца удалось показать, что продукт кристаллизации А является двухфазным, содержит кристаллы бронзы β -типа и кристаллы Б, что продукт кристаллизации С является смесью кристаллов бронзы d-типа и Б. В продуктах кристаллизации расплава, содержащего 50 мол.% Рьо, присутствуют d-бронза и Б. При затвердевания расплава, содержащего 52 мол.% Рьо, выпадают пированадат свинца и Б. Рентгенограмма

Таблица 2

Межплоскостные расстояния в продуктах кристаллизации A(Б+β-бронза), C(Б+α-бронза) и Б, получены в CuK_L излучении

	А			С			Б
d,Å	I/I。	фаза	d,Å	I/I。	фаза	d,Å	I/I。
7,69	17	Б	7,69	I8	Б	7,694	J.6
7,2I	54	ß	6,34	8	Б	6,308	17
6,33	I2	Б	5,73	8	X	5,308	29
5,30	27	Б	5,33	36	Б	4,547	68
4,74	64	ß	4,55	66	Б	3,515	9
4,54	56	Б	4,37	64	d	3,187	69
3,62	23	ß	4,09	20	d	3,178	100
3,52	I3	β+ Β	3,52	I3	Б	3,018	32
3,47	I7	* * *	3,40	I4	d	2,927	I8
3,37	40	ß	3,187	67	Б	2,897	49
3,19	75	<i>β</i> +Б	3,17	I00	Б	2,854	6
3,17	100	Б	3,02	53	Б	2,768	I2
3,05	85	ß	2,928	30	Б	2,664	3
3,0I5	55	Б	2,894	70	ж +Б	2,579	I6
2,927	30	в +Б	2,768	24	4 +P	2,441	6
2,897	87	β +Б	2,663	7	с+Р	2,388	7
2,768	21	_/3+B	2,607	6	Ъ	2,27I	I2
2,71	25	ß	2,578	I8	Б	2,251	6
2,6I4	II		2,44	5	Б	2,153	23
2,578	II	Б	2,374	I4	Б	2,115	21
2,515	7		2,27	20	Б	2,067	24
2,445	I4	<i>B</i> +Б	2,25	8	Б	2,040	3
2,4I	12	ß	2,185	II	d	2,003	I4
2,39	I4	<i>β</i> +Б	2,151	46	€ (+B)	I,930	30
2,27	2I	Б	2,II4	I4	a+b	I,867	20
2,25	IO	Б	2,067	I8	Б	I,832	I4
2,I64	61	В	2,04	3	Б	I,80I	7
2,151	48	_β +Б	2,00	22	X+B	I,7725	8
2,II	17	<i>В</i> +Б	I,929	28	d+B	I,7567	6
2,067	Iô	Б	I,9I7	IO	d	I,7004	17

	А			C		Б	
d,Å	I/I。	фаза	d,Å	I/I,	фаза	d,Å	I/I。
2,003	21	β +Б	I,899	5	ď	I,6639	3
I,973	33	ß	I,865	27	o⊾ +Б	I,6245	2
I,93	18	β +E	I,83I	2I	α+ ₽	I,6I46	4
I,9I4	8	ß	I,799	II	d+B	I,5866	22
I,864	27	B +B	I,772	9	d- + ₿	I,5479	9
						I,5I89	3
I,833	5I	, 6 + Б	I,756	II	Б	I,4873	3
I,803	44	β +B	I,70I	23	Б	I,4348	.3
I,770	6	β + Β	I,586	27	Б	I,4262	6
I,756	6	Б	I,549	I3	∝+ Б	I,3967	5
I,70I	I8	β + Β					
I,586	29	Б					
I,549	I3	Б					
I,53I	8	ß					
I,520	7	β +B					
I,487	21	β +B					

порошка Б в значительной степени совпадает с приведенной в литературе рентгенограммой метаванадата свинца. Прозрачные красноватые участки в продукте кристаллизации Б чередуются с темными участками. Это свидетельствует о том, что Б неоднороден по химическому составу. Однако рентгенограмма не претерпевает значительных изменений при варьировании условий получения Б и соотношения составляющих продукта кристаллизации.

Темные участки отсутствуют в кристаллах метаванадата свинца, выращенных методом Чохральского. Температура плавления этих кристаллов на I-2^OC превышает температуру плавления кристаллов Б и составляет 487^OC. Погрешность определения температуры ±5^OC. Температура и состав эвтектики ∝ -оронза - метаванадат свинца равны 483^OC и 45 мол.% РоО. Наиболее интенсивные отражения в рентгеновском спектре отвечают межплоскостным расстояниям 3,I7_X, 3,0I₇, 2,9₅. Между рентгенограммами порошков метаванадата свинца, полученного различными методами, имеются различия в количестве отражений и интенсивности их. Результаты рентгеноспектрального микроанализа подтверждают образование метаванадата свинца и указывают на идентичность химического состава образцов метаванадата свинца с различной окраской в пределах погрешности определения состава.

При нагреве стекол, содержащих 34-50 мол.% Рьо, наблюдалась кристаллизация метастабильной фази, пореходящей при более высоких температурах в метаванадат свинца. Например, в образце, содержащем 50 мол.% Рьо, метастабильная фаза выделялась при 340°С и затем при 412°С превращелась в метаванадат свинца. Наиболее интенсивные отражения в рентгеновском спектре порошка метастабильной фази - 3,34_х, 3,13_γ, 4,41₄.

По данным химического анализа, продукт кристаллизации A содержит I7,4 мол.% VO_2 , 23,5 мол.% PbO и 59,I мол.% V_2O_5 . Peзультаты химического анализа подтверждают данные рентгенофазового анализа, свидетельствующие о том, что продукт кристаллизации A состоит не только из кристаллов β -бронзы. Соотношение оксидов ванадия и свинца в A значительно отличается от соотношения оксидов в β -бронзе.

В пробах С с увеличением количества Б концентрация Рьо возрастала от 34 до 40 мол. %, концентрация VO₂ оказалась равной около 5-6 мол. %.

Обсуждение результатов экспериментов

Сопоставление результатов измерений плотности и вязкости расплавов с данными рентгенофазового анализа позволило слелать закличение об отсутствии связи экстремумов на изотермах свойств с образованием новых химических соединений в системе. Одной ИЗ причин появления экстремумов на изотермах молярного объема может являться ликвация расплава при кристаллизации химических соединений. Возликаниий при ликвании вертикальный градиент концентрации рьо не исчезает во время дифрузионного отжига расплава в течение менее 4-5 дней и служит причиной искажения результатов измерений. Поэтому обнаруженные в работе [4] значительные отрицательные отклонения молярных объемов от аддитивных значений молярных объемов не следует связывать с существованием метаванадата свинца. К этому же выводу можно прийти, если принять во внимание, что метаванадат свинца имеет самур низкую температуру

плавления среди химических соединений системы.

Ни в одном из экспериментов, связанных с изучением кристаллизации расплавов, в области концентраций около 50 мол. % Рьо не была получена эвтектическая смесь \measuredangle -бронзы с пированадатом свинца. Такая эвтектика должна образовываться согласно имеющейся в литературе диаграмме состояния V₂O₅-PbO. Все результаты исследования физико-химических свойств расплавов, полученные в данной работе, доказывают, что метаванадат свинца кристализуется при охлаждении расплавов как стабильное химическое соединение. Диаграмма состояния V₂O₅-PbO должна включать область составов, отвечающую образованию этого соединения и эвтектик с его участием.

Выводы

По данным исследований физико-химических свойств расплавов системы V₂O₅-VO₂-PbO показано, что метаванадат свинца кристаллизуется из расплавов как стабильное химическое соединение, не содержит включений темно-коричневого цвета, имеет температуру плавления 487⁰C.

Образование ярко выраженных экстремумов на изотермах свойств в области составов 0-60 мол. % PbO не связано с взаимодействием компонентов, а объясняется влиянием вертикального градиента концентрации PbO , возникшего в результате ликвации и сохранившегося при недостаточно длительном диффузионном отжиге расплава.

Ликвидус, отвечающий кристаллизации VO₂ в системе V₂O₅-VO₂, располагается при относительно йизких концентрациях VO₂ в области температур 700-900⁰С. Эти данные необходимо использовать при проведении измерений физико-химических свойств расплавов, чтобы устранить искажение результатов измерений.

Литература

I. Генрих В.Н., Каплун А.Б. Способ фазового анализа растворов и расплавов. А.С. 326489 (СССР).- Б.И., 1972, № 4, с.156-157.

2. Зязев В.Л., Есин О.А. Вязкость и плотность системы V₂0₅-PbO. - ЖНХ, I958, т.З, вып.6, с.I38I-I385. 3. Кузнецов П.Н., Букин Г.В., Сурикова А.П., Любушкина В.С. Термическая диссоциация V₂₀₅ в присутствии берилла, Al₂O₃, BeO и SiO₂ в области температур 700-IICO^OC. – В кн.: Вырашивание кристаллов бериллиевых минералов и исследование их свойств. Новосибирск: Изд-ние ИТыГ СО АН СССР, I980, с.59-62.

4. Лепинских Б.М., Есин О.А., Тетерин Г.А. Поверхностное натяжение и плотность расплавов, содержащих окислы свинца, ванадия и кремния. – ΣНХ, 1960, т.5, вып. 3, с.642-648.

5. Мундус-Табакаев А.Ф. Автоматизация измерений вязкости и плотности оксидных расплавов вибрационным методом и гидростатическим взвешиванием. - В кн.: Исследования по экспериментальной минералогии. Новосибирск: Изд-ние ИТи1 СО АН СССР, 1978, с.141-147.

6. Мундус-Табакаев А.Ф. Особенности методики исследования вязкости и плотности ванадийсодержащих оксидных расплавов. - Там же, с.148-153.

7. Пастухов Э.А., Есин О.А., Ватолин Н.А. Нестехиометричность и смещанная проводимость расплавов, содержащих V₂O₅. -Электрохимия, I970, т.6, вып.4, с.453-459.

8. Ткаченко А.А., Букин Г.В. Растворение и рост кристаллов берилла в расплавах на основе V₂O₅. – В кн.: Исследования по экспериментальной минералогии. Новосибирск: Изд-ние ИГиГ СО АН СССР, 1978, с.54-58.

9. Фотиев А.А., Волков В.Л., Капусткин В.К. Сксидные ванадиевые бронзы. - М.: Наука, 1978. - 176 с.

10. Suito H., Gackell D.R. The thermodynamics of Melts in the Sistem $VO_2 - V_2O_5$. - Metallurgical Transactions, 1971, v.2, N 12, p.3299-3303.

I23

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

УДК 543.422.5:546.19

В.И.Богданова

CIIEKTPOФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ МИКРООПРЕДЕЛЕНИЕ МЫШЬЯКА В ЕГО СУЛЬФИДАХ

Для анализа различных мышьяковых соединений нами испытывались и отрабатывались различные методики. При определении мышьяка из сравнительно больших навесок > 10 мг удовлетворительные результаты дайт объемные методы – броматометрический, метод Фольгарда, иодометрический [3]. Последний более прост в исполнении, но требует, чтобы анализ неизвестного и эталонного образцов проводался при одинаковой освещенности (при отсутствии прямых солнечных лучей). Недостатком указанных методов является малая специфичность. Поэтому для устранения влияния сопутствующих компонентов приходится проводить предварительное отделение мышьяка отгонкой, экстракцией или каким-нибудь другим приёмом. С уменьшением величины навески ошибка объемного определения увеличивается из-за малой чувствительности метода.

Высокочувствительным является метод атомно-абсорбщонного определения мышьяка. Мы использовали его для ориентировочной оценки мышьяка в растворе. Без сложной аппаратуры быстро и просто можно определить содержание мышьяка (0,5-3 мкг) в растворе и газовой фазе методом Гутцейта [3]. Но ни атомная абсорбция, ни

I24

метод Гундейта не могут быть использованы для точных определений малых содержаний мишьяка.

Наиболее подходящим способом, позволяющим проводить определение из микронавесок и с достаточной точностью, с нашей точки зрения, является спектрофотометрический метод по определению оптической плотности мышьяково-молибденовой сини. Этому методу было уделено основное внимание. Недостатком его является сравнительно малая специфичность. Поэтому в сложных объектах проводят предварительное отделение основы отгонкой, экстракцией и т.д. Ранее [1,2] нам удалось отработать методики спектрофотометрического определения мышьяка (из навесок > 5 мг) в присутствии coизмеримых количеств серебра, ртути, железа без отделения **JULE** элементов путем использования тех или иных приемов по ходу анализа.

Для перехода к определению мышьяка в сложных объектах из малых навесок (< 5 мг) необходимо было прежде всего отработать методику определения (с высокой точностью) мышьяка при минимальном количестве мешаниих компонентов, а именно в Ав_жS_y. Основное содержание работы касается именно этого случая. За основу была взята методика [I]^{*}. Оказалось, что при малых навесках воспроизводимость стала хуже. Специальными исследованиями было установлено, что ряд факторов, мало сказывающихся при больших навесках, стал весьма существенным в данном случае. К ним можно отнести : I) температуру и время нагревания при образовании мышьяково-молибденовой сини; 2) степень удаления нитратов; 3) степень разрушения перманцаната; 4) чистоту реактивов, в частности

Для уменьшения влияния этих факторов было предпринято следуищее:

I) сконструирована баня. Она состояла из собственно бани и специально изготовленной крышки. В крышке было сделано IO отверстий по размеру используемых колб. Вблизи каждого отверстия на металлической стойке укреплен деревянный держатель (в простейшем случае бельевые прищепки), который позволяет зажать реакционную колбу за её горлышко на фиксированной высоте. Для того, чтобы установить все колбы на одном уровне, используется специальный

^{*} Следует иметь в виду, что в методике [I] допущена опечатка: написано 0,015%-ный гидразин, следует читать 0,15%-ный.

поддон выбранной высоты. Крышка с прикрепленными реакционными колбочками переносится на кипящую баню (уровень воды в бане поддерживается постоянным). Через I5 мин. крышка со всеми колбочками снимается и ставится на баню с водой для охлаждения. Таким образом, все реакционные колбочки нагреваются строго определенное время и при строго одинаковой температуре, так как находятся на одинаковой высоте и не касакися ни дна, ни стенок бани, темперачура которых отличается от температуры воды. Зажимы позволяит опускать колбы в жидкость (как при нагревании, так и при OXлаждения) на любую высоту, не допуская их опрокидывания. Кроме того одновременное погружение всех коло в охлаждаемую и нагреваемую баню экономит время:

2) для лучшего удаления нитратов продолжительность нагрева после псявления паров SO₃ увеличили до I,5 мин. (операция повторяется трижди);

 для гарантированного разрушения всего пермантаната добавляли гидразин до обесцвечивания раствора и плюс ещё 2-3 капли избытка;

 использовали серную кислоту марки ОСЧ и парамолибдат аммония марки XЧ.

При переходе к меньшим навескам увеличивается ошибка взвешивания. В связи с этим взвешивание проводили на весах, обеспечиванщих шестой знак (весн Mettler) и отремились выполнять анализ мышьяка и серы из одной навески.

Ход анализа

На весах, сбеспечивающих шестой знак, берут навеску As_xS_y, равную I-5 мг. Помещают в стакан на 50 мл, добавляют 3 мл концентрированной HNO₃ и три капли брома. Оставляют стоять на холоде IO мин., затем нагревают до полного разложения и полного обесцвечивания раствора. Полученный раствор переносят^ж в колбу на 25 мл и доводят объем водой до метки. Для определения мышьяка берут аликвоту IO мл (остальное используют для определения серы), добавляют I мл концентрированной H₂SO₄ и нагревают до появле-

^{*} Если определяют только мыльяк, то деление раствора на части не проводят.

ния паровSO3 и еще 1,5 мин.; охлажлают, обызвают небольшим количеством воды и операцию отдымливания повторяют еще дважды. Раствор переносят в мерную колбу на 100 мл, добавляют воды до 50 мл, I каплю 0.05% -ного фенолфталенна и аммиака (I:I), до появления розовой окраски. Доводят водой до метки. В этом "промежуточном" растворе должно быть 200-900 мкг Ав (из расчета, чтобы в аликвоту для фотометрирования 5-25 мл попадало 30-45 мкгАз)^ж. Из полученного раствора в колбы (с длинным и узким горлышком) на 50 мл берут по 2 аликвоты (объемом не менее 5 мл) и добавляют воды до 25 мл. Затем добавляют I каплю Кмпоц (0,05м). Колбы тпательно обмывают небольшим количеством волы (чтобы не осталось на стенках остатков раствора КМвО,). Затем добавляют по каплям 0.15%-ный раствор гидразина до обесцвечивания раствора и еще дополнительно 2-3 капли; затем 6 мл (пипеткой) заранее (в этот же день) приготовленной смеси 2:4 гидразина (0,15%) и молибдата аммония (12,5 г парамолибдата аммония марки X.Ч на литр 6,5 м

H₂SO₄). Прикрепляют все колбочки с подготовленными растворами к крышке водяной бани и ставят на кипящую баню на I5 мин. Охлаждают, доводят водой до метки и фотометрируют на VSU-2P при Л = 840 нм в кывете с 1 = 50 мм. Одновременно в тех же условиях проводят анализ эталонного образца, по которому ведут расчет в анализируемой пробе.

В качестве примера определения мышьяка по отработанной методике приводится таблица, в которой представлены данные, полученные путем сравнения с эталонным образцом, проведенным через весь ход анализа (вариант I).

Ранее отмечалось [I], что при использования калибровочных кривых (вариант 2) получались большие ошибки, чем в случае расчета по эталонам, проведенным в тех же условиях, что я анализируемая проба. Однако в последнем случае труднее заметить систематические ошибки, которые, несмотря на применение эталона, могут вносить погрешности более высокие, чем ожидается. В связи с этим для контроля хода анализа использовали следующий прием: для каждой пробы рассчитывали коэффициенты молярного поглощения ξ

^{*} Если мышъяка больше, то необходимо либо увеличить объем "промежуточного" раствора, либо сделать дополнительное разведение раствора перед приготовлением "промежуточного" раствора.

Результаты определения мышьяка в различных As_xS_y из навесок 3-5 мг (доверительная вероятность, 0,95)

Номер	Число опре-	Найдено,	Отклонение		
оораз- ца	делении	aoc. //	adc.%	отн. %	
202	2	43,06	±0,36	0,84	
201	4	43,15	±0,25	0,58	
204	4	43,25	±0,25	0,58	
205	2	43,65	±0,36	0,82	
206	5	44,07	±0,23	0,52	
203	6	44,14	±0,20	0,45	

(равного оптической плотности, соответствующей концентрации мышьяка, равной I молю/л, измеренной в кювете длиной IO мм) мышьяково-молибденовой сини и сравнивали их между собой. Коэффициент молярного поглощения является универсальной величиной, зависящей лишь от количества образующейся мышьяково-молибденовой сини и длины волны (Л) [4], т.е. величиной, колебания которой в конечном счете обусловлены любыми отклонениями в ходе анализа. Целесообразность этого приема можно проиллострировать следующим примером, наблюдавшимся в нашей практике: методика определения мыльяка в виде сини давала в течение долгого времени отклонение отдельного определения от среднего ~ 2 отн. %. Тем не менее, при анализах, проведенных с 25 августа по I3 сентября, погрешность увеличилась до 3 отн. % (хотя и оставалась в пределах допустимых). Сравнивая коэффициенты Е для анализов, выполненных в разное время, установили, что обычно он находился в пределах 248--270·10², а в упомянутый стрезок времени - 160-193·10². Поскольку условия опытов не изменялись, то было предположено, что изменение & связано со случайных изменением Я при фотометрировании. А это должно было автоматически увеличить разброс данных (так как обычно используемая для измерения длина волны = 840 нм (соответствует максимуму на кривой зависимости оптической плотности от длины волны). Действительно, при установлении Я на спектрофотометре легко ошибиться и установить 880 вместо 840 нм. Это предположение было проверено на стандартах, и действительно, при $\lambda = 880$ ни коэффициент молярного поглощения упал до 173 $\cdot 10^2$ вместо 261·10². Причем ошибка измерения оптической плотности при 880 нм оказалась заметно выше, чем при 840 нм.

Была проведена сравнительная оценка точности лвух вариантов: I-го варианта, когда расчет солетжания мышьяка проволили по эталону, проведенному через весь ход анализа, и 2-го варианта. когда мыльяк рассчитывали по калибровочной кривой, снятой однажды. Для этого были рассчитаны средние: для варианта I путем деления всех найденных процентов на число навесок, а для варианта 2 - путем пеления всех найленных коэффициентов MOJINDHOLO поглощения на то же число навесок. Затем огределяли отклонения от среднего и по ним строили гистограммы (рис.). Причем на гистограмме (а) приведены результаты, полученные одним и тем же химиком. а на гистограмме (б) несколькими. Из рисунка вид-



Распределение частот при верианте I (гистограммы I^a и I^o) и при варианте 2 (гистограммы 2^a и 2^o) при определении мышьяка в виде сини одним химиком (а) и несколькими (о). Сплощные кривые А и Б (соответственно с 5 - 0,7 и I,2% отн.) - теоретические

но, что в случае варианта 2 отклонения заметно выше по сравнению с вариантом I; на гистограмме 2а в области высоких значений оптических плотностей имеется сравнительно узкая область, отделенная от остальной части провалом^ж. Можно предположить, что подоб-

^{*} Следует отметить, что использование коэффициента молярного поглощения позволяет построить подобную гистограмму для образцов с различным содержанием мышьяка. На такой гистограмме упомянутый провал выражен более резко.

ный ход гистограмми связан с систематической ошибкой, обусловленной некоторым фактором, приводящим к занижению результатов. Таким фактором могут быть нитрат-ионы, незначительное количество которых не влияет на результаты анализа, что приводит к своему собственному узкому распределению и наличию провала. Дальнейшее увеличение количеств нитрат-ионов ведет к заметному занижению оптической плотности.

При увеличении случайной ошибки указанная выше систематическая ошибка уже не выявляется (гистограмма, 26).

Определение мышьяка по варианту I, т.е. по эталону, прошедшему через такой же ход анализа, что и анализируемая проба, должно устранить в существенной мере систематическую ошибку. Это должно привести к снижению погрешности определения мышьяка и к лучшему подчинению результатов нормальному распределению (см. рисунок). Последнее позволяет применить статистическую обработку результатов, полученных по предлагаемой методике и дать с достаточной степенью точности результаты для определения незначительных различий по содержанию мышьяка в серии однотипных образцов (см. таблицу).

Выводы

Для характеристики хода анализа предлагается использование коэфиниента молярного поглощения.

Установлены параметры, влаяние которых резко увеличивается при переходе к определению мышьяка в виде мышьяково-молибденовой гетерополикислоты из малых навесок. Даны способы устранения этого влияния.

Показано, что при определении мышьяка по эталону, проведенному одновременно с анализируемой пробой, получаются более точные, лучше подчиняющиеся нормальному закону распределения результаты, чем при расчете содержаний мышьяка по калибровочной кривой, снятой однажды.

Литература

I. Богданова В.И., Грешнева Л.Л., Сердобинцева Т.И. Спектрофотометрическое определение мыльяка в виде мыльяково-молибде-

I30

новой сини в присутствии серебра. - В кн.: Исследования по экспериментальной минералогии. Новосибирск: Изд-ние ИГиГ СО АН СССР, 1978, с.IIO-II6.

2. Богданова В.И., Предеина Л.Л., Галай Т.И. К вопросу анализа соединений, содержащих серу. - Там же, с.28-36.

3. Гилленбранд В.Ф. и др. Практическое руководство по неорганическому анализу.-М.: Госхимиздат, 1967. - 1016 с.

4. Пешкова В.И., Громова М.И. Практическое руководство по спектрометрии и калориметрии. - М.: Изд-во МГУ, 1961. - 228 с.

УДК 548.3

А.М.Дорошев, Г.Н.Кузнецов

УТОЧНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ЯЧЕЙКИ КРИСТАЛЛОВ МЕТОДОМ НАИМЕНЬНИХ КВАДРАТОВ

В минералогических и петрологических исследованиях все шире применяются расчеты параметров элементарной ячейки кристаллов. Помимо диагностических целей это дает основную информацию о характере и величине изоморйных замещений в кристаллических веществах, степени упорядоченности и пр.

При определении размеров элементарной ячейки по рентгенограммам от поликристаллических образцов используется два подхода.

В первом случае измернется количество реўлексов, равное числу определяемых параметров. Оценка погрешностей выполняется на основе погрешностей определения углов, которые в свою очередь оцениваются по их воспроизводимости. Точность определения параметров при этом невысока, однако метод отличается экспрессностью и с успехом применяется при диагностике фаз.

Другой подход заключается в измерении как можно большего числа рефлексов и последующем вычислении параметров методом наименьших квадратов. Помимо очевидного повышения точности такой подход позволяет получить объективные оценки погрешностей.

Процедура расчета параметров путем минимизации среднеквад-

ратичных отклонений величин 1/d² или sin² подробно описана в ряде работ [2-4]. В последнее время появился ряд отечественных публикаций о реализации мацинных программ по вычислению параметров этим методом. Однако из-за того, что минимизируются, как правило, суммы квадратов отклонений не измеряемых величин – 20 при дифрактометрической съемке или L при съемке дебаеграмм, а их функции, получаемые значения не являются наилучшей в статистическом смысле оценкой параметров. Поэтому представляется полезным рассмотреть алгоритм вычисления параметров путем минимизации квадратов отклонений непосредственно измеряемых величин (20 или L).

Расчет параметров

Минимизируемая сумма квадратов в данном случае выразится в виде $\sum_{\tau}^{n} (2\Theta_{i_{3}\pi c} - 2\Theta_{i_{6}\ell r})^{2} = min$ при дифрактометрической съемке и $\sum_{\tau}^{n} (L_{i_{3}\pi c} - L_{i_{6}\ell r})^{2} = min$ при съемке дебаеграмм.

Таблица I

Коэффициент	N _{ik} B	уравнениях	(I)	И	(2)	
-------------	-------------------	------------	-----	---	-----	--

N _{ik} Сингония	N _{i1}	N _{i2}	N _{i3}	N ₁₄	N ₁₅	N _{i6}
Триклинная	h ² i	k2	1 ²	2hiki	2hili	2kili
Моноклинная	h ²	k²i	l ²	2hili		
Ромбическая	h ²	▶ k ² 1	l ²			
Гексагональная и тригональная	h ₁ ² +h _i k _i +	k ² 1 ²				
Тетрагональная	h ² +k ²	1 ²				
Кубическая	$h_{i}^{2}+k_{i}^{2}+$	1 ² i				

В общем случае связь между величинами 20 или L и парамет-

рами решетки для і-того рефлекса выражается в форме

$$2\Theta_{i} = \frac{360}{\pi} \alpha rcsin\frac{2}{2} \sqrt{\sum_{j=1}^{n} A_{k} N_{ik}}$$
(I),

$$L_i = 2R \operatorname{arcsin} \frac{\lambda}{2} / \sum_{i} \mathcal{A}_k N_{ik}$$
 (2),

где R – радиус камеры при съемке дебаеграмм, величины N_{ik} и Ак определены в таблицах I и 2.

Поскольку уравнения (I) и (2) нелинейны по отношению к параметрам решетки, для расчета величин Ак методом наименьших квадратов необходима процедура линеаризации. Из возможных способов линеаризации следует две схемы расчета параметров методом наименьших квадратов. Линеаризация может осуществляться разложением в ряд Тейлора правых частей уравнений (I) и (2) либо в точке А (а,..., χ) – (схема I), либо в точке А[#] (А,..., F) – (схема II), где а,..., χ – приближенные значения прямых и А,..., F – приближенные значения обратных параметров решетки. Соответственно, при применении процедуры обработки данных методом наименьших квадратов вычисляются поправки $\Delta a,..., \Delta \chi$ или $\Delta A,..., \Delta F$ Обозначая через φ правую часть уравнений (I) и (2) и ис-

Обозначая через Ф правую часть уравнений (I) и (2) и исключая при разложении члены с производными высших порядков, получим для і-того измерения (для триклинной сингонии)

$$\varphi_{i \ 3\kappa c} = \varphi_{i} \left|_{(\mathcal{A};\mathcal{A}^{*})} + \frac{\partial \varphi}{\partial t_{i}} \right|_{(\mathcal{A};\mathcal{A}^{*})} \Delta t_{i} + \dots + \frac{\partial \varphi}{\partial t_{6}} \left|_{(\mathcal{A};\mathcal{A}^{*})} \Delta t_{6} \right|_{(\mathcal{A};\mathcal{A}^{*})} \Delta t_{6}$$
(3)

где $t_1, \ldots, 6$ -а, ... у – прямые (схема I) или А, В, ... F – обратные (схема II) параметры решетки; значения производных и $\mathcal{P}_{\iota} |_{(\mathscr{A},\mathscr{A}^{*})}$ рассчитываются в точке А (схема I) или в точке А^{*} (схема II).

Перенося $\Phi_{i}|_{(A;A^{*})}$ в левую часть и обозначая $\Delta \Phi_{i} = \Phi_{i \ 3\kappa c} - \Phi_{i}|_{(A;A^{*})}$ получим систему линейных относительно Δt уравнений $\Delta \Phi_{i} = \frac{\partial \Phi_{i}}{\partial t_{i}}|_{(A;A^{*})} \Delta t_{i} + \dots + \frac{\partial \Phi_{i}}{\partial t_{6}}|_{(A;A^{*})} \Delta t_{6}$ (4)

Ак Сингония	A	В	C	D	E	F
Трпклинная ^ж	$\frac{\sin^2 \alpha}{N a^2}$	sin ² ß N b ²	$\frac{\sin^2 \chi}{N c^2}$	cosscosy-cosa N bc	<u>cos≪cosγ-cosβ</u> N ac	<u>cosacoss-cos</u> N ab
Моноклинная	$\frac{1}{a^2 \sin^2_{\beta}}$	- <u>1</u> b ²	$\frac{1}{c^2 \sin^2 \beta}$		ac sin ² b	
Ромбическая	a^2	- <u>1</u> b ²	1 2			
Гексагональная и тригональная	$\frac{4}{3 a^2}$					
Тетрагональная			- <u>1</u> c ²			
Кубическая	 a ²					
* B таблицах 2 N = 1 + 2 cc X = BC - D^2 ;	-6 принят засозвсоз Y = AC -	ы следуюц зү-соз ² а- - Е ² ; Z =	ше обозначен cos ² 3 -cos ² 7 AB - F ² ; Н =	ия [5]. ; W = ABC + 2DEF - = EF - AD; K = DF -	$AD^2 - BE^2 - CF^2;$ - BE; L = DE - CF	•

Коэффициент Ак в уравнениях (I) и (2)

(4a)

Параметр Сингония	a ² o	ъ2	c ₀ ²	cos2x	င၀န္န	cosz	v ²
Триклинная	<u>X</u> W	I W	<u>2</u> W	H ² YZ	<u>k</u> 2 xz	L ²	<u>1</u> W
Моноклинная	$\frac{C}{AC-E^2}$	<u>1</u> B	$\frac{A}{AC-E^2}$		E ² AC		$\frac{1}{B(AC-E^2)}$
Ромбическая	<u>1</u> A	<u>1</u> B	<u>1</u> c				1 ABC
Гексагональная и тригональная	<u>4</u> 3A		<u>1</u> c				4 34 ² C
Тетрагональная	<u>1</u> A		<u>1</u> c				$\frac{1}{A^2C}$
Кубическая	<u>1</u> A						$\frac{1}{\mathbb{A}^3}$

Вычисление параметров решетки через Ак

элементами матрицы U в схеме I будут частные производные

$$U_{ik} = \frac{\partial q_i}{\partial \alpha_k} \bigg|_{\mathcal{A}}$$

Значения U_{ik} для кристаллов всех сингоний приведены в таблице 4. Гораздо проще выражения для U_{ik} при расчете параметров по схеме II:

Табляца 4

Элементы матриц U и U * при расчете параметров по схеме I

$$\begin{split} & \text{IDPN RNVPRATOMETPHYCICKOЙ CSEMKE} \\ u_{\underline{i}\underline{k}} &= \frac{\partial \mathcal{P}_{\underline{i}}}{\partial a_{\underline{k}}} = \frac{180\lambda^2}{\overline{\pi}} \quad \frac{\underline{v_{\underline{i}}}\underline{z_{\underline{i}}}}{\sin 2\theta \underline{i}}; \quad u_{\underline{i}\underline{k}}^{\underline{N}} &= \frac{\underline{v_{\underline{i}}}\underline{z_{\underline{i}}}}{\sin 2\theta \underline{i}}; \\ u_{\underline{i}\underline{k}} &= \frac{\partial \mathcal{P}_{\underline{i}}}{\partial a_{\underline{k}}} = R\lambda^2 \quad \frac{\underline{v_{\underline{i}}}\underline{z_{\underline{i}}}}{\sin 2\theta \underline{i}}; \quad u_{\underline{i}\underline{k}}^{\underline{M}} &= \frac{\underline{v_{\underline{i}}}\underline{z_{\underline{i}}}}{\sin 2\theta \underline{i}}; \end{split}$$

		Tps	аклинная синг	RIHO	
3Фi/∂ak	٧ _i		zi		
æ <u>1</u> ,/∂a 2Ф <u>1</u> /∂b	$-\frac{h_1}{a}$ $-\frac{k_1}{b}$	h _i A + l _i E k _i B + l _i D	+ ic ₁ F + h ₁ F		
βΦ _i /∂c	$-\frac{l_1}{c}$	liC + kiD	+ hiE		
Pilla	sind N	$\frac{h_1^2 \cos d}{a_2} + \frac{k_1 l_1}{b c}$	$-\frac{h_{i}l_{i}cos\gamma}{ac}$	- hikicosβ a b	+ 4NbcDsin ² 01
$P_1/\partial \beta$	sin.B N	$\frac{k_1^2 \cos \beta}{b^2} - \frac{k_1 l_1 c}{b c}$	$\frac{b_{i}l_{i}}{a_{c}}$	- hikicosx a b	4NacEsin ² Oi
$(\Phi_i/\partial\gamma)$	sin Y N	$\frac{l_i^2 \cos \gamma}{c^2} - \frac{k_i l_i c_i}{b c}$	$\frac{\text{os}\beta}{\text{ac}} = \frac{h_{i}l_{i}co}{\text{ac}}$	$\frac{h_{i}k_{i}}{a b}$	$+\frac{4 \text{NabFsin}^2 \theta i}{2}$
	Моноклин	ная сингония		Ром	бическая сингония
da1/dak	Vi	Zi		2ª1/da	v _i z _i

öΦi/da	$-\frac{h_i}{a}$ $h_i A + l_i E$	$\partial \mathcal{P}_1/\partial a = \frac{h_1^2}{a^3}$
24,100	$-\frac{k_{\underline{i}}^2}{b}$ B	$\partial^{c} p_{\underline{i}} / \partial b = \frac{k_{\underline{i}}^2}{b^2}$
∂¢1/00	$-\frac{1}{c} 1_{\underline{i}}C + h_{\underline{i}}E$	$\partial \varphi_1 / \partial c - \frac{1_1^2}{c^3}$
2001 Bg	$-\frac{1}{\sin\beta} \cosh(h_{1}^{2} + l_{1}^{2} + h_{1}l_{1}E)$	+ $\frac{\mathbf{h}_{1}1_{1}\mathbf{E}}{\cos\beta}$
Гек	сагональная сингония	Тетрагональная сингония
2001/dak	v _i Z _i	de vi Zi
291/da	$\frac{-4(h_1^2 + k_1^2 + h_1 k_1)}{3a^3}$	$\partial \varphi_{1}/\partial a = \frac{-(h_{1}^{2} + k_{1}^{2})}{a^{3}}$
291/20	$-\frac{1_{1}^{2}}{2^{3}}$	$\partial^{(p_i)/\partial c} = \frac{-l_1^2}{c^3}$

	100.000.000	and the second se		
Кубическая	сингония:	V _i Z _i	$=\frac{h_{1}^{2}}{1}$	$\frac{k_{1}^{2} + 1_{1}^{2}}{a^{3}}$

$$u_{ik} = \frac{\partial \varphi}{\partial A_k} \bigg|_{\mathcal{A}^*}$$

Соответственно, при дифрактометрической съемке

$$u_{ik} = \frac{90\lambda^2}{\pi} \frac{N_{ik}}{\sin 20} i$$

и при съемке дебаеграмм

$$u_{ik} = \frac{R \lambda^2}{2} \frac{Nik}{\sin 20i}$$

При числе измерений больше числа определяемых параметров система уравнений (4, 4а) будет переопределенной, что позволяет применить к ней процедуру метода наименьших квадратов. Система "нормальных" уравнений получается обычным для этого метода способом:

$$(\mathcal{U}^{T}\mathcal{U})T = \mathcal{U}^{T}\mathcal{P}.$$
 (5)

Решение системы уравнений (5) запишется в виде:

$$\Gamma = (\mathcal{U}'\mathcal{U})^{-1}\mathcal{U}'\mathcal{P} \tag{6}$$

Естественно, получение решения системы уравнений (5) с наперед заданной точностью требует процесса итерация.

Если удается оценить индивидуальные веса измерений, например, из их воспроизводимости, можно ввести матрицу весов G — — Решением тогда будет т

$$T = (U^{T} G_{qp} U)^{T} U^{T} G_{qp} qp, \qquad (6a)$$

Вычисление существенно упрощается, если из матриц и вывести общий множитель $K = \frac{180\lambda^2}{\pi}$ или $K = R\lambda^2$ при расчете параметров по схеме I и множитель $K = \frac{90\lambda^2}{\pi}$ или $K = \frac{R\lambda^2}{2}$ при расчете параметров по схеме II. Тогда решение системы (5) запишется следующим образом:

$$T = \frac{1}{K} \left(\mathcal{U}^{*T} \mathcal{G}_{\varphi} \mathcal{U}^{*} \right)^{2} \mathcal{U}^{*T} \mathcal{G}_{\varphi} \mathcal{P}, \qquad (7)$$

Элементы матрицы \mathcal{U}^* для схемы I приведены в таблице 4. Для схемы II элементы матрицы \mathcal{U}^* просты:

$$u_{ik} = \frac{N_{ik}}{\sin 2\theta_i}$$
.
Оценка погредностей

Ковариационная матрица прямых параметров при вычислениях по схеме I имеет следующий вид: $C = G^{2}_{(20;L)} (\mathcal{U}^{T} G_{\phi} \mathcal{U})^{-1}$ (8) или, при вынесении из матриц \mathcal{U} и \mathcal{U}^{T} общего множителя К,

$$C = G_{(20;L)}^{2} \frac{1}{K^{2}} \left(\mathcal{U}^{*T} \mathcal{G}_{\varphi} \mathcal{U}^{*} \right)^{-1}$$
(8a)

где
$$\mathcal{G}_{(20;L)}^{2}$$
 для (**n** + **I**)-ой итерации равно
 $\mathcal{G}_{(20;L)}^{2} = \frac{\mathcal{P}_{(n+1)}^{T} - \mathcal{P}_{(n+1)}}{\mathcal{N} - 2} = \frac{\mathcal{P}_{n}^{T} \mathcal{P}_{n}^{-K} \mathcal{K} \mathcal{T}_{(n+1)}^{T} \mathcal{U}^{*T} \mathcal{P}_{n}}{\mathcal{N} - 2}$

где N – число используемых для расчета рефлексов, г – число определяемых параметров. 2

Длагональные элементы матрицы С суть дисперсии с_{kk}=б (a_k) Параметры решетки, вычисляемые по схеме II, заданы в неявном виде и для кристаллов триклинной и моноклинной сингоний взаимозависимы. Поэтому для получения ковариационной матрицы прямых параметров решетки в этом случае требуется операция линейного преобразования переменных [I]. Ковариационная матрица прямых параметров в схеме II запишется следующим образом:

$$S = G_{(2\theta;L)}^{2} P(\mathcal{U}^{T} \mathcal{G}_{qp} \mathcal{U})^{-1} P^{T}$$
(9)

ИЛИ

$$S = 6_{(20; b)}^{2} \frac{1}{K^{2}} P(U^{*T}G_{\varphi} U^{*})^{-1} P^{T}, \qquad (9a)$$

где – якобиан линейного преобразования

D	<u>2</u> 29	<u>да</u> дВ		$\frac{\partial \alpha}{\partial F}$		
Ρ=	<u>∂γ</u>	• •	•	dy de		

Значения частных производных, входящих в якобиан Р, для кристаллов триклинной и моноклинной сингоний приведены в таблице 5. Диагональные элементы матрицы \$ есть дисперсии s_{kk}=d(a_k) Дисперсия объема определяется следующим образом:

 $\sigma^{2}(V) = \sigma^{2}_{(20;L)} R(U^{T} G \varphi U)^{-1} R^{T}$ (10)

или

$$5^{2}(V) = 5^{2}_{(20,L)} \frac{1}{K^{2}} R(U^{*T} G_{ap} U^{*})^{-1} R^{T}, \qquad (I0a)$$

где R – вектор-строка частных производных $\frac{\partial V}{\partial a_k}$ в схеме I и $\frac{\partial V}{\partial A_k}$ в схеме II. Значения $\frac{\partial V}{\partial a_k}$ и $\frac{\partial V}{\partial A_k}$ приведены в таблице 6.

По предложенному алгоритму нами реализована программа уточнения параметров ячейки для кристаллов всех сингоний. Программа написана на явыке "Аналитик" для ЭВМ "МИР-2". По программе вычисляются уточненные параметры и объем элементарной ячейки, а также их среднеквадратичные отклонения. Алгоритм характеризуется

Частные производные $\partial a_i / \partial A_k$ Триклинальная сингония

dai/dAk	c l	A	В	C	D	E	F	
da da	$-\frac{a^3}{2}x$	1	$\frac{L^2}{\chi^2}$	x2 x2	2KL X ²	<u>2к</u> х	<u>2</u> L	
<u>др</u> д р	$-\frac{b^3}{2}x$	$\frac{L^2}{Y^2}$	1	$\frac{H^2}{Y^2}$	<u>2н</u> Ү	2 <u>HL</u> Y ²	2 <u>L</u> Y	
∂ c ∂ A k	$-\frac{c^3}{2}x$	$\frac{\kappa^2}{z^2}$	$\frac{\mathrm{H}^2}{\mathrm{z}^2}$	1	<u>2H</u> Z	<u>2K</u> Z	2RK Z ²	
∂∝ ∂∝	A sin≪√YZ x	<u>AKL+EFW</u> 2AYZ	<u>H</u> 2Z	<u>H</u> 2Y	1	L Y	<u>к</u> 2	
OB OAk	<u>B</u> sinβ√XZ x	<u>K</u> 2Z	BHL+DFW 2BXZ	<u>K</u> 2X	L X	1	X H	
<u>94</u> <u>94</u>	siny/XY x	<u>L</u> 27	L 2X	CHK+DEW 2CXY	<u>K</u> X	<u>н</u> Ү	1	
Моноклинная сингония								

dai/dak	Я	A	В	С	E	
<u>da</u> da _k	$-\frac{a^3}{2}x$	1	0	E ^{C2}	C C	
<u>36</u> 94 ¹	$-\frac{b^3}{2}x$	0	1	0	0	
<u>∂c</u> ∂₄ _k	$-\frac{c^3}{2}x$	<u>E</u> ² A ²	0	1	<u>2e</u>	
<u> 33</u> DAk	$-\frac{1}{AC-E^2}$	x - <u>E</u> 2A	0	2C	1	

хорошей сходимостью. При достаточно произвольном выборе начальных условий требуется не более трех-пяти итераций для получения значений параметров с любой наперед заданной точностью вычислений.

Таблица 6

/ 30	ACTHE	e npo	извод	da ₁		VCIM(5 1)	
Сингония ^{Эу}		<u>76</u>	<u>9 A</u> C	av ac	<u>7</u> 0 2		<u>∂V</u> ∂B	$\frac{\partial \mathbf{V}}{\partial \gamma}$
Триклинная	Лх	<u>1</u> a	1 b	<u>1</u> c	bcDsi	inœ	acEsinß	abFsiny
Моноклинная	A x	<u>1</u> a	1 Ъ	<u>1</u> c			1 tgB	
Ромбическая	A X	<u>1</u> a	<u>។</u> ៤	1 c				
Гексагональная и тригональная	x V	<u>2</u> a		<u>1</u> c				
Тетрагональная	γX	<u>2</u> a		<u>1</u> c				
Кубическая	x V	<u>3</u>						
Час	тные	произ	водны	e <u>30</u>	(cxe	ема	II)	
от о			V6 A6	<u>2 v</u> 7 b	<u>9 A</u> 9 C	<u>∂⊽</u>	9 A 9 E	∂V ∂F
Триклинная	- 12	3 - x	X.	Y	Z	2H	2K	2L
Моноклинная	$-\frac{v^2}{2}$	- x	BC	AC-E2	AB		-2BE	
Ромбическая	- 12	- x	BC	AC	AB			
Гексагональная и триклинная	- 3	v ³ x	2AC		.₄²			
Тетрагональная	- 12	- x	2AC		_₄ ²			
Кубическая	- 2	v ³ x	2					

Элементы матрицы R (частные производные <u>ЭV</u> в схеме I)

Литература

I. Брант З. Статистические методы анализа наблюдений. - М.: Мир, 1975. - 375 с.

2. Burnham C.W. Lattice constant refinement. - Carnegie

In.t. Wash. Year. Book, 1962, v.61, p.132-134.

3. Farinato R., Loreto L. A least-squares refinement of the crystal lattice constants and evaluation of their errors, using the direct unit cell. - Rend. Soc. Ital. miner. e petrol., 1975, v.31, N 2, p.487-500.

4. Langford J.I. The accuracy of cell dimensions determined by Cohen's method of least squares and the systematic indexing of powder data. - Journ. Appl. Cryst., 1973, v.6, N 1, pp.190-196

5. Visser J.W. Some calculation for powder patterns. -Journ. Appl. Cryst., 1969, v.2, N 1, p.142-143.

УДК 539.893+536.45

Г.Н.Кузнецов

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА В ОБЛАСТЬ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ

Для изучения процессов, происходящих в недрах Земли, необходимы знания о поведении вещества в условиях высоких давлений и температур. В первую очередь интересны данные о плотности и сжимаемости твердых тел, из которых можно вычислить скорости звука в твердом теле и сопоставить эти скорости со скоростями сейсмических волн на различных глубинах в коре, мантии и ядре Земли, и таким образом получить сведения о состоянии и составе вешества Земли в этих условиях. Зависимость плотности (или объема) от давления и температуры называется обычно уравнением состояния. Диференцируя уравнение состояния по объему, можно вычислить сжимаемость, а интегрированием - свободную энергию, из которой можно вычислить все термодинамические величины для данного вецества. Отсюда видна важность исследования уравнения состояния для физики высоких давлений и всех связанных с этой областью знаний наук. Эксперименты по изучению уравнения состояния, в которых измерены непосредственно объем и давление. известны RIT ограниченного количества веществ и для давлений, не превылающих

обычно 30-40 кбар (3-4 IIIa). Развитке экспериментальной техники позволило проводить рентгеноструктурные исследования и вычислить по их результатам объем элементарной ячейки до давлений в несколько сот кбар, но давление при этом приходится оценивать по экстраполяции какого-либо свойства некоторого эталонного тела – сопротивление манганита, положение линий флиоресценции рубина. Эксперименты по ударному сжатию позволяют вычислить одновременно и объем, и давление. Из таких экспериментальных данных можно получить зависимость объема от давления на нулевой изотерме (при $T = 0^{O}$ K). Однако техника ударных экспериментов доступна далеко не всем, и многие вещества, интересные с точки зрения наук о Земле, не исследованы.

Теоретические исследования в области физики высоких давлений позволяют получить уравнение состояния вещества только в области предельно сверхвысоких давлений порядка IOOO Мбар. Для относительно невысоких давлений существуют несколько полуэмпирических уравнений состояния. Постоянные, входящие в эти уравнения, обычно подбирают методом наименьших квадратов по экспериментальным данным во всем доступном диапазоне. Однако число этих постоянных невелико, и их можно было бы получить из данных при ну-, левом давлении. Если подбирать их таким способом и сравнивать расчеты с опытом, то из уравнений с наименьшим количеством эмпирических констант следует признать наилучшим уравнение Мурнагана-Бэрча (М.Б.) $\rho = \frac{3}{2} K_o \left[\left(\frac{\rho}{\rho_o}\right)^{\frac{3}{2}} - \left(\frac{\rho}{\rho_o}\right)^{\frac{5}{2}} \right].$

Для наук о Земле наиболее интересна промежуточная область давлений 0, I-IO Мбар. Поэтому если для какой-либо кристаллической фазы известно уравнение состояния при небольших давлениях, а при сверхвысоких можно построить теоретическое уравнение, то было бы заманчивым построить интерполяционное уравнение для этой промежуточной области. Будем считать, что любое описание поведения вещества должно удовлетворять смедующам требованиям:

I) соответствовать возможным теоретическим моделям в области их применимости;

2) совпадать с имехщимися экспериментальными денными.

Будем рассматривать уравнение для нулевой изотермы. По-кольку теоретическое уравнение строится для сжатий порядка десятикратных, т.е. достаточно далеко от интересующей нас области, а нас интересуют самые разнообразные, в том числе достаточно сложные вещества, делесообразно выбрать простую для вычисления MOдель. Наиболее подходящей является квантово-статистическая MOдель атома (КСМ) в виде, представленном в работах Калиткина и др. [1,2]. Уравнение состояния КСМ может быть аппроксимировано уравнением:

 $\begin{array}{l} P = 0.30412 \cdot 10^8 \cdot \mathbb{Z} \, \frac{10/3}{2} \, \exp\left[-27.3233\left(\sum_{i=1}^{l_2} \sigma_i \chi^{i-1} + 1\right)\right] - \\ & - 0.5530 \cdot 10^6 \, \mathbb{Z}^{\frac{8}{3}} \cdot \exp\left[-21.472\left(\sum_{i=1}^{l_2} \beta_i \chi^{i-1} + 1\right)\right] \\ \text{где } \mathbf{x} = 0.0841535 \, \ln(\mathbf{z} \cdot \mathbf{V}) - 0.2449865; \quad \mathbf{V} - \text{объем (см}^3/\text{мол.)} \end{array}$ - атомный номер. Z

Для сложных веществ в этом приближении объем соединения является суммой объемов компонентов (при таких сжатиях эффекты, обусловленные химической связью, пренебрежимо малн).

Ниже излагается методика построения интерполяционного уравнения. Строится уравнение Мурнагана-Бэрча. Постоянные, вхоляшие в это уравнение, вычисляются из денных опытов по измерению скорости ультразвука в монокристаллах, а также из опытов, где непосредственно измерялись объем и давление. Поскольку нас интересует нулевая изотерма, то необходим пересчет к T = 0°K. Эгот пересчет можно осуществить, используя модель твердого тела Дебая [3]. Затем вычисляем по уравнению М.Б. объем (V₆) на нулевой изотерме как функцию давления. При больших давлениях объем (Vm) как функцив давления вычисляем по КСМ. Объем по интерполяционному уравнению состояния будет представляться тогда со стороны малых давлений как разложение в ряд по степеням V₀-V_Б, где V₀ объем при нулевом давлении, а со стороны больших давлений - как разложение в ряд по степеням V_п . В крайних точках должно быть полное совпадение с соответствующими уравнениями (вплоть до второй производной по давлению), а в точке стыковки должны быть непрерывными и гладкими функции, отвечающие объему, модулю упругости и коэффициенту Грюнайзена, что приводит к требованию paвенства в этой точке объема и первых трех производных его по давлению с обеих сторон.
Экспериментальные данные часто не позволяют вычислить вторую производную от объема по давлению при P = 0 достаточно точно. В этом случае рекомендуется использовать уравнение Слэтера:

 $\int = -\frac{V}{2} \frac{\partial^2 P}{\partial V} - \frac{\kappa}{3}$

и термодинамическое значение постоянной Гринайзена:

ў = <u>⟨√⟩</u> где *⊲* - коэффициент термического объемного расширения, β изотермический коэффициент объемной сжимаемости, с_v - удельная теплоемкость при постоянном объеме.

В некоторых работах [4,5] вместо указанного уравнения предлагается другое, так называемое уравнение Дугдала-Мак-Дональда, однако вывод его как в работе 4, так и в работе 5 не свободен от ошибок. Последовательное проведение расчетов по схеме. предложенной в работе [4], приводит также к формуле Слэтера. Единственным существенным предположением при выводе этого уравнения является предположение об одинаковой зависимости всех МОД колебаний кристаллической решетки от объема. Это то же самое предположение, которое мы принимаем, когда используем уравнение Ми-Грюнайзена $P=P_{0}(V)+V \stackrel{\text{\tiny L}}{=}$ с одной постоянной Грюнайзена. Здесь Р. (V) - давление на нулевой изотерме, обусловленное изменением потенциальной энергии и нулевымы колебаниями решетки, Е, - часть внутренней энергии, обусловленная тепловыми колебаниями, зависящая от температуры и объема.

Это довольно смелое предположение, и оно не всегда может выполняться, но тогда и уравнение Ми-Грюнайзена не должно выполняться. Однако обычно уравнение Ми-Гринайзена достаточно точно описывает данные. Кажущееся несоответствие коэффициента Гринайзена, вычисленного по формуле Слэтера, и его термодинамического значения может объясняться неточным определением экспериментальных термодинамических величин. Сопоставление входящих в этот коэффициент величин, взятых из разных источников, показывает, **UTP** вычисленная величина коэффициента Гринайзена может варьировать в пределах 30%. Таким образом, лучше иметь непосредственные данные по второй производной от объема по давлению, а используя данные по коэффициенту Грюнайзена, нужно помнить об их ограниченной точности. Обсуждаемая методика была реализована в виде комплекса программ для ЭВМ "Мир-2", а затем опробована на нескольких Be-

I44

цествах. Быля построены кривые холодного сжатия, а цля серебра и меди для сравнения с экспериментом были построены теоретические ударные адиабаты. Анализ этих кривых показал, что отклонения от опытных данных не превышают границы в данных различных авторов.

Литература

I. Калиткин Н.Н. Модель атома Томаса-Ферми с квантовыми и обменными поправками. - ЖЭГФ, 1960, т.38, вып.5, с.1534-1540.

2. Калиткин Н.Н., Говорухина И.А. Интерполяционные формулы холодного сжатия веществ. – ФТТ, 1965, т.7, вып.2, с.355-362.

3. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. - М.: Наука, 1978. - 791 с.

4. Райс М., Мак-Куин Р., Уолш Дж. Сжатие твердых тел сильными ударными волнами. – В кн.: Линамические исследования твердых тел при высоких давлениях. М.: Мир, 1965, с.9-92.

5. Dugdale J.S., McDonald D. The thermal expansion of solids. - Phys. Rev., 1953, v.89, N 4, p.832-838.

УДК 620.179.13+620.22+531.71+549.672.1

И.А.Белицкий, Е.И.Ханженков

К МЕТОДИКЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ (20-1000⁰C) ДИЛАТОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МИНЕРАЛОВ НА ДЕРИВАТОГРАФЕ ОД-102 С

Изучение линейных (объемных) размеров образца при нагревании дает информацию о происходящих в нем структурных изменениях. Особенности теплового расширения-сжатия, кинетика и механизм твердофазных превращений типа $A_{TB} = B_{TB}, A_{TB} = B_{TB} + C_{PA3}$ в минералах представляет большой интерес для современной генетической минералогии. Так как форма дилатографических кривых (ТД,ДТД) определяется структурной индиницуальностью веществ, такие кривые могут использоваться в качестве необходимого дополнения к кривым ДТА при диагностике минералов. В некоторых случаях это особенно важно в связи с тем, что теплоты твердофазных превращений малы, и стандартные методы термографии не эффективны.

Однако, несмотря на большие возможности и относительную простоту дилатографии, а также широкое распространение в минералогических лабораториях термоаналитических приборов типа венгерских дериватографов (ОД-IO2, ОД-IO3 и ОД-IO2 С), имеющих стандартную приставку для дилатографии, публиканий по высокотемпературной дилатографии минералов мало. Объясняется это главным образом двумя причинами: трудностью приготовления однородных образцов из твердых порошков и низкой чувствительностью стандартного дилатометра дериватографа.

Ранее [I], при исследовании структурных превращений в природных цеолитах в процессе нагревания, нами была разработана методика прессования сбразцов в стандартной пресс-форме с использованием фторопластовой пленки и прокладок. Методика исклычала выход из строя пресс-формы при прессовании твердых порошков без добавления связующего и позволяла приготавливать однородные, прочные коаксиальные цилиндры для дилатации. Это существенно расширило крут изученных цеолитов [4], но требовало больших количеств вещества. В связи с тем, что при исследовании природных объектов количество минерала обычно ограничено, к тому же при дилатографическом изучении анизотропии расширения-сжатия в минералах требуются уже монокристаллы, необходимо было значительно повысить чувствительность дилатометра.

В дериватографах типа ОД-ІОІ и ОД-ІОЗ [2] перемещение коромысла весов при изменении длины образца (в случае использования стандартной дилатографической приставки, входящей в комплект прибора) передается на фоторегистрирующее устройство СВЕТОВЫМ лучом, проходящим через систему линз и зеркал. Поскольку ход коромысла весов остается неизменным и ограничен 2,5 мм, то максимальная чувствительность дилатометра такого типа к изменению дляны образца - 2,5 мм на всю шкалу (25 мкм/деление шкалы NULN 12,5 мкм/мм шкалы). При такой чувствительности дилатометра NCследование веществ с малым коэффициентом линейного расширения требует образцов большого линейного размера. Например, для OTклонения линии ТД на 2 деления шкалы при нагревании до IOOO^OC вещества с коэффициентом линейного расширения I.10⁻⁶ грал⁻¹ необходим образец с линейным размером 50 мм. Причем, если погреш-

I46

ность отсчета по шкале принять равной I/3 деления, то погрешность измерения будет более <u>+</u>15%. Такие величины во многих случаях неприемлемы.

У дилатометра более поздней модели дериватографа 0**Д**-102C чувствительность к изменению длины образца осталась прежней, но фоторегистрирурцее устройство заменено на "ниверсальный четырехканальный самописец. Меканическое перемещение коромысла весов передается не световым лучом, а преобразуется в электрический сигнал. Для детектирования изменения длины образца используется дифференциальный трансформатор, который преобразует перемещение коромысла весов в электрический сигнал. Величина сигнала пропорциональна изменению длины образца. Такая схема позволяет существенно повысить чувствительность дериватографа с помсшых внешних устройств, не изменяя конструкции прибора.

В качестве одного из простых, успешно использованных нами вариантов повышения чувствительности дериватографа было включение в его схему стандартного фотокомпенсационного усилителя типа ФП6/2, работающего в режиме усиления напряжения. Фотоусилитель

подключался к выходу дифференциального трансформатора. Параллельно входу регистрируншего устройства включался магазин сопротивлений РЗЗ, изменяя сопротивление которого в пределах 900-30 Ом, можно было получить чувствительность 0,5-5,0 мкм/деление (0,25-2,5 мкм/ мм шкалы), что превышает обычную чувствительность дериватографа в 5-50 раз.

Для проведения количественных дилатографических исследований проводится калиб-



Рис. I. Зависимость чувствительности дилатометра S (мкм/мм) от выходного сопротивления фотоусилителя R (Ом)

ровка прибора, виличанция ряд этапов. Предварительно, без образца, измеряются отклонения, связанные с тепловой деформацией держателя и прижима образца (в интервале температур предполагаемого исследования). Затем производится калибровка дилатометра по чистны металлам (Ag, Cu) или кварцу, коэфинциенты термического расширения которых детально изучены [3].



Рис. 2. Лилатограммы природного натролита, полученные при pasной чувствительности пилато-

метра

а - кривая I снята с помощью стандартного дилатометра на кристалле размером IO мм. Колвая 2 получена в тех же условиях на кристалле I мм; б -KDNвая получена на дилатометре С внешним усилением, размер кристалла I мм

Необходимая чувствительность дилатометра S (мкм/мм) подбирается изменением выходного сопротивления фотоусилителя R (Ом). В нашем случае зависимость S =f(R) имела вил кривой, показанной на рис. І.

Примером, иллострирукщим различие размеров кристаллов. необходимых для получения $(\Delta 1)$ одинакового отклонения на стандартном дилатометре И пилатометре с использованием внешнего усиления сигнала служат дилатограммы природного натролита (рис. 2).

Для проведения лилатографических исследований MOнокристаллов и таблеток не-больших размеров необходимо изменить форму держателя 00разца. В стандартном держателе в центре кварцевой пластинки, на которую устанавливается образец, имеется OTверстие, затрудняющее установку небольших объектов. В этом случае мы использовали такую же пластину, но без отверстия. Пластина была M3TOтовлена заодно с кварцевой трубкой. в которую вволилась термопара.

Использованный

вариант повышения чувствительности дилатометра в одинаковой мерс OTHOсится и к увеличению чувствительности термогравиметрических ИЗмерений на дериватографе ОД-102С.

Описанный метод работи на дериватографе существенно Daciniрил возможности термоаналитического изучения минералов, включая редкие, мелкие (доли мм) природные кристаллы. Он очень прост и дог vneн всем минералогическим лабораториям.

Литература

I. Беляцкий И.А., Никуличева О.Н. Приготовление образцов из твердых порошков для высокотемпературной дилатометрии на дериватографе. - В кн.: Экспериментальные исследования по минералогии. 1972-1973 год. Новосибирск: Изд-ние ИГиГ СО АН СССР, 1974, с.176-182.

2. Инструкция к дериватографу системы Ф.Паулик, И.Паулик и Л.Эрдеи, МОМ. Будапент, 1976, с.217.

3. Новикова С.И. Тепловое расширение твердых тел. М.: Наука, 1974, с.104.

4. Belitsky J.A., Nikulicheva O.N. Dilatometric study of zeolites using derivatograph. - In.: Fourth International conference on thermal analysis (ICTA). Abstracts of papers, Budapest, Hungary, 1974, c.37.

УДК 536.62

Е.И. Ханженков

ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОНЦИЙ ИНТЕГРАТОР С ШИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ДЛЯ МИКРОКАЛОРИМЕТРА ТИПА КАЛЬВЕ

Для проведения экспериментальных работ на высокотемпературном микрокалориметре Кальве НТ-800 (фирма Сетарам, Франция) в Секторе экспериментальной минералогии ИГиГ СО АН СССР разработан и изготовлен линейный электронный преобразователь "наприжениечастота" (ПНЧ).

Предлагаемая схема ПНЧ отличается простотой исполнения, необходимой линейной зависимостью выходной частоты следования импульсов от входного напряжения и почти не требует дополнительной подгонки элементов схемы. Кроме того, применение интегральных



Рис. I. Принципиальная схема преобразователя "напряжение-частота"

микроскем обеспечивает высокую температурную стабильность преобразователя.

Принципиальная схема преобразователя приведена на рис. I. Преобразователь работает следуищим образом. Напряжение U_{BX} подается на вход управляемого зарядного устройства, состоящего из цепочки R1C1. Напряжение Uc1, накапливаемое на интегрирующем конденсаторе C1, равно: <u>t</u>...

$$\mathcal{U}_{C1} = \frac{1}{C1} \int_0^{CU} \mathcal{J}_3 dt ,$$

где tu – время интегрирования; I₃ – ток заряда конденсатора. Напряжение Uc1 через согласующий каскад поступает на вход

амплитудного дискриминатора, собранного на микросхеме КІУТ401Б.

Назначение согласующего каскада состоит в том, чтобы согласовать большое выходное сопротивление интегрирующей цепочки R1C1 с низким входным сопротивлением амплитудного дискриминатора.

В качестве согласующего каскада используется интегральная МОП-микросхема КІЛБ72І. Высокая степень симметрии обеих половин микросхемы, обеспечиваемая технологией ее изготовления, позволяет получить величину температурного дрейфа нулевого уровня не больше, чем у усилителя с тщательно подобранными парами дискретных МОП-транзисторов на входе. Кроме того, включение на входе амплитудного дискриминатора микросхеми КІЛБ72I позволяет повысить низкий коэффициент усиления операционного усилителя КІУТ40I, что положительно сказывается на работе преобразователя.

Амплитудный дискриминатор представляет собой нуль-орган, собранный по схеме релаксационного генератора, который обеспечивает получение на выходе непрерывной последовательности импульсов при U_{BX}(9) < 0. Если же U_{BX}(9) 7/0, то импульсы на выходе отсутствуют.

В исходном состоянии U $_{\rm BX}(9) = U_{\rm BX}(10)$; импульсы на выходе амплитудного дискриминатора отсутствуют. При увеличении напряжения U $_{\rm BX}$ (Uc1 на конденсаторе C1), происходит увеличение разности ΔU между входами U $_{\rm BX}(9)$ и U $_{\rm BX}(10)$ и при $\left| U_{\rm BX}(9) \right| > |U_{\rm BX}(10)|$ на выходе амплитудного дискриминатора появятся импульсы.

При этом будет справедливо равенство:

$$\mathcal{U}_{C1} = \frac{\mathcal{I}_3 t_u}{C_1} = \mathcal{U}_n,$$

где U_{II} - порог срабатывания амплитудного дискриминатора. Импульсм с амплитудного дискриминатора поступают на схему разряда интегрирующего конденсатора СІ, которая состоит из транзисторного ключа, собранного на транзисторе MIIIЗА и безинерционного реле PI. Положительный импульс, поступающий с амплитудного дискриминатора на базу транзистора T2, открывает его и тем самым вызывает срабатывание реле PI, нормально разомкнутые контакты которого замыкаются и образуют быструю цепь разряда интегрирующего конденсатора.

Разряд конденсатора вызывает уменьшение разности оU между входами U_{BX}(9) и U_{BX}(IO) до нуля. На этом заканчивается цикл формирования выходного импульса.

Описанный цикл повторяется до тех пор, пока к схеме преобразователя приложено напряжение U_{рх}.

Поскольку время разряда конденсатора СІ меньше минимального времени заряда, то можно принять, что частота преобразования будет линейно зависеть от входного напряжения, т.е.

$$\oint = \frac{1}{t_u} = \frac{k l l e_x}{C l \cdot U_n}$$

где: 1 - выходная частота следования импульсов, к - коэффициент передачи напряжения от входа преобразователя к входу пороговой схемы. Для регистрации количества импульсов можно использовать любые стандартные цифровые индикаторы или пересчетные приборы.

Для согласования выхода преобразователя со входом выбранного счетчика импульсов (в данном случае цифровой индикатор Ф207А-I) добавлен еще один каскад, построенный на транзисторе MIIIЗА.



Рис. 2. Зависимость частоты следования выходных импульсов f (имп/сек) от напряжения на входе U_{вх}(В)

На рис. 2 показан графия зависимости частоти следования выходных импульсов от величины входного напряжения. Рабочий диапезон входного напряжения определяется высокоточным усилителем напряжения, входящим в комплект измерительной системы микрокалориметра (0-IB для усилителя № V724).

Максимальная приведенная погрешность из-за нелинейности на рабочем участке (U_{BX} = 0,I+IB) на основании экспериментальных данных составляет

не более 0,3%. Максимальный уход частоты преобразователя от температуры в диапазоне 20+50°С не более 0,005%.

Входное сопротивление около 100 кОм.

Безотказность в работе и сохранение требуемых параметров описанного электронного интегратора проверена при эксплуатации прибора в Секторе экспериментальной минералогии ИГиГ СО АН СССР в течение ряда лет.

COLEPEAHNE

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ BENECTBA

Пальянов Ю.Н.,	, Хохряков А	А.Ф., Чепур	ов А.П.	Шиклические	
лвойники	синтетическ	кого алмаза			3

Стр.

СУЛЬФИЛН

Годовиков А.А., Куряева Р.Г. Особенности расчета приве- денных силовых характеристик для сульфидов р-эле- ментов III группы	12
Куряева Р.Г., Годовиков А.А. Температура начала размяг- чения халькогенидных стекол на основе As ₂ S ₃ , ле- гированных р-элементами, и средняя энергия связи этих стекол	I4
Ильяшева Н.А., Ненашев Б.Г., Синяков И.В. Исследования в системе нg-Ga-S	23
Ненашева С.Н., Синякова Е.Ф. Термографическое исследова- ние части системы Ag-Ga-S	30
Федорова К.Н. Взаимодействие золота с мышьяком и серой при нагревании	38
Федорова Т.Н., Михайлик М.В. Упругость и молекулярный состав паров серы над ковеллином при 669-772 ⁰ К	44
Колонин Г.Р., Артеменко О.В., Лаптев Ю.В., Сахарова М.С. Условия извлечения серебра в раствор из серебросо- держащего галенита	49

ОКСИЛН

Калашников А.П. Кинетика растворения монокристаллов па-	
рателлурита в сильных щелочах	56
Казанцева Л.К. Изменение физических свойств аморфного	
кремнезема при термической обработке	59
Сысоева Е.И., Денискина Н.Д., Калинин Д.В., Казанцева Л.К.	
ИК-спектроскопия искусственных благородных опалов	65

Сысоева Е.И. Термическое исследование иривирующего опалового материала

75

оксосоли

Дорошев А.М., Логвинов В.М., Олеш М., Нехаев П.Ю. Фазо-	
вые превращения в ZnSiO ₃ и Zn ₂ SiO ₄ при высоких давлениях	85
Томас В.Г., Лебедев А.С. Кинетика гидротермальной крис- таллизации берилла из оксидов	97
Фурсенко Д.А. Зависимость состава гельвинов от кислот- ности-щелочности минералосбразующих растворов	I04
Каргальцев С.В., Лебедев А.С., Павлюченко В.С. О синте- тическом еремеевите	107
Мундус-Табакаев А.Ф. Взаимодействие компонентов в систе- ме V ₂ O ₅ -VO ₂ -PbO при больших концентрациях V ₂ O ₅	II2

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Богданова В.И. Спектрофотометрическое микроопределение мышьяка в его сульфидах	I24
Дорошев А.М., Кузнецов Г.Н. Уточнение параметров элемен- тарной ячейки кристаллов методом наименьших квад-	
ратов	131
Кузнецов Г.Н. Экстраполяция уравнения состояния твердо- го тела в область высоких давлений	I4I
Белицкий И.А., Ханженков Е.И. К методике высокотемпера- турных (20-1000 ⁰ С) дилатографических исследований	
минералов на дериватографе ОД-102С	I45
Ханженков Е.И. Простой электронный интегратор с цифровой индикацией для микрокалориметра типа Кальве	I49

Св.план, 1982, поз.42

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИНЕРАЛООБРАЗУКЦИХ СИСТЕМ

Сборник научных трудов

Ответственный редактор А.А.Годовиков

Утверждено к печати Институтом геологии и геофизики СО АН СССР

Редактор Л.А.Довгаль

Технический редактор Н.Н. Александрова

Подписано к печати 25,06.82. МН 17109. Бумага 60х84/16. Печ.л. 9,75. Уч.-изд.л. 8,9. Тираж 400. Заказ 282. Цена 65 коп.

Институт геологии и геофизики СО АН СССР Новосибирск, 90. Ротапринт.